ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

นางสาวกิตติมา ศิลปษา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 ISBN 974-171-756-3 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## EFFECTS OF SILICON POWDER SIZE ON THE PROCESSING OF REACTION-BONDED SILICON NITRIDE (RBSN) AND OXIDATION OF RBSN

Miss Kittima Sillapasa

# สถาบนวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Metallurgical Engineering Department of Metallurgical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2002 ISBN 974-171-756-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอน-
	ในไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
โดย	นางสาวกิตติมา ศิลปษา
สาขาวิชา	วิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร. กุลจิรา สุจิโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคร จารุพิสิฐธร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ด่านชัยวิจิตร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงศ์จันทร์)

กิตติมา ศิลปษา : ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กขันบอนด์ซิลิคอน ในไตรด์ และการเกิดออกซิเดขันของรีแอ็กขันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์. (Effects of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-bonded Silicon Nitride (RBSN) and Oxidation of RBSN) อ.ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร, อ. ที่ปรึกษาร่วม : ดร. กุลจิรา สุจิโรจน์, 113 หน้า. ISBN 974-171-756-3.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอกชัน บอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ โดยในส่วนแรก ถูกตรวจสอบด้วยการใช้ผงซิลิคอนสามขนาดซึ่งมีขนาดเฉลี่ย 3, 6 และ 12 ไมโครเมตร อัดขึ้นรูป ด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa แล้วทำการอัดขึ้นรูปด้วยแรงแบบทุกทิศทางที่ 300 MPa จากนั้น เผาผนึกขั้นต้นที่อุณหภูมิ 1200 °C ในบรรยากาศอาร์กอนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และทำการ ในไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1500 °C ในบรรยากาศอาร์กอนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจสอบสมบัติทาง กายภาพและสมบัติทางกล จากผลการทดลองพบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลงสมบัติท่งๆ ทั้งความหนาแน่น, โมดูลัสของยัง, ความแข็ง และความแข็งแรงต่อการดัดจะมีค่าเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ สองทำการศึกษาการเกิดออกซิเดชันโดยเผาชิ้นงานรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ในบรรยากาศ ที่ อุณหภูมิ 700, 800, 900 และ 1000 °C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง หาค่าพลังงานกระตุ้นและตรวจสอบ โครงสร้างจุลภาค จากผลการทดลองพบว่าการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิระหว่าง 700-1000 °C มี ค่าพลังงานกระตุ้นที่จะเกิดซิลิกาเป็น 209 kJ/mol (50 kcal/mol)

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา2545	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

## 4370229321: MAJOR METALLUGICAL ENGINEERING KEYWORD: REACTION-BONDED SILICON NITRIDE (RBSN) / RBSN / NITRIDATION / MECHANICAL PROPERTY/ OXIDATION

KITTIMA SILLAPASA: EFFECTS OF SILICON POWDER SIZE ON THE PROCESSING OF REACTION–BONDED SILICON NITRIDE (RBSN) AND OXIDATION OF RBSN, THESIS ADVISOR: ASSIATANT PROFESSOR DR. SAWAI DANCHAIVIJIT, THESIS CO-ADVISOR: DR. KULJIRA SUJIROTE, 113 pp. ISBN 974-171-756-3

The objectives of this thesis were to study the effects of silicon powder size on the processing of reaction-bonded silicon nitride (RBSN) and oxidation of RBSN. The first part was investigated by using three silicon powders of 3, 6 and 12  $\mu$ m in average size. The procedure for processing of RBSN body was as follows: compacting the silicon powder with uniaxial press at 72 MPa and then cold isostatic press (CIP) at 300 MPa; pre-sintering the green compact at 1200 °C in argon atmosphere for 3 hrs; then nitriding the preform body at 1500 °C in nitrogen atmosphere for 3 hrs. The physical and mechanical properties were measured. From the results, bulk density, hardness, young's modulus and flexural strength are increased with decreasing the silicon powder size. For the second part the oxidation of RBSN was investigated at 700°C, 800°C, 900°C and 1000°C in air atmosphere for 20 hrs. The activation energy was calculated and microstructure was observed. In the range of 700-1000 °C, SiO<sub>2</sub> is formed with activation energy of 209 kJ/mol (50 kcal/mol).

# จุฬาลงกรณมหาวทยาลย

Department	.Metallurgical E	ngineering	Student's	signature	
Field of study	Metallurgical	Engineering	Advisor's	signature	
Academic year.	2002	)	Co-advisc	or's signature	

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร และอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม ดร. กุลจิรา สุจิโรจน์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือและแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งในการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านในคำแนะนำและช้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ขอขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่อนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ วิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาต่อและให้ทุนบางส่วนในการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ คุณกันยาทิพย์ ตันติคมน์ คุณกรรณิการ์ เดชรักษา คุณกฤดิภัค โกยดุลย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานวิจัย และเพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจจนกระทั่ง งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนด้าน การศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งคุณตา คุณยาย และครอบครัวทุกคนที่เป็นกำลังใจที่สำคัญ ทำ ให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังเจตนารมณ์

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญ

		หน้า
บเ	กคัดย่อภาษาไทย	٩
บเ	ุ่งคัดย่อภาษาอังกฤษ	۹
กิต	าติกรรมประกาศ	ପି
ଶୀ	ารบัญตาราง	j
ଶୀ	ารบัญรูป	ສິ
บเ	กที่	
1.	บทนำ	
	1.1 ความสำคัญของงานวิจัย	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงร่างวิทยานิพนธ์	3
	1.3 ขอบเขตของการ <mark>ศึกษา</mark>	3
	1.4 ประโยชน์ที่คา <mark>ดว่าจะได้รับ</mark>	4
2.	ปริทรรศน์วรรณกรร <mark>ม</mark>	
	2.1 สมบัติของซิลิคอนในไตรด์	5
	2.2 โครงสร้างผลึกของซิลิคอนในไตรด์	<u>6</u>
	2.2.1 โครงสร้างของ α-Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> และ β- Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	6
	2.2.2 การเปลี่ยนแปลงเฟสของ $lpha$ และ $eta$ ซิลิคอนในไตรด์	7
	2.3 กระบวนการขึ้นรูปรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	7
	2.3.1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	9
	2.3.2 ผลของสารปนเปื้อนต่อการเกิดรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	12
	2.3.3 ผลของก๊าซต่อการเกิดรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	13
	2.3.4 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	15
	2.3.4.1 ผลของขนาดผงต่อการเกิดปฏิกิริยาของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์	15
	<sup>9</sup> 2.3.4.2 ผลของขนาดผงต่อสมบัติของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	17
	2.4 การเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนในไตรด์	19
	2.4.1 หลักเคมีความร้อนของการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนในไตรด์	19
	2.4.2 การเกิดออกซิเดชันของผงซิลิคอนในไตรด์บริสุทธิ์	21
	2.4.3 การคำนวณหาความสัมพันธ์จากการเกิดออกซิเดชัน	23
	2.4.4 ผลการเกิดออกซิเดชันต่อสมบัติของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	25

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.5 การใช้งานของซิลิคอนไนไตรด์	28
3. ระเบียบวิธีการวิจัย	
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง	29
3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การบดและขึ้นรูปงานซิลิคอน	29
3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตชิ้นงาน	29
3.1.3 เครื่องมือและอุป <mark>กรณ์ทดส</mark> อบและตรวจสอบ	29
3.2 วัสดุที่ใช้ในการท <mark>ดลอง</mark>	30
3.2.1 ผงโลหะซิ <mark>ลิคอน</mark>	30
3.2.2 สารช่วยเกาะยึด	31
3.2.3 ก๊าซที่ใช้ควบคุมบรรยากาศในเตา	31
3.3 การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง	31
3.3.1 วิธีการบดและผสมผง	31
3.3.2 วิธีการอัดขึ้นรูปช <mark>ึ้นงานซิลิคอน</mark>	32
3.4 วิธีการเผาผนึกขั้นต้น	33
3.5 การตรวจสอบสมบัติขอ <mark>งชิ้นงานที่ผ่านการเผาผนึ</mark> กขั้นต้น	
3.5.1 วิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการวัดความหนาแน่น	34
3.5.2 การตรวจสอบสมบัติทางกล	34
3.5.2.1 วิธีการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน	
3.5.2.2 วิธีการวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด	35
3.5.2.3 วิธีการวัดค่าโมดูลัสของยัง	36
3.5.3 วิธีการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศ์แบบส่องกวาด	37
3.6 วิธีการทำในไตรเดชัน	37
3.7 การตรวจสอบสมบัติของชิ้นงานที่ผ่านการทำไนไตรเดชัน	38
3.7.1 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการหาค่าความหนาแน่น	38
3.7.1.1 วิธีการหาความหนาแน่นด้วยการวัด	
3.7.1.2 วิธีการหาความหนาแน่นด้วยการแทนที่ด้วยน้ำ	38
3.7.1.3 วิธีการหาความหนาแน่นด้วย Ultrapycnometer	39
3.7.2 การตรวจสอบสมบัติทางกล	39

# สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	3.	7.2.1 วิธีการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน	39
	3.	7.2.2 วิธีการวัดค่า Fracture toughness, K <sub>าc</sub>	40
	3.	7.2.3 วิธีการวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด	41
	3.	7.2.4 วิธีการวัดค่าโมดูลัสของยัง	41
	3.7.3	วิธีการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีด้วย X-ray diffractometer	42
	3.7.4	วิธีการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแบบส่องกวาด	42
	3.8 การไ	ศึกษาการเกิ <mark>ดออกซิเดชัน</mark>	42
	3.8.1	ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง <u>.</u>	42
	3.8.2	วิธีการเผ <mark>าชิ้นงานที่อุณหภูมิต่างๆ</mark>	43
	3.8.3	วิธีการหาค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชันและความหนาชั้นฟิล์ม SiO <sub>2-</sub>	43
	3.8.4	วิธีการตร <mark>วจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแบบส่องกวาด</mark>	<u>45</u>
	3.8.5	วิธีการวัดค่ <mark>าความแข็งของชิ้นงานที่เกิดออกซิเดชัน</mark>	<u>45</u>
	3.8.6	วิธีการวัดค่า Fracture toughness, K <sub>าc</sub>	46
4.	ผลการท	าดลอง	
	4.1 ผลก	กรตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการวัดค่าความหนาแน่น	48
	4.2 ผลก	ารตรวจสอบสมบัติทางกล	<u>52</u>
	4.2.1	ผลการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน	<u>52</u>
	4.2.2	ผลการว <mark>ัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด</mark>	<u>54</u>
	4.2.3	ผลการวัดค่าโมดูลัสของยัง	<u>55</u>
	4.2.4	ผลการวัดค่า Fracture toughness, K <sub>าc</sub>	<u>56</u>
	4.3 ผลก	ารหาปริมาณเฟสในโครงสร้างจากการตรวจสอบด้วย X-ray diffractometer	<u>57</u>
	4.4 ผลก	ารตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแบบส่องกวาด	<u></u> 59
	4.5 ผลก	ารศึกษาการเกิดออกซิเดชัน	<u>63</u>
	4.5.1	ผลการเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง	63
	4.5.2	ผลการหาค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชัน	63
	4.5.3	ผลการหาความหนาของชั้นฟิล์ม SiO <sub>2</sub>	66
	4.5.4	ผลการวัดค่าความแข็งของชิ้นงานที่เกิดออกซิเดชัน	67
	4.5.5	ผลการวัดค่า Fracture toughness, K <sub>าc</sub>	<u>68</u>

<u>ہ</u>	
สารบญ	(ตอ)

	หน้า
4.5.6 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด	69
4.5.7 ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีด้วย Energy Dispersive Spectroscopy	
ร่วมกับการทำ mapping	70
5. อภิปรายผลการทดลอง	
5.1 สมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน Perform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ	72
5.1.1 ความหนาแน่น	72
5.1.2 ความแข็ง	74
5.1.3 ความแข็งแรงต่อ <mark>การดัด</mark>	75
5.1.4 โมดูลัสของยัง	76
5.1.5 Fracture toughness, K <sub>1c</sub>	77
5.2 ปริมาณเฟสในโครงสร้างของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ	79
5.3 การเกิดออกซิเดชั้นของรีแอกชั้นบอนด์ซิลิคอนในไตรด์	
5.3.1 ค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซีเดชันของชิ้นงาน RBSN	
5.3.2 ความแข็งของชิ้ <mark>น</mark> งาน <mark>RBSN ที่เกิดออก</mark> ซิเดชัน <u>.</u>	81
5.3.3 Fracture toughnes <mark>s, K<sub>าc</sub> ของชิ้นงาน R</mark> BSN ที่เกิดออกซิเดชัน	
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
6.1 สรุปผลการทดลอง	<u>83</u>
6.2 ข้อเสนอแนะ	83
รายการอ้างอิง	84
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. ข้อมูลการวัดขนาดผงด้วยเครื่อง Mastersizer	
ภาคผนวก ข. ข้อมูลการหา True density ด้วย Ultrapycnometer	91
ภาคผนวก ค. ข้อมูลและกราฟจากการทดสอบ Three-point bending	
ภาคผนวก ง. กราฟและข้อมูลจากการวัดด้วย XRD	101
ภาคผนวก จ. กราฟจากการตรวจสอบด้วย EDS	105
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	113

# สารบัญตาราง

ตาร	างที่	หน้า
2.1	ความหนาแน่นและสมบัติทางกลของซิลิคอนในไตรด์ <u></u>	5
2.2	ข้อมูลโครงสร้างผลึกของซิลิคอนไนไตรด์	7
2.3	สรุปอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น	18
3.1	ส่วนผสมหลักของ silicon metal ตรวจสอบโดย X-ray fluorescence	30
3.2	ขนาดของผงซิลิคอน 3 ขนาดที่วัดได้จากเครื่อง Mastersizer	30
3.3	ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอ <mark>งสำหรับวิเ</mark> คราะห์ผลของขนาดผง	32
3.4	ข้อมูลการให้ความร้ <mark>อนในการเผาผ</mark> นึกขั้นต้น	33
3.5	ข้อมูลการให้ความ <mark>ร้อนในการเผาไนไตรเดชัน</mark>	37
3.6	ข้อมูลการให้ความร้อนในการเผาเพื่อศึกษาการเกิดออกซิเดชัน	43
4.1	ความหนาแน่นของ Bulk density ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN	48
4.2	% รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact	
	ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	50
4.3	% รูพรุนของชิ้นงาน RBSN เมื่ออัดแบบแนวเดียวด้วยแรงต่างๆ โดย green compact	
	มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 µm และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	51
4.4	ความแข็งของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดยที่	
	green compact ถูกอัดด้วยแรงแนวเดียวที่ 72 MPa	
	และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	53
4.5	ความแข็งแรงต่อการดัดของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ	
	โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
	และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	54
4.6	โมดูลัสของยังของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย	
	green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
	และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	55
4.7	Fracture toughness ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนต่างๆ โดย green compact	
	ผ่านการอัดแนวเดียว ที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	56
4.8	Relative integrated intensity ของ peak $lpha$ -Si $_{_3}$ N $_{_4}$ เทียบกับ $eta$ - Si $_{_3}$ N $_{_4}$	
	ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ	57

# สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.9 ปริมาณของ $lpha$ -Si $_{_3}$ N $_{_4}$ และ $eta$ - Si $_{_3}$ N $_{_4}$ ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ	
โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	58
4.10 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของชิ้นงานที่ผ่านการเผาในบรรยากาศ	63
4.11 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่ห <mark>น้าตัดของชิ้นงาน RBSN</mark> ที่ผ่านการเผาในบรรยากาศ	64
4.12 ค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ได้ในแต่ละอุณหภูมิการเกิดออกซิเดชัน	65
4.13 ค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 700 -1000 °C	65
4.14 สรุปความหนาขอ <mark>งชั้นฟิล์มซิลิกาบนผิวของชิ้นงาน R</mark> BSN ที่เกิดออกซิเดชัน	66
4.15 ความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ	67
4.16 ค่า K <sub>1c</sub> ของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 ไมครอน โดย green compact	
ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	68
5.1 ค่าพลังงานกระตุ้นของก <mark>ารเกิดออกซิเดชันขอ</mark> งซิลิคอนไนไตรด์	81

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างผลึกของ a) <b>α</b> -Si <sub>3</sub> N₄ และ b) β-Si <sub>3</sub> N₄[Hampshire et al., 1987]	6
2.2 การเกิดซิลิคอนไนไตรด์หลังจากไนไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1150 °C	
เป็นเวลา 28 นาที [Sheldon, 1995]	8
2.3 การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันกับเวลา [Atkinson et al, 1976]	10
2.4 การกลายเป็นไอและความ <mark>ดันย่อยสมดุลบนผิว</mark> ซิลิคอนกับอุณหภูมิ (A) Unvala, 1963	
(B) Honig, 1957 (C) Batdorf and Smits, 1959 [Jennings, 1983]	10
2.5 ความดันย่อยของซิล <mark>ิคอนเหนือผิว</mark> กับอัตราก <mark>ารกลายเป็นไอ</mark> ของซิลิคอน[Jennings, 1983	]11
2.6 เปอร์เซ็นต์การเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของเหล็กที่เติมในผงเริ่มต้น [Moulson,1979]	13
2.7 ผลของการผ่านก๊าซต่อการเกิดปฏิกิริยาในไตรเดชัน [Mostafa and Arvind, 1996]	14
2.8 a) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของผงซิลิคอนและชั้นที่เกิดในไตรด์ และ	
b) อิทธิพลของขนาดผงซิลิคอนต่ออัตราการเกิดชั้นในไตรด์ [Yasutomi et al., 1997]	15
2.9 ขอบเขตสำหรับการเกิดออกซิเดชันแบบ passive และ active ของซิลิคอนในไตรด์	
[Singhal, 1976]	20
2.10 ค่าคงที่อัตราเส้นโค้งพ <mark>าราโบลิคของการเกิดออ</mark> กซิเดชันของซิลิคอนไนไตรด์	
ที่มีรูปแบบต่างกัน, E เป็นพลั <mark>งงานกระตุ้น (kJ/m</mark> ol) [Goursat et al., 1972, 1973]	22
2.11 ความสัมพันธ์ของ $\Delta  extsf{W}^2$ กับเวลา ของการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่างๆ	
[Kainasskii et al.,1960]	24
2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า k <sub>p</sub> และอุณหภูมิ [Kainasskii et al.,1960]	25
2.13 อัตราการเกิดออกซิเดชันของ RBSN [Haggerty et al.,1989]	26
2.14 Fracture strength ของชิ้นงานที่ถูกออกซิไดซ์ [Haggerty et al.,1989]	26
2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและน้ำหนักของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น	
[Gogotsi and Grathwohl, 1993]	27
2.16 ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ผลิตจากซิลิคอนในไตรด์ (Trademark T&N plc)	28
3.1 การกระจายตัวของขนาดผงซิลิคอนทั้ง 3 ขนาด ที่วัดได้จากเครื่อง Mastersizer	30
3.2 ขนาดชิ้นทดสอบที่ได้จากการอัดขึ้นรูป	32
3.3 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาผนิกขั้นต้น	33
3.4 การทดสอบแบบ Three-point bending	35
3.5 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาไนไตรเดชัน	37

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	าน้า
3.6 ลักษณะรอยกดจากการวัดความแข็งแบบ Vickers4	40
3.7 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาเพื่อศึกษาการเกิดออกซิเดชัน	43
3.8 ลักษณะชิ้นงาน RBSN ที่ใช้ในการทดลองการเกิดออกซิเดชัน4	43
3.9 แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูป RBSN4	47
4.1 ผลของผงซิลิคอนต่อค่าความห <mark>นาแน่นของชิ้นงาน</mark> Preform และ RBSN ที่	
green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	49
4.2  ผลของแรงอัดแบบแนวเดียวต่อค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่	
green compact <mark>มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่ 6 μ</mark> และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa4	49
4.3  ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อ % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรง	
แบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	51
4.4  ผลของแรงอัดแบบแนวเดียวต่อ % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ green compact มี	
ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต <b>้นที่ 6 µ</b> m โดยผ่านการ CIP ที่ 300 MPaร	52
4.5  ผลของขนาดผงซิลิคอน <mark>ต่อค่าความแข็งของชิ้นงา</mark> น Preform และ RBSN ที่ green	
compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa!	53
4.6  ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัดของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่	
green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	54
4.7  ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าโมดูลัสของยัง ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่	
green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	56
4.8  ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่า Fracture toughness ของชิ้นงาน RBSN ที่ green	
compact ผ่านการอัดแนวเดียว ที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	57
4.9  ข้อมูล XRD ของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 μm โดย green compact	
ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPaร	58
4.10 Calibration curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง integrated intensity ของ $m{lpha} ext{-Si}_3{\sf N}_4$	
เทียบกับ weight fraction ของ $eta$ - Si $_{_3} extsf{N}_{_4}$ [Charles and Donald, 1977]	.59

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.11	โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน Preform ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น	
	ต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
	และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa	60
4.12	โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น	
	ต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa	
	และผ่านการ CIP ที่ 30 <mark>0 MPa</mark>	62
4.13	ความสัมพันธ์ของ $\Delta W^2~(g^2)$ กับ เวลา (ชั่วโมง) ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน	64
4.14	ความสัมพันธ์ระหว่างค่า k <sub>p</sub> (g²/(cm⁴. min)) และอุณหภูมิ (°C) ของชิ้นงาน RBSN	
	ที่เกิดออกซิเดชันในแต่ละอุณหภูมิ	65
4.15	ความหนาของชั้นฟิล์ม SiO <sub>2</sub> ในแต่ละอุณหภูมิการเกิดออกซิเดชัน เมื่อทำการเผา	
	เป็นเวลา 20 ชั่วโมง	66
4.16	ความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ	67
4.17	ค่า K <sub>1c</sub> ของชิ้นงาน <mark>RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภู</mark> มิต่างๆ	68
4.18	ความหนาของชั้นฟิล์ม SiO <sub>2</sub> ของชิ้นงาน RBSN ที่ทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่างๆ	
	ตรวจสอบด้วยกล้อง SEM	69
4.19	ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่ 1000 °C ที่บริเวณผิว	
	เทียบกับภายในชิ้นงาน	70
4.20	โครงสร้างจุลภา <mark>ค แ</mark> ละ mapping ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่ 1000 °C	71
5.1	Diagram ของการเกิดซิลิคอนในไตรด์ระหว่างกระบวนการ	
	reaction-bonded silicon nitride [Atkinson et al., 1976]	74
5.2	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงต่อการดัดและ % รูพรุน	76
5.3	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสของยังและ % รูพรุน	77
5.4	ชิ้นงานทดสอบสำหรับหาค่า K <sub>1c</sub> [ASTM E1820-01, pp.1046]	78
5.5	Fracture surfaces ที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน GPSed-RBSN ของ	
	a) ผงซิลิคอนขนาด 2 $\mu$ m และ b) ผงซิลิคอนขนาด 7 $\mu$ m [Lee และคณะ, 2001]	79

บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญของงานวิจัย

ปัจจุบันมีการพัฒนาและให้ความสำคัญกับวัสดุประเภทเซรามิกส์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก เซรามิกส์มีสมบัติที่ดีหลายประการ คือมีความแข็งแรงสูงทั้งที่มีน้ำหนักเบากว่าเมื่อเทียบกับโลหะ และ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงมีการใช้เซรามิกส์ในอุตสาหกรรมในปริมาณมากขึ้นและหลากหลาย ขึ้น โดยอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นมากจากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า มาเป็นการผลิตเพื่อส่งออก เน้นการใช้วัตถุดิบจากแหล่งในประเทศ ปัจจุบันทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และทำให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยหากสามารถผลิต ซิลิคอนไนไตรด์ (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ซึ่งเป็นเซรามิกส์ที่ยังไม่ได้มีการผลิตในไทยขึ้นใช้เองได้ก็จะยิ่งเพิ่มรายได้ให้กับ ประเทศได้มากขึ้น

ซิลิคอนในไตรด์ (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) เป็นวัสดุในตระกูลของเซรามิกส์ประเภทในไตรด์ที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ได้แก่ มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนอย่าง ทันทีทันใด (shock resistance) มีความต้านทานต่อการสึกหรอ (wear resistance) ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบ กับซิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ [Sujit and Randall, 1992] ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (thermal expansion coefficient) ต่ำ ความหนาแน่นน้อย ต้านทานต่อการกัดกร่อน (corrosion resistance) ได้ดี มีความต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง [Neil et al., 1992] สมบัติดังกล่าวสนับสนุนให้วัสดุที่ผลิตจากซิลิคอนไนไตรด์สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี

โครงสร้างและคุณสมบัติของซิลิคอนในไตรด์จะแตกต่างกันไปตามกรรมวิธีการผลิต โดยสามารถ ผลิตซิลิคอนในไตรด์ได้หลายวิธีได้แก่ การอัดด้วยความร้อน (hot pressing) การอัดร้อนด้วยความดันทุก ทิศทาง (hot isostatic pressing) การเผาโดยปราศจากความดัน (pressureless sintering) หรือการทำ ปฏิกิริยาระหว่างผงซิลิคอนกับก๊าซไนโตรเจน (reaction-bonding) เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ซิลิคอนในไตรด์แล้ว อาจกล่าวได้ว่าวิธีรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ (reaction-boned silicon nitride, RBSN) มีข้อได้เปรียบดังนี้คือ ต้นทุนด้านวัสดุต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นเนื่องจากใช้วัตถุดิบเป็นซิลิคอนซึ่งมี ราคาต่ำกว่า และอุณหภูมิที่ใช้ยังต่ำกว่าการขึ้นรูปวิธีอื่น ทำให้สามารถใช้เตาที่อุณหภูมิไม่สูงมากได้ การ ควบคุมบรรยากาศไม่ยุ่งยากนักเพราะต้องการเพียงควบคุมบรรยากาศให้เป็นไนโตรเจน โดยไม่ จำเป็นต้องเพิ่มความดัน และจะได้ขนาดของชิ้นงานสำเร็จใกล้เคียงกับชิ้นงานจริง (near net shape) เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดการหดตัวเหมือนการเผาเซรามิกส์ทั่วไป ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในส่วนของการตัดเจาะกลึงใส (machining) สามารถขึ้นรูปวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตามในการ ใช้งานรีแอกซันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์มีข้อจำกัดจากกระบวนการผลิต ทำให้ยังมีความพรุนเหลืออยู่ ดังนั้นสมบัติโดยทั่วไป เช่นความแข็งแรงและความหนาแน่นจะต่ำกว่าการขึ้นรูปวิธีอื่น จึงเหมาะสำหรับ การนำไปใช้งานที่ต้องทนอุณหภูมิสูงแต่ไม่ต้องรับแรงมาก

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้งานหัวฉีด เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแก๊สเทอร์ ไปด์ (gas turbine power plant) หรือพลังความร้อน (thermal power plant) เช่นอุปกรณ์ชุดหัวเผา, อุปกรณ์ชุดหัวฉีด โดยใช้วัสดุหลายชนิด เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม (AISI 304) เหล็กกล้าเครื่องมือ (SKD11) และนิกเกิลอัลลอย (Inconel 750) ซึ่งต้องใช้งานที่อุณหภูมิสูง ต้องมีความแข็งสูงเนื่องจากต้องทนต่อการ สึกหรอ (wear resistance) และต้องมีความต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (oxidation resistance) ที่อุณหภูมิสูงได้ดี โดยอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานสั้น ทำให้เสียโอกาสใน การผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องสำหรับการบำรุงรักษา เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว [วีรศักดิ์ หอมกระจาย, 2543]

โครงงานนี้จึงสนใจในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นส่วนหัวฉีด น้ำมันที่ใช้กับอุปกรณ์โรงไฟฟ้าด้วยซิลิคอนไนไตรด์ โดยได้แบ่งโครงงานออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสที่ 1 ศึกษาการขึ้นรูปของซิลิคอน ความสามารถในการตัดเจาะกลึงไสของซิ้นงานซิลิคอน ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเมื่อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการทำไนไตรเดชัน ศึกษาสมบัติทางกลเบื้องต้นของ ชิ้นงาน และศึกษาโครงสร้างจุลภาคของซิลิคอนไนไตรด์

เฟสที่ 2 ศึกษาผลของขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนใน ไตรด์ ศึกษาการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

เฟสที่ 3 สร้างชิ้นงานต้นแบบ นำชิ้นงานต้นแบบของหัวฉีดน้ำมันรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ ไปทดลองใช้จริงในโรงไฟฟ้า ศึกษาสมบัติที่อุณหภูมิสูง ศึกษาสมบัติทางด้านความต้านทานการกัดกร่อน และการสึกกร่อนเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ เทียบกับวัสดุเดิมที่เป็นเหล็ก SKD11 ในโครงงานก่อนหน้านี้ (เฟสที่ 1) กันยาทิพย์ ตันติคมน์, [2543] ได้ศึกษาเรื่องการขึ้นรูปและ คุณลักษณะของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตหัวฉีดในโรงไฟฟ้า แต่สมบัติ ต่างๆ ที่ได้ยังไม่สูงพอ โดยเฉพาะความหนาแน่นของชิ้นงานที่มี 72-82%ของความหนาแน่นทางทฤษฏี ซึ่งยังมีค่าต่ำเมื่อเทียบกับชิ้นงานเชิงพาณิชย์ (84%ของความหนาแน่นทางทฤษฏี) เปอร์เซนต์รูพรุนที่มี อยู่ในชิ้นงานมีค่าอยู่ในช่วง 16-24% ซึ่งมากกว่าชิ้นงานเชิงพาณิชย์ที่มีรูพรุนเพียง 10% การที่ค่าความ หนาแน่นไม่สูงเท่าที่ควรและเปอร์เซนต์รูพรุนมากมีสาเหตุจากขนาดผงซิลิคอนใหญ่ (25 ไมครอน) และ เวลาในการในไตรเดชันน้อยจึงไม่เกิดเป็นซิลิคอนไนไตรด์สมบูรณ์ โดยค่าความแข็งแรงต่อการดัดเท่ากับ 42-143 MPa และค่าโมดูลัสของยังเท่ากับ 68-138 GPa ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานเชิง พาณิชย์ (197 MPa และ 255 GPa ตามลำดับ) เนื่องจากมีรูพรุนมากในชิ้นงานนั่นเอง

โครงงานนี้เป็นเฟสที่ 2 จึงสนใจที่จะศึกษาผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กขัน บอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และศึกษาการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงร่างวิทยานิพนธ์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ (reaction-boned silicon nitride, RBSN)
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

#### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.3.1 ขึ้นรูปผงซิลิคอนที่แตกต่างกัน 3 ขนาด โดยการอัดแบบแนวเดียว (uniaxial press) และอัด แบบทุกทิศทาง (cold isostatic press) ทำการปรับเปลี่ยนแรงในการอัดแต่ละแบบ เปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของซิ้นงานภายหลังการอัดขึ้นรูป
- 1.3.2 ศึกษาผลของขนาดผงซิลิคอนที่แตกต่างกัน 3 ขนาด ต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอกชันบอนด์ ซิลิคอนไนไตรด์ โดยการตรวจสอบ ความหนาแน่น (density), ความแข็งแรงต่อการดัด (flexural strength), ความแข็ง (hardness) ,โมดูลัสของยัง (young's modulus), โครงสร้าง ทางเคมี และโครงสร้างจุลภาค ของชิ้นงานภายหลังการอัดขึ้นรูป (green compact), ชิ้นงานหลังการเผาผนึกขั้นต้น (preform) และชิ้นงานหลังไนไตรเดชัน (RBSN)
- 1.3.3ศึกษาการเกิดออกซิเดชันของชิ้นงานซิลิคอนไนไตรด์ในอากาศที่อุณหภูมิสูงโดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการเผาเป็น 700, 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา

ประมาณ 20 ชั่วโมง ทำการชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หาค่าพลังงานกระตุ้นที่จะเกิดออกซิเดชัน ตรวจสอบโครงสร้างทางเคมี และโครงสร้างจุลภาค

# 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชัน และข้อมูลเกี่ยวกับผลของผงซิลิคอนต่อกระบวนการ
   ขึ้นรูปรี่แอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์ (RBSN) เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบหัวฉีดน้ำมันใน
   โรงไฟฟ้าแทนที่วัสดุเดิมที่ทำด้วยเหล็ก SKD 11 ต่อไป
- 1.4.2 เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หัวฉีดแบบ RBSN (Reaction-Boned Silicon Nitride) เพื่อ ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิสูงอื่นๆ เช่น ในโรงงานไฟฟ้า โรงงานหลอมโลหะ โรงงาน ที่เผาเหล็กให้ร้อนด้วยน้ำมันโดยใช้โลหะทนความร้อนที่มีอายุการใช้งานสั้น เช่นเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
- 1.4.3 ได้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการขึ้นรูป และสมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน RBSN

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรม

#### 2.1 สมบัติของซิลิคอนในไตรด์

ซิลิคอนในไตรด์ (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) เป็นวัสดุในตระกูลของเซรามิกส์ประเภทในไตรด์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้ในงานวิศวกรรม มีสมบัติแตกต่างกันไปตามกรรมวิธีการผลิต โดยซิลิคอนไนไตรด์สามารถผลิต ได้หลายวิธีได้แก่ การอัดด้วยความร้อน (hot pressing) การอัดร้อนด้วยความดันทุกทิศทาง (hot isostatic pressing) การเผาโดยปราศจากความดัน (pressureless sintering) หรือการทำ ปฏิกิริยาระหว่างผงซิลิคอนกับก๊าซไนโตรเจน (reaction-bonding)

Property	RBSN	HPSN	SSN
Relative density ( $\rho$ ), % theoretical	70-88	99-100	95-99
Young's Modulus(E), GPa	120-250	310-330	260-320
Flexural strength ( $\sigma$ ), MPa	150-350	450-1000	600-1200
Flexural strength ( $\sigma$ ), MPa (1200 °C)	150-350	450-850	500-780
Hardness, (HV)	400-700	1600-1800	1350-1600
Fracture toughness (K <sub>IC</sub> ), MPam <sup>1/2</sup>	1.5-3.0	4.2-7.0	5.0-8.5
Density (g/cm <sup>3</sup> ) *	2.5	3.19	3.19
Conductivity (W/mK) *	5-13	25	5-13
Expansion ( $K^{-1} 10^{-4}$ ) *	1.5-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0

ตารางที่ 2.1 ความหนาแน่นและสมบัติทางกลของซิลิคอนไนไตรด์

[Taffner et al, 1991] และ \* [Morrell, 1985]

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าสมบัติของซิลิคอนไนไตรด์ที่ผ่านกระบวนการ RBSN จะต่ำกว่า ซิลิคอนไนไตรด์ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบอื่น แต่การขึ้นรูปแบบ Hot Press Silicon Nitride (HPSN) มี ข้อจำกัดคือไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ การขึ้นรูปแบบ Sintered Silicon Nitride (SSN) เป็นวิธีที่ควบคุมขนาดชิ้นงานยากเนื่องจากมีการหดตัวหลังการเผาผนึก (sintering) สูง ข้อดีของการขึ้นรูปแบบ RBSN คือสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ ได้ขนาดและรูปร่างใกล้เคียง ชิ้นงานจริง (near net shape) ทำให้ลดต้นทุนในการตัดเจาะกลึงไส (machining) ต้นทุนด้านวัสดุ จะต่ำกว่ากรรมวิธีอื่นเนื่องจากใช้ผงซิลิคอนเป็นวัตถุดิบ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่ำกว่ากรรมวิธี SSN ทำให้ไม่มีปัญหาข้อจำกัดด้านอุณหภูมิของเตา

# 2.2 โครงสร้างผลึกของซิลิคอนไนไตรด์

## 2.2.1 โครงสร้างของ $\pmb{\alpha}$ -Si $_{_3}N_{_4}$ และ $\pmb{\beta}$ -Si $_{_3}N_{_4}$

ซิลิคอนในไตรด์สามารถเกิดผลึกได้ 2 รูป คือ ผลึกแอลฟา-ซิลิคอนในไตรด์ (α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) และผลึกเบตา-ซิลิคอนในไตรด์ (β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ผลึกทั้งสองรูปจะเป็นเฮคซะโกนอล (hexagonal) จะต่างกันตรงระยะทางในทิศทางแกน C โดยโครงสร้างแบบเอลฟามีความยาวมากกว่า แบบเบตาประมาณ 2 เท่า โครงสร้างทั้ง 2 แบบ เกิดจากการใช้มุมร่วมกันของกลุ่ม Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>tetrahedral โครงสร้างซิลิคอนไนไตรด์ประกอบด้วยชั้นอะตอมซิลิคอนและชั้นอะตอมของ ในโตรเจนมีลำดับเป็น ABCDABCD... หรือ ABAB... โดยเป็นเฟสแอลฟาและเบตา ตามลำดับ ชั้น AB ในเฟสแอลฟาและเบตามีลักษณะเหมือนกัน ส่วนชั้น CD เกิดจากการลื่น ไถลของระนาบ C [Ekstrom and Nygren, 1992] ดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างผลึกของ a)  $\alpha$ -Si $_3N_4$  และ b)  $\beta$ -Si $_3N_4$ [Hampshire et al., 1987]

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปของผลึก ผลึก α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิดที่ อุณหภูมิต่ำ และผลึก β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิดที่อุณหภูมิสูง เฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> แข็งกว่าเฟส β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> แต่ โครงสร้างแบบ β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> มีความสมมาตรมากกว่า ทำให้มีความเครียดน้อยกว่าแบบ α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จากผลดังกล่าวผลึกแบบเบตาจึงมีความเสถียรมากกว่า แสดงข้อมูลของโครงสร้างผลึกแต่ละ รูปดังตารางที่ 2.2

Silicon	Unit cell	a (A°)	c (A°)	c/a	V (A <sup>° 3</sup> )	Calculated	JCPDS
nitride	contents					density	card
						(g/cm <sup>3</sup> )	number*
α	Si <sub>12</sub> N <sub>16</sub>	7.748	5.617	0.7250	292.0	3.184	41-360
β	Si <sub>6</sub> N <sub>8</sub>	7.608	2.9107	0.3826	145.9	3.187	33-1160

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลโครงสร้างผลึกของซิลิคอนในไตรด์

[Hardie and Jack, 1957] และ\* [William and Mark, 1994]

### 2.2.2 การเปลี่ยนแปลงเฟสของ lpha และ eta ซิลิคอนไนไตรด์

Longland [1978], Moulson [1979] และ Jenning [1983] พบว่าเฟสแอลฟาซิลิคอน ในไตรด์ (α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) จะเกิดจากปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส แต่เฟสเบตาซิลิคอนไนไตรด์ (β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) จะ เกิดจากปฏิกิริยาที่เป็นของเหลว Henderson และ Taylor [1975] อธิบายไว้ว่าพันธะของ Si-N จะเกิดเป็น β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ได้ยากและซับซ้อนเมื่อเกิดจากปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส และที่อุณหภูมิสูง กว่าจุดหลอมเหลวของซิลิคอน ซิลิคอนจะเป็นของเหลวทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเฟส เบตาได้ง่ายขึ้น [Jenning et al, 1988] โดย β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเป็นเฟสที่เกิดที่ อุณหภูมิสูง และ α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เป็นเฟสที่เกิดที่อุณหภูมิต่ำ การเปลี่ยนเฟสจาก α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ไปเป็นเฟส β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะพบเมื่อเกิดเฟสของเหลว [Messier,1978; Morgan,1980] แต่การเปลี่ยนเฟสจาก β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ไปเป็น α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ยังไม่มีการค้นพบ

# 2.3 กระบวนการขึ้นรูปรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

กระบวนการขึ้นรูป RBSN เริ่มจากการขึ้นรูปผงซิลิคอน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การอัดด้วยความดันทุกทิศทาง (isostatic pressing) การหล่อแบบ (slip casting) การอัดผ่านหัว แบบ (extrusion) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการอัดธรรมดา (die pressing) ได้ ออกมาเป็นชิ้นงาน silicon compact แล้วนำไปผ่านการเผาผนึกขั้นต้น (pre-sintering หรือ prenitride) ที่อุณหภูมิประมาณ 1200 °C ในบรรยากาศก๊าซอาร์กอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ชิ้นงานสำหรับการเคลื่อนย้ายและการนำไปตัดแต่งให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ต้องการ จากนั้นนำ ชิ้นงานที่ได้ไปทำไนไตรเดชัน (nitridation) ที่อุณหภูมิ 1250-1450 °C ในบรรยากาศไนโตรเจน [John et al, 1985] ให้เกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ [2.1]

$$3 \operatorname{Si}_{(s)} + 2 \operatorname{N}_{2(g)} \rightarrow \operatorname{Si}_{3}\operatorname{N}_{4(s)}$$
 [2.1]

โดยซิลิคอนจะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนได้เป็นซิลิคอนไนไตรด์ (ดังรูปที่ 2.2) ซึ่งจะเกิดเป็น พันธะโควาเลนท์ (Si-N covalent bond) ที่มีความแข็งแรง ประกอบไปด้วยโครงสร้างของ α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> โดยชิ้นงานสุดท้ายที่ได้จะมีรูพรุน (porosity) ประมาณ 15-30 %โดยปริมาตร และ ขนาดของรูพรุนส่วนใหญ่ใน RBSN จะมีขนาดประมาณ 10-100 nm แต่อาจพบรูพรุนขนาดใหญ่ ถึง 250 µm ความหนาแน่นจริง (true density) ของซิลิคอนมีค่า 2.33 g/cm<sup>3</sup> ขณะที่เมื่อเป็น ซิลิคอนไนไตรด์มีค่าเป็น 3.187 g/cm<sup>3</sup>



รูปที่ 2.2 การเกิดซิลิคอนไนไตรด์หลังจากไนไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1150 °C เป็นเวลา 28 นาที [Sheldon, 1995]

ซิลิคอนไนไตรด์ของ RBSN ที่เกิดดังปฏิกิริยาที่ [2.1] อาจเกิดเป็นปฏิกิริยาย่อยดังนี้ [Pehlke and Elliott, 1959]

$3 \operatorname{Si}_{(\mathrm{s})} + 2 \operatorname{N}_{2(\mathrm{g})} \longrightarrow \operatorname{Si}_{3} \operatorname{N}_{4(\mathrm{s})}$	: $\Delta G^{\circ} \sim -723 + 0.315 T \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	[2.2]
$3 \operatorname{Si}_{(I)} + 2 \operatorname{N}_{2(g)} \longrightarrow \operatorname{Si}_{3}\operatorname{N}_{4(s)}$	: $\Delta G^{\circ} \sim -874 + 0.4505T (kJ mol^{-1})$	[2.3]
$3 \operatorname{Si}_{(g)} + 2 \operatorname{N}_{2(g)} \longrightarrow \operatorname{Si}_{3}\operatorname{N}_{4(s)}$	: $\Delta G^{\circ} \sim -2080 + 0.757 T (kJ mol^{-1})$	[2.4]

#### 2.3.1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

อัตราการเกิดปฏิกิริยาของซิลิคอนในไตรด์จะขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ คือ อุณหภูมิและ เวลาในการในไตรเดชัน โดยปฏิกิริยาจะเกิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 เกิดการแพร่ของสารตั้งต้น (reactant) ไปที่บริเวณที่เกิดปฏิกิริยา หรือเกิด การสร้างช่องว่างและการเคลื่อนย้ายของซิลิคอน โดยปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับสารปนเปื้อน (impurities) ที่อยู่ในผงซิลิคอนเริ่มต้น ได้แก่ ฟิล์มออกไซด์ที่ผิว ออกซิเจน ไอน้ำ หรือธาตุ เหล็กที่ปนเปื้อน

ลักษณะที่ 2 เกิดปฏิกิริยาจากสารตั้งต้นที่เป็นแก๊ส ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่บริเวณผิวของ ซิลิคอน โดยปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแก๊สในระหว่างการในไตรเดชัน

การเกิดปฏิกิริยาทั้งสองลักษณะ สามารถแสดงขั้นตอนของอัตราการเกิดปฏิกิริยาใน ไตรเดชัน ดังรูปที่ 2.3 โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะเริ่มแรกปฏิกิริยาจะดำเนินไปอย่างช้าๆ เกิดจากการเคลื่อนย้ายของฟิล์มซิลิคอนมอนอกไซด์ (SiO) ที่ผิวของซิลิคอนด้วยอัตราคงที่ เป็นสัดส่วนกับความดันของไนโตรเจน ในระยะที่สองเป็นระยะที่เกิดนิวเคลียสของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่ผิว ของซิลิคอนปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน และระยะที่ สามปฏิกิริยาจะช้าลงเพราะเป็นระยะที่ในโตรเจนแพร่ผ่านชั้นของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เข้าไปทำปฏิกิริยากับ ซิลิคอนภายในโพรง ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะถูกควบคุมด้วยอัตราการแพร่ [Atkinson et al., 1976]

โดยในระยะที่สองนั้น ช่วงแรกของการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงซิลิคอนยังมีความดัน ย่อย (partial pressure) ต่ำทำให้ซิลิคอนแพร่ออกจากผิวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ไนโตรเจนไม่ สามารถแพร่ซึมเข้าไปทำปฏิกิริยาเป็นซิลิคอนไนไตรด์ได้ ดังนั้นที่อุณหภูมิสูงจะทำให้เกิด นิวเคลียสของซิลิคอนไนไตรด์ได้น้อยและเกิดโครงสร้างของซิลิคอนไนไตรด์ที่หยาบ ส่งผลให้ ระยะต่อไปเกิดได้ช้า เนื่องจากไนโตรเจนต้องแพร่ผ่านซิลิคอนไนไตรด์เข้าไปทำปฏิกิริยา และ ที่อุณหภูมิสูงยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียซิลิคอนอีกด้วย ในระยะนี้โดยปกติควรจะให้อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เพราะต้องการให้มีเวลาสำหรับการเกิดนิวเคลียส (nucleation) ของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ขึ้นทั่วไปที่ผิวของซิลิคอน ซึ่งจะทำได้โดยการควบคุมความดันและอุณหภูมิ จาก การทดลองพบว่าที่สภาวะอุณหภูมิต่ำและความดันสูงจะสนับสนุนให้เกิดนิวเคลียสและเกิด การโตขึ้น (growth) ของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ได้ดีกว่าที่สภาวะอุณหภูมิสูงและความดันต่ำเพราะจะเกิดชั้น ของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่หนากว่า ทำให้ระยะที่สามเกิดขึ้นได้ช้าเนื่องจากไนโตรเจนจะต้องแพร่ผ่านชั้น ของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เป็นระยะทางมากขึ้น



รูปที่ 2.3 การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันกับเวลา [Atkinson et al, 1976]

โดยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความดันไอ เป็นไปดังปฏิกิริยาที่ [2.5]

$$p = A \exp(-L/RT)$$
[2.5]

เมื่อ p คือความดันไอของซิลิคอน, L คือความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (สำหรับ Si = 442 kJ mol<sup>-1</sup> ที่ 1400 °C), R คือค่าคงที่ของก๊าซ, T คืออุณหภูมิในองศาสัมบูรณ์ และ A คือ ค่าคงที่ของการ intetrate จะพบว่าความดันไอขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นอย่างมากและไม่ขึ้นอยู่ กับความดันของก๊าซอื่น



รูปที่ 2.4 การกลายเป็นไอและความดันย่อยสมดุลบนผิวซิลิคอนกับอุณหภูมิ (A) Unvala, 1963 (B) Honig, 1957 (C) Batdorf and Smits, 1959 [Jennings, 1983] รูปที่ 2.4 แสดงอัตราการกลายเป็นไอของซิลิคอนจากสารตั้งต้นบริสุทธิ์ (อัตราจะ เปลี่ยนไปถ้าใช้สารตั้งต้นไม่บริสุทธิ์) จากรูปจะเห็นว่าที่อุณหภูมิสูงจะเกิดการกลายเป็นไอ อย่างรวดเร็ว

อัตราการกลายเป็นไอของซิลิคอน นอกจากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วยังขึ้นอยู่กับความ ดันย่อยเหนือผิวซิลิคอนด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.5 พบว่าที่อุณหภูมิสูงกว่าจะให้อัตราการ กลายเป็นไอของซิลิคอนได้มากกว่า และเมื่อความดันย่อยเพิ่มขึ้นอัตราการกลายเป็นไอของ ซิลิคอนจะลดลงเป็นอย่างมาก



รูปที่ 2.5 ความดันย่อยของซิลิคอนเหนือผิวกับอัตราการกลายเป็นไอของซิลิคอน [Jennings,983]

ความหนาแน่นของนิวเคลียสของซิลิคอนไนไตรด์ที่เกิดในระยะที่สองนั้น (จากรูปที่ 2.3) พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับความดันย่อยของไนโตรเจนและซิลิคอน มี ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นดังปฏิกิริยาที่ [2.6]

$$K = AP_{si}P_{N}e^{-\Delta_{E+/RT}}$$
[2.6]

โดยที่ A คือ activation entropy, P<sub>si</sub> และ P<sub>N</sub> เป็นความดันย่อยบนผิวเมื่อเกิดปฏิกิริยาของ ซิลิคอนและไนโตรเจน ตามลำดับ, ΔE+ คือ activation barrier โดยค่าจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ การที่ P<sub>si</sub> และ P<sub>N</sub> มีความดันสูงจะทำให้เกิดการฟอร์มนิวเคลียสของซิลิคอนไนไตรด์มาก เป็นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเริ่มต้น ความดันย่อยที่สูงของซิลิคอนจะช่วยในการ เกิดปฏิกิริยาในสถานะก๊าซให้เร็วขึ้น ทำให้ได้นิวเคลียสของซิลิคอนไนไตรด์ที่ละเอียดทั่วไป บริเวณผิว เป็นผลทำให้ได้โครงสร้างสุดท้ายของซิลิคอนไนไตรด์ที่ละเอียด และยังช่วยลดการ เกิดรูพรุนในชิ้นงาน [Jennings, 1983]

#### 2.3.2 ผลของสารปนเปื้อน (impurities) ต่อการเกิดรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

สารปนเปื้อนที่อยู่ในผงซิลิคอน ได้แก่ ฟิล์มออกไซด์ที่ผิว ออกซิเจน ไอน้ำ และธาตุ เหล็ก จะช่วยเร่งปฏิกิริยาไนไตรเดชันด้วยกลไกการกลายเป็นไอของซิลิคอน โดยฟิล์มออกไซด์ ที่ผิว ออกซิเจน และไอน้ำ จะเกิดปฏิกิริยากับซิลิคอนกลายเป็นไอซิลิคอนมอนอกไซด์ (silicon monoxide, SiO) ดังปฏิกิริยาที่ [2.7], [2.8] และ [2.9] ตามลำดับ

- $Si_{(s)} + SiO_{2(s)} = 2 SiO_{(g)} : \Delta G_{298}^{\circ} = -143 \text{ kJ}$  [2.7]
- $2 \operatorname{Si}_{(s)} + O_{2(g)} = 2 \operatorname{SiO}_{(g)} : \Delta G_{298}^{\circ} = -477 \text{ kJ}$  [2.8]
- $Si_{(s)} + H_2O_{(g)} = SiO_{(g)} + H_{2(g)} : \Delta G_{298}^{\circ} = -82 \text{ kJ}$  [2.9]

โดยไอซิลิคอนมอนอกไซด์จะเกิดปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนได้เป็นซิลิคอนไนไตรด์ ดัง ปฏิกิริยาที่ [2.10]

$$3 \operatorname{SiO}_{(g)} + 2 \operatorname{N}_{2(g)} = 2 \operatorname{Si}_{3}\operatorname{N}_{4(s)} + 3/2 \operatorname{O}_{2(g)} : \Delta \operatorname{G}_{298}^{\circ} = 502 \text{ kJ}$$
 [2.10]

จากการวิเคราะห์พบว่า SiO จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันที่ความดันย่อยของ ออกซิเจน P<sub>02</sub> ประมาณ 10<sup>-5</sup> atm และความดันย่อยของซิลิคอน P<sub>si</sub> ประมาณ 10<sup>-8</sup> atm ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อมาจะเกิดในพื้นที่ที่มีความดันย่อยของออกซิเจนต่ำ จากการวิจัยของ Moulson [1997] พบว่าความดันย่อยของน้ำที่สูงจะสนับสนุนการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชัน และปฏิกิริยาไนไตรเดชันจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มก๊าซไฮโดรเจนในก๊าซไนโตรเจน

สำหรับธาตุเหล็ก (Iron) ที่ปนเปื้อนในผงซิลิคอนจะเร่งอัตราการในไตรเดชั่นในการ เกิดปฏิกิริยาระยะแรกโดยจะช่วยขจัดฟิล์มออกไซด์ สนับสนุนให้ฟิล์ม SiO<sub>2</sub> กลายเป็นไอ [Atkinson, 1976] และจะมีผลต่อการเกิดเฟสของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> คือ ถ้ามีเหล็กผสมอยู่ในผงซิลิคอน จะทำให้จุดหลอมเหลวของซิลิคอนต่ำลงเกิดเป็นของเหลว FeSi<sub>2</sub> ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดเฟส β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [Atkinson, 1974] และยังช่วยในการกลายเป็นไอของซิลิคอนส่งเสริมให้เกิดเฟส α- Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> อีกด้วย รูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยปรับเปลี่ยนปริมาณ เหล็กที่เติม โดยใช้ซิลิคอนความบริสุทธิ์สูง ทำปฏิกิริยาที่ 1350 °C เป็นเวลา 10 ชั่วโมง พบว่าเมื่อเติมเหล็กมากกว่าประมาณ 1000 ppm ปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจาก การลดลงของอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเฟสแอลฟา



รูปที่ 2.6 เปอร์เซ็นต์การเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของเหล็กที่เติมในผงเริ่มต้น [Moulson,1979]

### 2.3.3 ผลของก๊าซต่อการเกิดรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

Moulson, [1979] ได้อธิบายผลของก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนต่อการกลายเป็นไอ และการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันของซิลิคอนดังกล่าวไว้ในสมการที่ [2.8] และ [2.10]

$$2 H_2 O = 2 H_2 + O_2$$
;  $\Delta G^{\circ}_{298} = 314 \text{ kJ}$  [2.11]

จากปฏิกิริยาที่ [2.11] พบว่าไฮโดรเจนจะลด P<sub>o2</sub> ลงเมื่อมี H<sub>2</sub> เกินในปฏิกิริยาที่ [2.11] ปฏิกิริยาจะดำเนินไปทางซ้ายและจะใช้ออกซิเจน ดังนั้นไฮโดรเจนจะช่วยขจัดชั้นของ ซิลิกาที่อยู่บนผิวของซิลิคอน เมื่อเติมไฮโดรเจน 0.1 ถึง 10% ในไนโตรเจนปฏิกิริยา ในไตรเดชันจะเพิ่มขึ้น โดย H<sub>2</sub> จะขัดขวางการเกิดไนโตรเจนอะตอมและส่งเสริมการรีดักชัน (reduction) ของ SiO ดังนั้นก๊าซไฮโดรเจนไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการเกิด α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> แต่ยังลด อัตราการเกิด β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ดังนั้นถ้าขัดขวางการเกิดในโตรเจนอะตอมในการเกิดปฏิกิริยา ระยะแรกได้ จะสามารถควบคุมการเกิดนิวเคลียสของซิลิคอนไนไตรด์ในระยะที่สองได้ ส่งผล ให้โครงสร้างซิลิคอนไนไตรด์ละเอียดขึ้น และยังทำให้เกิดเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เพิ่มขึ้น อัตราส่วนของ เฟส α/β จะเพิ่มขึ้น



รูปที่ 2.7 ผลของการผ่านก๊าซต่อการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชัน [Mostafa and Arvind, 1996]

ผลของอัตราเร็วในการผ่านก๊าซ (Gas-flow rate) ต่อการเกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันยัง ไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจน Jenning และ Richman [1976] อธิบายว่าการผ่านก๊าซ ในโตรเจนเร็วจะนำซิลิคอนออกไซด์ที่เป็นไอออกไป ทำให้การเกิด α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ลดลง เนื่องจาก α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เกิดจากปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส และทำให้ความดันย่อยลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดรูพรุนและ เกิดซิลิคอนไนไตรด์ที่หยาบ (ลดความแข็งแรงทางกล) ดังนั้นการเกิด turbulence จากการ ผ่านก๊าซ จะช่วยให้ก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในรูพรุนได้ดีกว่า จากรูปที่ 2.7 แสดงผลของการผ่าน ก๊าซไนโตรเจน 95% ไฮโดรเจน 5% ที่อุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 1350 °C จะเห็นว่าในชั้นแรก ของปฏิกิริยา ความเร็วในการผ่านก๊าซจะไม่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา และพบว่าเมื่อความเร็ว ในการผ่านก๊าซเพิ่มขึ้นจะทำให้การเกิดปฏิกิริยาลดลง

#### 2.3.4 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

2.3.4.1 ผลของขนาดผงต่อการเกิดปฏิกิริยาของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

Yasutomi และคณะ [1997] ได้ทำการศึกษากลไกการเกิดไนไตรเดชันของอนุภาค ซิลิคอน พบว่าชั้นของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะบางลงเมื่อขนาดผงลดลง และชั้นของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ เริ่มเกิดไนไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1100-1250 °C ระหว่างผงซิลิคอนและชั้นของออกไซด์ด้าน นอก พบว่าชั้นมีความบางประมาณ 10-50 nm มีผลทำให้การเกิดไนไตรเดชันซ้าลง ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 a) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของผงซิลิคอนและชั้นที่เกิดในไตรด์ และ b) อิทธิพล ของขนาดผงซิลิคอนต่ออัตราการเกิดชั้นในไตรด์ [Yasutomi et al., 1997]

Lee และคณะ [2001] พบว่าขนาดผงซิลิคอนที่มีขนาดเล็ก (2 ไมครอน) จะมีพื้นที่ ผิวและมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าผงขนาดใหญ่ (7 ไมครอน) แต่จะได้ความหนาแน่นหลัง การอัดขึ้นรูปมากกว่าผงขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อผ่านการในไตรเดชันพบว่าผง ขนาดเล็กจะมีเฟสของซิลิคอนเหลืออยู่มากกว่า ในขณะที่ผงขนาดใหญ่มีรูพรุนเหลืออยู่ จำนวนมากกว่า โดยผงขนาดเล็กจะมีรูพรุนละเอียดขนาด 0.1-0.4 ไมครอน ขณะที่รูพรุนที่ พบในผงขนาดใหญ่จะโตกว่าและมีปริมาณมากกว่า แงขนาดเล็กจะมีอัตราการเกิดในไตรเดชันได้ต่ำกว่าขนาดผงใหญ่ [Lee et al., 2001] เนื่องจากว่ามีความหนาแน่นของ green density มากกว่า และมีชั้นของซิลิกาปก คลุมที่ผิวในปริมาณมากกว่าจึงทำให้ระดับการในไตรเดชันต่ำกว่า โดยระดับการเกิดไนไตร เดชันจะลดลงเมื่อปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลมากกว่าผลจากขนาดผง เช่นในกรณี เมื่อผงขนาดใหญ่มีปริมาณออกซิเจนมากกว่าผงขนาดเล็ก จะทำให้อัตราการเกิดในไตรเด ชันต่ำกว่า แต่ถ้าปริมาณออกซิเจนเท่ากันผงขนาดเล็กกว่า จะเกิดอัตราการในไตรเดชันได้ ดีกว่า

ขนาดของอนุภาคที่เล็กจะเพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยา โดยออกซิเจนจำนวน น้อยๆ บริเวณผิวของซิลิคอนสามารถเปลี่ยนในโตรเจนอะตอม (active nitrogen) ไปเป็น ในโตรเจนโมเลกุลได้ดังปฏิกิริยาที่ [2.12] และ [2.13]

$$N + O_2 = NO + O$$
 [2.12]

$$N + NO = N_2 + O$$
 :  $\Delta H_{298}^\circ = -313 \text{ kJ}$  [2.13]

ไนโตรเจนโมเลกุลจะส่งเสริมให้เกิดเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกิดจาก ปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส และไนโตรเจนอะตอมจะส่งเสริมให้เกิดเฟส β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ดังนั้นการที่มีพื้นที่ ผิวมากจะส่งผลให้เกิดเฟสแอลฟาซิลิคอนไนไตรด์ขึ้นบริเวณพื้นที่ทำปฏิกิริยา (พื้นที่ผิวที่ ปกติจะถูกปกคลุมด้วยออกไซด์) ทำให้อัตราส่วนของ α/β เพิ่มขึ้น [Jennings, 1983]

α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิดได้ในทั้ง 2 ขนาด โดยไม่คำนึงถึงขนาดผงเริ่มต้น [Lee et al., 2001] ซึ่งสัดส่วนของ β/(α+β) จะขึ้นกับขนาดของผง โดยที่ผงขนาดใหญ่จะพบว่า α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เปลี่ยนไปเป็น β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ได้เร็วกว่าผงขนาดเล็ก เพราะว่าผงขนาดใหญ่มีเฟส ของเหลวมากกว่านั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากผงขนาดใหญ่จะมีชั้นของซิลิกาปกคลุมน้อยกว่าและ จากการกระจายตัวของ additive เป็นแบบ heterogeneous มากกว่าผงขนาดเล็กถึงแม้ว่า ปริมาณ additive จะเท่ากัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเฟสของเหลวมากขึ้นทำให้ได้สัดส่วนของ β/ (α+β) เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

#### 2.3.4.2 ผลของขนาดผงต่อสมบัติของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

Lee และคณะ [2001] พบว่า gas-pressure-sintering RBSN (GPSed-RBSN) ที่ มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นใหญ่กว่าจะให้ค่าความแข็ง (Hardness) ที่ต่ำกว่า แต่ว่าให้ค่า Fracture strength และค่า Fracture toughness มากกว่าทั้งนี้เนื่องจากเกิดโครงสร้างที่ เป็นแท่งยาว (rod-like) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของ รอยร้าว (crack bridging) และเกิดการสะท้อนของรอยร้าว (crack deflection) บนพื้นผิวที่ แตกหักได้ดี

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ ได้ดังตารางที่ 2.3



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวแปร	อิทธิพลต่อ $oldsymbol{lpha}_{-}$ Si $_{_3}N_{_4}$	อิทธิพลต่อ β–Si <sub>3</sub> N₄	อิทธิพลต่ออัตราการ
			เกิดปฏิกิริยา
ขนาดของผง	อัตราส่วนของ $lpha/eta$	อัตราส่วนของ $eta$ / $lpha$	อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
(particle size)	เพิ่มขึ้น เมื่อลดขนาดของผง	เพิ่มขึ้น เมื่อขนาดของ	ด้วยการลดขนาดของผง
		ผงเพิ่มขึ้น	
อุณหภูมิ	อุณหภูมิต่ำ ช่วยให้เกิด	อุณหภูมิสูงช่วยให้เกิด	อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
(Temperature)	α–Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> :โครงสร้าง	β–Si <sub>3</sub> N₄ :โครงสร้าง	เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
	ละเอียด	หยาบ	
ความดัน	เนื้อของผลิตภัณฑ์จะ		ระยะแรกของการเกิดปฏิกิริยา
(Pressure)	ละเอีย <mark>ดเมื่อเพิ่มความ</mark> ดัน		เพิ่มขึ้น และปฏิกิริยาระยะที่
			สามลดลง เมื่อเพิ่มความดัน
สารปนเปื้อน	สารปนเปื้อนส่งผลต่อการ	สารปนเปื้อนส่งผลต่อ	เพิ่มการเกิดปฏิกิริยาขั้นตอน
(impurity)	เกิด SiO ซึ่งช่วยเพิ่มการ	การเก <mark>ิดเฟสข</mark> องเหลว	สุดท้าย และทำให้ขั้นตอนแรก
(ออกไซด์ที่ผิว,	เกิด <b>α</b> –Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	ซึ่งช่วยให้เกิดเฟล	ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาสั้นลง
ออกซิเจน, ไอน้ำ)		$\beta$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	
ไฮโดรเจน	เติม H <sub>2</sub> จะเพิ่มอัตราส่วน	The second	อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
(Hydrogen)	α/β	12 Ja	เมื่อเติม H <sub>2</sub>
เวลา	ระยะแรกของปฏิกิริยาจะ	ระยะยาวจะทำให้	อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลง
(Time)	ช่วยให้อัตราส่วน $lpha/eta$	อัตราส่วน $lpha/eta$ ลดลง	เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
	เพิ่มขึ้น	6	
ระดับความดัน	เนื้อของผลิตภัณฑ์ละเอียด	<u> </u>	มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ของออกซิเจน	ขึ้นเมื่อเพิ่มความดันของ		เกิดปฏิกิริยาเล็กน้อย ขั้นตอน
(Oxygen	ออกซิเจน		แรกของปฏิกิริยายาวขึ้น เพิ่ม
potential)	กาบัยเวิย	เยเมริกา	การเกิดปฏิกิริยาในขั้นสุดท้าย
อัตราการให้ความ	อัตราการให้ความร้อนมีผล		ไม่ซัดแจ้ง ปฏิกิริยาขั้นตอนแรก
ร้อน (Heating	อย่างเด่นชัดต่ออัตราส่วน		จะส่งผลปฏิกิริยาในขั้นตอนหลัง
rate)	α/β	IN LIVE	BALL
ขนาดของชิ้นงาน	ไม่ซัดแจ้ง		อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับ
(Compact size)			เกรเดียนของอุณหภูมิและ
			เกรเดียนของส่วนผสมของแก๊ส
			ขณะทำปฏิกิริยา ซึ่งจะเพิ่มขึ้น
			เมื่อขนาดชิ้นงานเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2.3 สรุปอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

[กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543]

#### 2.4 การเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนในไตรด์

## 2.4.1 หลักเคมีความร้อนของการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนในไตรด์ (Thermochemical aspects of oxidation of silicon nitride)

ซิลิคอนในไตรด์มีพฤติกรรมการเกิดออกซิเดชันที่เด่นชัด 2 ชนิดเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น นั่น คือ พาสสีบออกซิเดชัน ("passive" oxidation) และ แอคทีบออกซิเดชัน ("active" oxidation) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความดันของออกซิเจนที่อยู่ล้อมรอบ

พาสสีบออกซิเดชัน ("passive" oxidation) เป็นการเกิดออกซิเดชันชนิดที่หนึ่ง จะเกิด เมื่อมีความดันออกซิเจนสูง โดยเกิดชั้นของซิลิกา (silica, SiO<sub>2</sub>) ขึ้นบนผิวของซิลิคอนไนไตรด์ เป็นไปตามปฏิกิริยาที่ [2.14]

$$Si_{3}N_{4}(s) + 3O_{2}(g) \longrightarrow 3SiO_{2}(s) + 2N_{2}(g)$$
 [2.14]

เมื่อพิจารณาสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ จะพบว่ามีเฟสของซิลิคอนออกซีไนไตรด์ (silicon oxy-nitride, Si<sub>2</sub>ON<sub>2</sub>) เกิดขึ้นในช่วงกลางขณะเกิดออกซิเดชันด้วย [S.C. Singhal, 1976] แต่อย่างไรก็ตาม Si<sub>2</sub>ON<sub>2</sub> ที่เกิดขึ้นจะเกิดออกซิไดซ์ต่อไปอีกจนได้เป็นซิลิกาในที่สุด [T.N. Zabruskova, 1971] โดยในการเกิดชั้นของซิลิกาบนผิวของซิลิคอนไนไตรด์ถือเป็นพาสสี บออกซิเดชัน (น้ำหนักซิลิคอนไนไตรด์มีค่าเพิ่มขึ้น) ซึ่งกรณีดังกล่าวจะทำให้การเกิดออกซิเดชัน ต่อไปถูกจำกัดลง จึงถือเป็นตัวต้านทานการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation-resistance) ที่ยอด เยี่ยมไปในตัวด้วย

ในระหว่างการเกิดออกซิเดชัน จากสมการ [2.14] พบว่าจะเกิดแก๊สไนโตรเจนบริเวณ รอยต่อระหว่างเฟสของซิลิคอนไนไตรด์กับซิลิกา (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> - SiO<sub>2</sub> interface) เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ได้จากตาราง JANAF [D.R. Stull, 1971] แสดงค่าความดันแก๊สไนโตรเจน เป็น 7.5 x 10<sup>37</sup> และ 4.3 x 10<sup>23</sup> atm ที่อุณหภูมิ 1200, 1800 K ตามลำดับ ซึ่งค่าถูกคำนวณมา จากสมการ [2.14] ที่ออกซิเจนความดัน 1 บรรยากาศ การประเมินค่าแก๊สไนโตรเจนจาก รอยต่อระหว่างเฟสนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าไนโตรเจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูพรุนและรอย แยกในผิวของออกไซด์ ในส่วนของพาสสีบออกซิเดชัน จะเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เกิดออกซิไดซิ่งสูงๆ ส่วนชนิดที่ สองคือ แอคทีบออกซิเดชัน ("active" oxidation) (น้ำหนักซิลิคอนไนไตรด์มีค่าลดลง) จะ สามารถเกิดได้ในสภาวะที่มีความดันออกซิเจนต่ำ (low oxygen partial pressure) เป็นไป ตามปฏิกิริยาที่ [2.15]

$$2 \operatorname{Si}_{3} \operatorname{N}_{4}(s) + 3 \operatorname{O}_{2}(g) \longrightarrow 6 \operatorname{SiO}(g) + 4 \operatorname{N}_{2}(g)$$
 [2.15]

โดยในการเกิดแอคทีบออกซิเดชัน ("active" oxidation) วัสดุจะมีการสูญเสียออกซิเจน อย่างต่อเนื่องที่ผิว เกิดเป็นแก๊สซิลิคอนมอนอกไซด์ (silicon monoxide, SiO) ซึ่งเกิดจากการที่ ซิลิกาทำปฏิกิริยากับซิลิคอนไนไตรด์ เกิดเป็นแก๊สซิลิคอนมอนอกไซด์ ดังปฏิกิริยาที่ [2.16]

 $Si_{3}N_{4}(s) + 3 SiO_{2}(g) \longrightarrow 6 SiO(g) + 2 N_{2}(g)$  [2.16]

จากปฏิกิริยาที่ [2.16] เมื่อซิลิกาที่ผิวกลายเป็นแก๊สซิลิคอนมอนอกไซด์จนหมด ก็จะทำ ให้เกิดออกซิเดชันดังปฏิกิริยาที่ [2.15] ดำเนินไปแทน ขอบเขตของ "active" และ "passive" สำหรับการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนไนไตรด์เป็นค่าที่ได้จากคำนวณโดยใช้สมมุติฐานของ Wagner [1958] ดังแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ขอบเขตสำหรับการเกิดออกซิเดชันแบบ passive และ active ของซิลิคอนไนไตรด์ [Singhal, 1976]

### 2.4.2 การเกิดออกซิเดชันของผงซิลิคอนไนไตรด์บริสุทธิ์

มีงานวิจัยมากมาย เกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนในไตรด์บริสุทธิ์ Krasotkina [1967] พบว่าผงซิลิคอนในไตรด์จะถูกออกซิไดซ์ในอากาศที่อุณหภูมิระหว่าง 1100 °C ถึง 1500 °C โดยพบซิลิกาเกิดขึ้นที่ผิวเป็นส่วนใหญ่, Goursat และคณะ [1972, 1973] ได้ศึกษา การเกิดออกซิเดชันเมื่อมีปริมาณของเฟส lpha-Si N, และ eta- Si N, แตกต่างกันในความดัน ืออกซิเจนที่ (P<sub>∩2</sub>) 2.2 x 10<sup>-1</sup> ถึง 2.1 x 10<sup>-2</sup> atm อุณหภูมิ 1100 °C ถึง 1300 °C โดยผงใน ขั้นตอนแรกจะถูกเก็บรักษาให้อยู่ในอุณหภูมิที่มีความเป็นสูญญากาศสูง เพื่อให้ผงปราศจาก ออกไซด์อื่นๆ เกาะบนผิวก่อนการทดสอบออกซิเดชัน พบว่าการเกิดออกซิเดชันในช่วงแรก ดำเนินไปโดยขั้นการควบคุมด้วยปฏิกิริยา (reaction-controlled stage) มีค่าพลังงานกระตุ้น เท่ากับ 293 kJ/mol ทั้งนี้จะขึ้นกับค่าพลังงานพันธะของ Si-N รวมทั้งพบว่า α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิด ออกซิไดซ์ได้เร็วกว่า β- Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ในระยะการเกิดออกซิเดชันช่วงที่เป็นเส้นตรงเริ่มต้น (initial linear region) ซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับการทดลอง CVD- Si<sub>2</sub>N, ที่ทดลองโดย Franz และ Langheinrich [1971,1972] อย่างไรก็ตามในการศึกษาการเกิดออกซิเดชันในช่วงเส้นตรง ้เริ่มต้นของ Si<sub>2</sub>N, นั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง แต่สันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการที่เกิดชั้น ออกไซด์ขึ้นที่ผิวก่อนเริ่มต้นการทดลองออกซิเดชัน โดยออกไซด์ที่เกิดนั้นจะเพิ่มแนวความหนา เมื่อเกิดออกซิเดชันขึ้น เมื่อเกิดออกซิเดชันผ่านชั้นความหนาดังกล่าวจะอาศัยขบวนการควบคุม ด้วยการแพร่ (diffusion-controlled) มีผลทำให้เกิดพฤติกรรมออกซิเดชันเป็นเส้นโค้งพาราโบ ลิค (parabolic oxidation) ซึ่งผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้

Goursat และคณะ [1972, 1973] ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมออกซิเดชันแบบเส้นโค้งพารา โบลิคจะเกิดหลังจากช่วงเส้นตรงเริ่มต้นเกิด โดยในช่วงเส้นโค้งพาราโบลิคนี้พบว่าอัตราการเกิด ออกซิเดชันจะเท่ากันถึงแม้ชนิดของผงซิลิคอนไนไตรด์ต่างกันและจะไม่ขึ้นกับ P<sub>o2</sub> รวมทั้ง ยืนยันว่า P<sub>N2</sub> ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดออกซิเดชันด้วย โดย P<sub>N2</sub> จะเกิดขึ้นสูงมากเฉพาะที่รอยต่อ ระหว่างเฟสของไนไตรด์กับออกไซด์ (nitride/oxide interface) นั่นทำให้มีการเปลี่ยนแปลง P<sub>N2</sub> ที่ล้อมรอบพียงไม่กี่บรรยากาศ จึงไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการเกิดเส้น โค้งพาราโบลิค (K<sub>p</sub>) ได้จากการแปลงข้อมูลความหนาของออกไซด์ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ดัง แสดงในรูปที่ 2.10 ซึ่งมีค่าพลังงานกระตุ้น (activation energy) เท่ากับ 146 kJ/mol โดยค่า พลังงานกระตุ้นนี้เป็นค่าที่บอกถึงการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนไนไตรด์บริสุทธิ์ที่ถูกควบคุม ด้วยการแพร่ของออกซิเจนผ่านชั้นของซิลิกา พบว่าค่าพลังงานกระตุ้นมีความแตกต่างกันไม่
มาก ทั้งนี้อาจจะเกิดจากอิทธิพลเล็กน้อยของในโตรเจนต่ออัตราการแพร่ของออกซิเจน หรือ จากผลน้อยมากของความดันออกซิเจนต่ออัตราการแพร่

Horton [1969], Fitzer และ Ebi [1974] ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเกิด ออกซิเดชันเป็นเส้นโค้งพาราโบลิคของผงซิลิคอนไนไตรด์ในออกซิเจนความดัน 1 atm ค่าคงที่ ของอัตราเส้นโค้งพาราโบลิค (K<sub>p</sub>) หาได้จากการทดลองดังแสดงในรูปที่ 2.10 ในอากาศแห้งที่ อุณหภูมิระหว่าง 1065-1340 °C Hortor ได้ค่าพลังงานกระตุ้นเท่ากับ 255 kJ/mol ในขณะที่ อุณหภูมิระหว่าง 1060-1600 °C Fitzer และ Ebi พบว่าการเกิดออกซิเดชันมี 3 ช่วงจะมีค่า พลังงานกระตุ้นที่แตกต่างกัน 3 ค่า โดยที่อุณหภูมิระหว่าง 1000-1200 °C จะเกิดซิลิกาด้วย พลังงานกระตุ้น 151 kJ/mol ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จาก Goursat และคณะ [1972, 1973] อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิระหว่าง 1200-1400 °C จะเกิดชั้นของออกไซด์ที่ ประกอบด้วย คริสโตบาไลท์ (cristobalite) และเกิดออกซิเดชันขึ้น ด้วยพลังงานกระตุ้น 90 kJ/mol ขณะที่อุณหภูมิระหว่าง 1400-1600 °C พบว่าอัตราการเกิดออกซิเดชันเพิ่มขึ้นสูงมาก เช่นเดียวกันกับค่าพลังงานกระตุ้น เนื่องจากที่ผิวมีการหลอมของ SiO<sub>2</sub> เกิดขึ้น



รูปที่ 2.10 ค่าคงที่อัตราเส้นโค้งพาราโบลิคของการเกิดออกซิเดชันของซิลิคอนไนไตรด์ ที่มีรูปแบบต่างกัน, E เป็นพลังงานกระตุ้น (kJ/mol) [Goursat et al., 1972, 1973] ข้อมูลการเกิดออกซิเดชันของผงซิลิคอนในไตรด์บริสุทธิ์ สรุปได้ดังรูปที่ 2.10 จาก รูปแสดงอัตราการเกิดออกซิเดชันและพลังงานกระตุ้นมีค่าที่ต่างกันมาก ทั้งนี้เพราะว่าแต่ละค่า ได้จากผู้ตรวจสอบที่ต่างกัน ผลที่แตกต่างเหล่านี้อาจเกิดจากการที่ Goursat และคณะ ได้ คำนึงถึงพื้นที่ที่ลดลงเมื่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของผงซิลิคอนในไตรด์ดำเนินไป ขณะที่ Horton, Fitzer และ Ebi ได้ละเลยการพิจารณาพื้นที่ที่ลดลงเมื่อคำนวณหาอัตราการเกิด ออกซิเดชัน

อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดออกซิเดชันที่ไม่เท่ากันก็สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความ แตกต่างกันทางด้าน โครงสร้างของผงซิลิคอนไนไตรด์ (amorphous, เฟส α หรือ เฟส β), ความพรุนและความหนาแน่นของผง และเนื่องจากความแตกต่างกันในเงื่อนไขของการทดลอง ด้วย ตัวอย่างเช่น ปริมาณความชื้นในออกซิเจนที่ใช้, ปริมาณของออกไซด์ที่ผิวก่อนทดลอง ออกซิเดชัน และวิธีการให้อุณหภูมิออกซิเดชันกับชิ้นงาน ปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิด พลังงานกระตุ้นสำหรับการเกิดออกซิเดชันเป็นเส้นโค้งพาราโบลิคที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น การ เปลี่ยนจาก extrinsic เป็น intrinsic จะถูกควบคุมด้วยการแพร่ โดยการเพิ่มอุณหภูมิ ซึ่ง พลังงานกระตุ้นมักจะขึ้นกับความบริสุทธิ์ของวัสดุและอุณหภูมิ [Kofstad, 1966] รูปผลึกของซิ ลิกาจะขึ้นกับอุณหภูมิและสารปนเปื้อนซึ่งมีผลต่อการเกิดนิวเคลียสของผลึก

#### 2.4.3 การคำนวณหาความสัมพันธ์จากการเกิดออกซิเดชัน

Kainasskii และคณะ [1960] ได้เสนอการเกิดออกซิเดชัน ดังสมการที่ [2.14]

 $Si_3N_4 + 3O_2 \longrightarrow 3SiO_2 + 2N_2$ 

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดออกซิเดชัน แสดงถึงความแตกต่างของน้ำหนักระหว่าง Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ 3 SiO<sub>2</sub> การเกิดออกซิเดชันที่สมบูรณ์ของตัวอย่างเป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ประมาณ 28.5%

การเกิดออกซิเดชันที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดคือ สมการพาราโบลิคแบบผสม (mixed parabolic equation) หรือเรียกว่า สมการอัตราพาราโบลิคทั่วไป (general parabolic rate equation) ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังสมการที่ [2.17]

$$\Delta W^2 + A \Delta W = kt + c \qquad [2.17]$$

เมื่อ ΔW คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยพื้นที่, t คือเวลา และ A, k, c คือค่าคงที่ สำหรับ ฟิล์มออกไซด์ที่บางมาก (ΔW มีค่าน้อย) ทำให้พจน์แรกในสมการ [2.17] เป็นค่าที่น้อยมากจน ละเลยได้ จากสมการทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นเส้นตรง ซึ่งนำไปใช้ในการอธิบายการ เกิดปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมด้วยผิว (surface-controlled reaction) สำหรับฟิล์มออกไซด์ที่หนา (ΔW มีค่ามาก) ทำให้พจน์ที่สองในสมการ [2.17] เป็นพจน์ที่น้อยจนละเลยได้ ทำให้พฤติกรรม การเกิดออกซิเดชันเป็นเส้นโค้งพาราโบลิค จากสมการที่ [2.17] จะได้เป็นสมการที่ [2.18]

$$\Delta W^2 = k_p t + c \qquad [2.18]$$

เมื่อ k<sub>p</sub> คือค่าคงที่อัตราเส้นโค้งพาราโบลิค (parabolic rate constant) อัตราการ เกิดปฏิกิริยาของการเกิดออกซิเดชันเป็นเส้นโค้งพาราโบลิคใช้อธิบายการแพร่ของบาง species หรือเรียกว่า การควบคุมด้วยการแพร่ (diffusion-controlled)



รูปที่ 2.11 ความสัมพันธ์ของ ∆W<sup>2</sup> กับเวลา ของการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่างๆ [Kainasskii et al.,1960]

จากรูปที่ 2.11 พบว่าในออกซิเจนแห้งจะมีอัตราการเกิดออกซิเดชันได้เร็วกว่าในอากาศ แห้ง ซึ่งกราฟได้จากการนำค่า  $\Delta W^2$  ที่เกิดขึ้นที่เวลาต่างๆ มา plot โดยสามารถหาค่า k<sub>p</sub> ได้ จากค่าความชันของเส้นโค้งพาราโบลิค จากนั้นนำค่าที่ได้ไป plot กราฟระหว่าง k<sub>p</sub> และ อุณหภูมิดังรูปที่ 2.12 ซึ่งจะสามารถหาค่าพลังงานกระตุ้นได้จากความสัมพันธ์แบบ Arrhenius



รูปที่ 2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า k<sub>p</sub> และอุณหภูมิ [Kainasskii et al.,1960]

Deal และคณะ [1965] พบว่าการเกิดออกซิเดชันมีความสัมพันธ์เป็นแบบโค้งพาราโบลา ดังสมการที่ [2.17] และ [2.18] เช่นกัน

#### 2.4.4 ผลการเกิดออกซิเดชันต่อสมบัติของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์

การเกิดออกซิเดชันของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ในอากาศ จะเริ่มเกิดที่อุณหภูมิ 800 °C และเกิดชั้นป้องกันบางๆ ขึ้นจากการเกิดซิลิกา (SiO<sub>2</sub>) ขึ้นที่ผิวของ RBSN ดังปฏิกิริยาที่ [2.14]

Haggerty และคณะ [1989] พบว่าอัตราการเกิดออกซิเดชันเฉลี่ย ขึ้นกับอุณหภูมิใน ทุกชิ้น งาน ดังแสดงในรูปที่ 2.13 โดยที่ชิ้นงานของ Davidge และคณะจะมีรูพรุนน้อยที่สุด รองลงมาคือ RBSN ของ Porz และ Thummier และชิ้นงาน RBSN ของ Haggerty และคณะ มีรูพรุนมากที่สุดคือ 23% พบว่าชิ้นงานที่มีรูพรุนต่ำจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่า



รูปที่ 2.13 อัตราการเกิดออกซิเดชันของ RBSN [Haggerty et al.,1989]

Horton [1969] พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวอย่างที่มีขนาดผง แตกต่างกันมาก จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อน้ำหนักของผงมีค่าเท่ากัน หรือกล่าว ได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแต่ละขนาดผงจะเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักของ ตัวอย่าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพื้นที่ผิวของทุกขนาดผงมีค่าประมาณเท่ากัน และจะสามารถเป็น จริงได้ถ้าทุกอนุภาคมีการเผาผนึก (sintering) จากผงขนาดเล็กที่ขนาดใกล้เคียงกันให้ติดกัน เป็นก้อน (agglomerate)



รูปที่ 2.14 Fracture strength ของชิ้นงานที่ถูกออกซิไดซ์ [Haggerty et al.,1989]

Haggerty และคณะ [1989] พบว่าการวางชิ้นงานไว้ที่อุณหภูมิห้องจะไม่ทำให้ความ แข็งแรงลดลง เพราะว่าชิ้นงานมีชั้นฟิล์มออกไซด์บางๆ ป้องกันการเกิดออกซิเดชันไว้ เมื่อเกิด ออกซิเดชัน ความหนาของชั้นออกไซด์เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงต่อการแตกหักจะลดลง ได้ ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 2.14 พบว่า Fracture strength ของชิ้นงานที่ถูกออกซิไดซ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อ flaw มีขนาดเล็กลง คำนวณจากสมการที่ [2.19]

$$\sigma_{f} = \frac{Z K_{c}}{Y (a^{1/2})}$$
[2.19]

เมื่อ **o**<sub>f</sub> คือค่า fracture strength, Y คือ geometric constant, Z คือค่าคงที่ของ flaw ที่เป็นรูปวงรี, a คือค่าความลึกของ flaw และ K<sub>c</sub> คือค่า fracture toughness ของวัสดุ

Gogotsi และ Grathwohl [1993] พบว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดออกซิเดชันทำ ให้ความเค้น (stress) เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 2.15 แต่ในทางตรงกันข้ามการเกิดอกซิเดชันของ ซิลิคอนในไตรด์จะกระทบกับสมบัติของวัสดุที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น การแปรรูป (deformation), โพรง (cavitation) และรอยร้าว (cracking)



รูปที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและน้ำหนักของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น [Gogotsi and Grathwohl, 1993]

#### 2.5 การใช้งานของซิลิคอนไนไตรด์

ซิลิคอนในไตรด์เป็นเซรามิกส์ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย เนื่องจากมีสมบัติที่ดีในด้าน ต่างๆ จากสมบัติด้านความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานการสึกกร่อนของซิลิคอนไนไตรด์ การใช้งานส่วนใหญ่จึงใช้งานเป็นพวกอุปกรณ์ตัด (cutting tools) ลูกบด (grinding media) หัวฉีด พ่นทราย (grit blasting nozzles) จากสมบัติด้านความต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง และการนำความร้อนที่ดี ซิลิคอนไนไตรด์สามารถนำไปใช้งานในเตา (burner) หัวฉีดงานเชื่อม (welding nozzles) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers)



รูปที่ 2.16 ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ผลิตจากซิลิคอนในไตรด์ (Trademark T&N plc)

รูปที่ 2.16 แสดงตัวอย่างชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ผลิตจากซิลิคอนไนไตรด์ (Trademark T&N plc) นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องจักร ได้แก่ วาล์ว (valves) เทอร์โบซาร์ทเจอร์โรเตอร์ (turbo-charger rotor) แก๊สเทอร์ไบน์ (gas turbine) และ สปาร์คปลั๊ก (spark plugs) และซิลิคินไนไตรด์ยังมีความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดที่ดี จึงสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ทนความร้อนในเตา, thermocouple shielding tube ใน อุตสาหกรรมโลหะ, ส่วนประกอบของ handing molten aluminum, combustion chambers ฯลฯ [William and Mark, 1994]

## บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

#### 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

# 3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การบดและขึ้นรูปงานซิลิคอน

- 3.1.1.1 Disc Grinding Mill Model HSM 100 A
- 3.1.1.2 Retsch Sieve มาตรฐาน ASTM E 11 ขนาด 60, 120, 325 และ 400 mesh
- 3.1.1.3 Attritor Model 01-HD
- 3.1.1.4 Hydraulic Pressing
- 3.1.1.5 Cold-Isostatic Pressing
- 3.1.1.6 Furnance 1500 Model LTF 15/75
- 3.1.1.7 Sinterring Furnace HT 1600

## 3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตชิ้นงาน

- 3.1.2.1 Drilling Machine
- 3.1.2.2 Machine Tool Plant-Silven CU 500 M
- 3.1.2.3 Cutting Machine Struers Accutom-5

#### 3.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบ

- 3.1.3.1 Grindosonic Model MK 51
- 3.1.3.2 Universal Testing Machine Instron 4502
- 3.1.3.3 Micro Hardness Tester MHT-10 Anton Paar
- 3.1.3.4 X-Ray Diffractometer System JDX-3530
- 3.1.3.5 Optical Microscope
- 3.1.3.6 Scanning Electron Microscope (JEOL)

#### 3.2.1 ผงโลหะซิลิคอน

ีแงวัสดุที่ใช้ในการทดลองคือผง silicon metal ซึ่งมีส่วนผสมดังตารางที่ 3.1

ตารา.เท	21	ส่วายสามหลักของ	cilicon mot	ป ตรกดสดงปิดย	X ray fluor	osconco (YPE)
	5.1	01 9 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	SIICOLLINE	AL ALA 9.464 CITI PALC	I A-lay huule	

ตัวอย่าง	ปริมาณธาตุ (%โดยน้ำหนัก)					
	Si	AI	Са	Fe	W	
ผง Silicon Metal	99.11	0.14	0.47	0.17	0.10	

Trace element: Na, Mg, K, Ti, Cr, Mn

วัดขนาดผงซิลิคอนที่บดได้ด้วยเครื่อง Mastersizer ในสภาวะน้ำกลั่นธรรมดาโดยได้ ขนาดผงสรุปดังตารางที่ 3.2 และแสดงลักษณะการกระจายตัวของผงดังรูปที่ 3.1 (ข้อมูลการ วัดด้วยเครื่อง Mastersizer แสดงในภาคผนวก ก.)

ตารางที่ 3.2 ขนาดของผงซิลิคอน 3 ขนาดที่วัดได้จากเครื่อง Mastersizer

Powder	Partic	cle size distrib	Specific Surface Area	
( <b>µ</b> m)	d10	d50	d90	(m²/g)
3.26	0.76	3.26	17.42	1.99
6.23	1.14	6.23	20.43	1.27
11.87	4.28	11.87	30.88	0.32



รูปที่ 3.1 การกระจายตัวของขนาดผงซิลิคอนทั้ง 3 ขนาด ที่วัดได้จากเครื่อง Mastersizer

#### 3.2.2 สารช่วยเกาะยึด

3.2.2.1 สารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly Vinyl Alcohol, PVA) ความเข้มข้น 2%โดย มวลต่อปริมาตร (กรัม/มิลลิลิตร) (เช่น ใช้สาร PVA 2 g ต่อน้ำ 100 ml)

#### 3.2.3 ก๊าซที่ใช้ควบคุมบรรยากาศในเตา

- 3.2.3.1 ก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.9% ใช้ในการบดผงด้วย Attritor และใช้ในการเผา ผนึกขั้นต้น
- 3.2.3.2 ก๊าซไนโตรเจนและไฮโดรเจน ในอัตราส่วน 95:5 common grade ใช้ในการ ในไตรเดชัน

## 3.3 การเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน

#### 3.3.1 วิธีการบดและผสมผง

- 3.3.1.1 ทุบก้อน silicon metal จนได้ก้อนเล็กขนาดประมาณ 1 ม.ม.
- 3.3.1.2 บด silicon metal ที่ได้ด้วยเครื่อง Disc grinding mill โดยใส่ผงครั้งละประมาณ50 กรัม / ครั้ง / 3 นาที ด้วยความเร็วสูงสุด
- 3.3.1.3 ร่อนผงที่ได้ด้วยตะแกรงของ Retsch ตามมาตรฐาน ASTM E.11 ขนาด 60 และ 120 mesh ตามลำดับ ซึ่งจะได้ผงขนาดเล็กกว่า 125 μm
- 3.3.1.4 บดผงที่ได้ด้วย Attritor โดยใส่ผงครั้งละประมาณ 350 g ต่อลูกบด tungsten carbide 6 กิโลกรัม ใช้บรรยากาศก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.9% ใช้เวลาในการบด 1 ชั่วโมง 30 นาที และ 4 ชั่วโมง 30 นาที (ยิ่งใช้เวลานานผงที่ได้ก็จะเล็กลง)
- 3.3.1.5 ร่อนผงที่ได้ด้วยตะแกรงของ Retsch ตามมาตรฐาน ASTM E.11 ขนาด 325 และ
   400 mesh ตามลำดับ ซึ่งจะได้ผงขนาดเล็กกว่า 38 μm
- 3.3.1.6 ทำการวัดขนาดผงด้วยเครื่อง Mastersizer
- 3.3.1.7 พ่นสารละลาย PVA ที่มีความเข้มข้น 2 % กรัม/มิลลิลิตร (ละลายผง PVA ในน้ำที่ อุณหภูมิประมาณ 80 °C ในอัตราส่วน PVA 2 กรัม:น้ำ100 มิลลิลิตร) ลงบนผง ซิลิคอนที่ได้ คนผสมให้ทั่ว
- 3.3.1.8 น้ำผงที่ผสมแล้วไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 50 °C ประมาณ 45 นาที
- 3.3.1.9 ร่อนผงที่ได้ผ่านตะแกรงขนาด 120 mesh อีกครั้ง
- 3.3.1.10 จากนั้นนำผงที่ได้ไปทำการอัดขึ้นรูปต่อไปทันที อย่าปล่อยทิ้งจนไว้นานจนผง เกาะตัวกันจนแข็ง

## 3.3.2 วิธีการอัดขึ้นรูปชิ้นงานซิลิคอน

นำผงที่ได้จากข้อ 3.3.1.9 (ผงที่ผสมสารละลาย PVA และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 120 mesh แล้ว) มาอัดด้วยไฮดรอลิกแบบแนวเดียว (uniaxial press) ใน Stainless steel die ขนาดประมาณ 4 x 34 x 6 mm (ดังรูปที่ 3.2) จำนวนประมาณ 200 ชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงาน บางส่วนไปทำ Cold Isostatic Press (CIP) โดยใส่ในถุงยางทำให้เป็นสุญญากาศ และทำการ CIP ที่แรงดัน 300 MPa เป็นเวลา 2 นาที



รูปที่ 3.2 ขนาดชิ้นทดสอบที่ได้จากการอัดขึ้นรูป

โดยตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองวิเคราะห์ผลของขนาดผง

ตารางที่ 3.3 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองสำหรับวิเคราะห์ผลของขนาดผง

แรงที่ใช้ในการอัดด้วย		จำนวนชิ้นงาน								
Uniaxial Press	Uniaxial	CIP	Uniaxial	CIP	Uniaxial	CIP				
1 ตัน	10	10	10	10	10	10				
2 ตัน			10	10	-	-				
4 ตัน	<u>าร</u> ณ	1-19	10	10	8 -	-				
9	ผงมีขนาเ	n∼3μ	ผงมีขนา	α∼6μ	ผงมีขนาเ	n ~ 12 μ				
รวมทั้งหมด			100	ชิ้นงาน						

การ CIP ชิ้นงานดังตารางที่ 3.3 จะทำหลังจากอัดด้วย Uniaxial Press แล้ว เช่นใช้ Uniaxial Press อัดด้วยแรง 1 ตัน ต่อพื้นที่หน้าตัด 1.36 cm<sup>2</sup> (735 kg/cm<sup>2</sup>, 72 MPa) จากนั้น ทำการ CIP ด้วยแรง 300 MPa เป็นต้น โดยชิ้นงานแต่ละเงื่อนไข เงื่อนไขละ 10 ชิ้นนั้น จะนำไป ตรวจสอบหาค่าความหนาแน่น, ความแข็ง, โมดูลัสของยัง, ความแข็งแรงต่อการดัด, ตรวจสอบ ด้วย SEM และ XRD ต่อไป

## 3.4 วิธีการเผาผนึกขั้นต้น

นำชิ้นงานที่ได้เข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง ในบรรยากาศ แก๊สเฉื่อยอาร์กอน นำชิ้นงานเข้าเตาเผา Tube Furnace (LTF 15/75) โดยตั้งโปรแกรมตามตาราง ที่ 3.4 และแสดงแผนภาพการทำงานดัง รูปที่ 3.3 จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นงานพรีฟอร์ม (Preform)

Heating Step	Heating rate	Temperature	Dwell time
	(°C/hr)	(°C)	(hr)
Calcination & binder removal	250	500	1
Pre-sintering	250	1200*	3
Cooling	300	30	-

ตารางที่ 3.4 ข้อมูลการให้ความร้อนในการเผาผนึกขั้นต้น

\* [กุลจิรา สุจิโรจน์ และเบญญา เชิดหิรัญกร, 2541]



#### เวลา (hr)

รูปที่ 3.3 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาผนึกขั้นต้น

## 3.5 การตรวจสอบสมบัติของชิ้นงานที่ผ่านการเผาผนึกขั้นต้น

#### 3.5.1 วิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการวัดความหนาแน่น

3.5.1.1 ขัดเตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600,800,1000 และ 1200 ตามลำดับ
3.5.1.2 วัดขนาดเพื่อหาปริมาตรของชิ้นงาน
3.5.1.3 ชั่งน้ำหนักชิ้นงาน
3.5.1.4 จากนั้นนำค่าที่ได้มาแทนค่าในสูตรดังสมการที่ 3.1

$$ρ = m / V (n \tilde{z} )^{3}$$
[3.1]

โดย ρ คือค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน, m คือน้ำหนักชิ้นงาน (กรัม) และ V คือ ปริมาตรของชิ้นงาน (ซ.ม.<sup>3</sup>)

#### 3.5.2 การตรวจสอบสมบัติทางกล

สมบัติที่ทำการตรวจสอบชิ้นงานพรีฟอร์ม ได้แก่ ความแข็ง (Hardness, HV), โมดูลัส ของยัง (Young's modulus, E, MPa) และความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural strength, **σ**, MPa) โดยการตรวจสอบแต่ละสมบัติมีวิธีการดังนี้

## 3.5.2.1 วิธีการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน

ใช้การวัดความแข็งแบบไมโครวิคเกอร์ (Micro Vickers Hardness, HV) (JIS R 1610) ด้วยเครื่อง Micro Hardness Tester MHT-10 โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.5.2.1.1 ขัดเตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600,800,1000 และ 1200 ตามลำดับ

- 3.5.2.1.2 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที
- 3.5.2.1.3 ทดสอบความแข็งของชิ้นงานพรีฟอร์ม โดยใช้แรงกด 300 กรัม เป็นเวลา 10 วินาที ทดสอบชิ้นละ 10 จุด และหาค่าเฉลี่ย
- 3.5.2.1.4 คำนวณค่าความแข็งโดยใช้สมการ 3.2

$$HV = 0.1891 P / d^2$$
 [3.2]

โดย HV คือค่าความแข็งชิ้นงานแบบ Vickers (N/mm²), d (diagonal) คือ ความยาวเส้นทแยงมุมเฉลี่ยของรอยกด (mm), P คือแรงที่ใช้กด (N)

#### 3.5.2.2 วิธีการวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด

- 3.5.2.2.1 เตรียมชิ้นงานพรีฟอร์มให้ได้ขนาด 3 x 5 x 25 mm.
- 3.5.2.2.2 ขัดเตรียมผิวขึ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ
- 3.5.2.2.3 ลบมุมชิ้นงานด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์ 1000 ให้ทำมุม 45° เพื่อลด stress concentration ที่จะเกิดบริเวณมุมชิ้นงานขณะทดสอบ
- 3.5.2.2.4 ทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดแบบ Three-point-bending ด้วยเครื่อง Instron 4502 โดยใช้ crosshead speed 0.045 mm/min ตามมาตรฐาน ASTM C 1161 โดยมีลักษณะการทดสอบดังรูปที่ 3.4



โดย **σ**<sub>flex</sub> คือค่าความแข็งแรงต่อการดัด (MPa), P คือแรงที่ทำให้ชิ้นงานแตกหัก (N), L คือความยาวช่วงที่รับแรงต้าน (mm), W คือความกว้างของชิ้นงาน (mm) และ t คือ ความหนาของชิ้นงาน (mm) 3.5.2.3 วิธีการวัดค่าโมดูลัสของยัง

ทำการวัดค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus) ตามมาตรฐาน ASTM C 1259-94 โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 3.5.2.3.1 เตรียมชิ้นงานพรีฟอร์มให้ได้ขนาด 4 x 6 x 30 mm.
- 3.5.2.3.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ
- 3.5.2.3.3 ทำการชั่งน้ำหนัก (m), วัดความกว้าง (W), ความหนา (t) และความยาวของ ชิ้นงาน (L) เพื่อหาค่า T<sub>1</sub> ดังสมการที่ 3.4

T1 = 
$$\begin{bmatrix} 1 + 6.585 (1+0.0752\mu + 0.8109\mu^{2})(t/L)^{2} - 0.868(t/L)^{4} \\ - \begin{bmatrix} 8.340 (1+0.2023\mu + 2.173\mu^{2})(t/L)^{4} \\ \hline 1+6338(1+0.1408\mu + 1.536\mu^{2})(t/L)^{2} \end{bmatrix}$$
[3.4]

โดย m คือน้ำหนักของชิ้นงาน (กรัม), W คือความกว้างของชิ้นงาน (mm), L คือความยาวของชิ้นงาน (mm), t คือความหนาของชิ้นงาน (mm) และ μ คือค่า Poisson's ratio ของซิลิคอน ซึ่งมีค่า = 0.17

 3.5.2.3.4 ทดสอบหาค่าโมดูลัสของยังด้วยเครื่อง Grindosonic โดยการเคาะที่บริเวณ กึ่งกลางงาน เป็นจำนวน 10 ครั้ง บันทึกค่าความถี่กำทอนพื้นฐาน (fundamental resonant frequency, f, ) ที่ได้ในแต่ละครั้ง และหาค่าเฉลี่ย
 3.5.2.3.5 คำนวณหาค่าโมดูลัสของยัง ด้วยการแทนค่าต่างๆ ที่ได้ในสมการที่ 3.5

$$E = 0.9465(mf_{f}^{2}/b)(L^{3}/t^{3})T_{1}$$
[3.5]

โดย E คือค่าโมดูลัสของยัง (Pa) และ f<sub>r</sub> คือค่า fundamental resonant frequency (Hz)

## 3.5.3 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด

- 3.5.3.1 เตรียมชิ้นงานพรีฟอร์มให้ได้ขนาดประมาณ 4 x 6 x 30 mm.
- 3.5.3.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ
- 3.5.3.3 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที ทั้งนี้ เพื่อทำให้ชิ้นงานสามารถนำไฟฟ้าได้
- 3.5.3.4 ตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

## 3.6 วิธีการทำไนไตรเดชั<mark>น</mark>

นำชิ้นงานพรีฟอร์มเผาไนไตรเดชัน (Nitridation) ที่อุณหภูมิ 1500 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใน บรรยากาศไนโตรเจน โดยนำชิ้นงานเข้าเตาเผา High Temperature Furnace HT 1600 °C โดย ตั้งโปรแกรมตามตารางที่ 3.5 และแสดงแผนภาพการทำงานดังรูปที่ 3.5 จะได้เป็นชิ้นงาน RBSN

ตารางที่	3.5	ข้อมลก	ารให้ <mark>ค</mark> วา	มร้อนใน	การเผาใน	ไตรเดชั้น
VI 10 I NVI	0.0	T C C 2 011 1	10 001010		11 10 004 1000	00100011000

Heating Step	Heating rate (°C/hr)	Temperature (°C)	Dwell time (hr)
Heating	250	1100	0
Nitriding	50	1500	3
Cooling	600	30	0



รูปที่ 3.5 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาไนไตรเดชัน

## 3.7 การตรวจสอบสมบัติของชิ้นงานที่ผ่านการทำไนไตรเดชัน

#### 3.7.1 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการหาค่าความหนาแน่น

การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการหาค่าความหนาแน่น (Density, ρ, g/cm³) ของชิ้นงาน RBSN แบ่งออกเป็น 3 วิธีการ ดังนี้คือ

- 3.7.1.1 วิธีการหาความหนาแน่นด้วยการวัด
  - 3.7.1.1.1 ขัดเตรียมผิวชิ้นงาน RBSN ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600,
     800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1
     ไมครอน ตามลำดับ
  - 3.7.1.1.2 ทำการวัดขนาดของชิ้นงานเพื่อหาปริมาตร และชั่งน้ำหนักชิ้นงาน
  - 3.7.1.1.3 แทนค่าที่ได้ทั้งหมดในสูตรดังสมการที่ 3.1
- 3.7.1.2 วิธีการหาความหนาแน่นด้วยการแทนที่ด้วยน้ำ
  - 3.7.1.2.1 ขัดเตรียมผิวชิ้นงาน RBSN ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600,
     800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1
     ไมครอน ตามลำดับ
  - 3.7.1.2.2 อบชิ้นงานที่อุณหภูมิประมาณ 110 °C ประมาณ 3 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นจนถึง
     อุณหภูมิห้อง แล้วทำการชั่งน้ำหนักในอากาศ (m₁)
  - 3.7.1.2.3 นำชิ้นงานไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้จนเย็นจนถึง
     อุณหภูมิห้อง ทำการชั่งน้ำหนักในน้ำ (m<sub>2</sub>)
  - 3.7.1.2.4 คีบชิ้นงานออกมา ซับด้วยผ้าเปียก จากนั้นชั่งน้ำหนักในอากาศ (m<sub>3</sub>)
  - 3.7.1.2.5 คำนวณหาค่าความหนาแน่นตามสูตร ดังสมการที่ 3.6

โดย ho คือความหนาแน่นของชิ้นงาน,  $ho_{_0}$  คือความหนาแน่นของน้ำที่ อุณหภูมิที่ตรวจสอบ 3.7.1.3 วิธีการหาความหนาแน่นด้วย Ultrapycnometer

เป็นการตรวจสอบความหนาแน่นเพื่อหาค่า true density ของชิ้นงาน RBSN โดยมี ขั้นตอนดังนี้

- 3.7.1.3.1 ทำการ Calibrate เครื่องโดย calibrate Vcell และ Vadded
- 3.7.1.3.2 ชั่งน้ำหนักผงซิลิคอนไนไตรด์ที่ได้จากการบดชิ้นงาน RBSN ด้วยโกร่งอลูมินา เพื่อนำค่าที่ได้ป้อนลงในเครื่อง Ultrapycnometer ต่อไป
- 3.7.1.3.3 นำผงซิลิคอนไนไตรด์เข้าเครื่องเพื่อทำการวัด โดยเครื่องจะเปรียบเทียบปริมาตรของผงเทียบกับมาตรฐาน แล้วทำการคำนวณหาค่าความหนาแน่น
- 3.7.1.3.4 ผ่านก๊าซฮีเลี่ยม (He) เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ทำการตรวจสอบ 5 ครั้งต่อ
   1 ผงตัวอย่าง

#### 3.7.2 การตรวจสอบสมบัติทางกล

สมบัติที่ทำการตรวจสอบ ได้แก่ ความแข็ง (Hardness, HV), โมดูลัสของยัง (Young's modulus, E, MPa) และความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural strength, **o**, MPa) โดยการตรวจสอบแต่ละสมบัติมีวิธีการดังนี้

## 3.7.2.1 วิธีการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน

ใช้การวัดความแข็งแบบไมโครวิคเกอร์ (Micro Vickers Hardness, HV) (JIS R 1610) ด้วยเครื่อง Micro Hardness Tester MHT-10 โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 3.7.2.1.1 ขัดเตรียมผิวชิ้นงาน RBSN ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชร (Diamond paste) ขนาด 6, 3 และ 1 ไมครอน ตามลำดับ
- 3.7.2.1.2 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที
- 3.7.2.1.3 ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน RBSN โดยใช้แรงกด 300 กรัม เป็นเวลา 10 วินาที ทดสอบชิ้นละ 10 จุด และหาค่าเฉลี่ย
- 3.7.2.1.4 คำนวณค่าความแข็งโดยใช้สมการ 3.2

3.7.2.2 วิธีการวัดค่า Fracture toughness, K<sub>1c</sub>

การหาค่า Fracture toughness ด้วยวิธี Indentation Fracture โดยหาได้จากการ ประมาณความยาวรอยแตกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกดแบบ Vickers hardness tester ดังรูป ที่ 3.6 โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 3.7.2.2.1 เตรียมผิวชิ้นงานและทำการ sputtering ด้วยทองเช่นเดียวกับการวัดค่า ความแข็ง
- 3.7.2.2.2 ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน RBSN โดยใช้แรงกด 1.5 กิโลกรัม เป็นเวลา 20 วินาที ทดสอบชิ้นละ 10 จุด และหาค่าเฉลี่ย
- 3.7.2.2.3 คำนวณค่า Fracture toughness โดยใช้สมการที่ 3.7

$$K_{1c} = 0.016 (E/HV)^{1/2} (F/C^{3/2})$$
 [3.7]

เมื่อ K<sub>1c</sub> คือค่า Fracture toughness (Pa .m<sup>1/2</sup>), E คือค่าโมดูลัสของยัง (Pa), HV คือค่าความแข็งแบบ Vickers (Pa), F คือภาระที่ใช้ในการกด (N) และ C คือครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นทแยงมุมเฉลี่ยของรอยแตก (m)



รูปที่ 3.6 ลักษณะรอยกดจากการวัดความแข็งแบบ Vickers

3.7.2.3 วิธีการวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด

การวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural strength, **o**, MPa) เป็นไปตาม มาตรฐาน ASTM C 1161 โดยมีขั้นตอนในหารหาค่าดังนี้

3.7.2.3.1 เตรียมชิ้นงาน RBSN ให้ได้ขนาด 3 x 5 x 25 mm.

- 3.7.2.3.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600, 800,
  1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1
  ไมครอน ตามลำดับ
- 3.7.2.3.3 ลบมุมชิ้นงานด้วยการขัดกระดาษทรายเบอร์ 1000 ให้ทำมุม 45° เพื่อลด stress concentration ที่จะเกิดบริเวณมุมชิ้นงานขณะทดสอบ
- 3.7.2.3.4 ทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดแบบ Three-point-bending ด้วยเครื่อง Instron 4502 โดยใช้ crosshead speed 0.045 mm/min ตามมาตรฐาน ASTM C 1161 โดยมีลักษณะการทดสอบดังรูปที่ 3.4

3.7.2.3.5 จากนั้นคำนวณหาค่าความแข็งแรงต่อการดัด ดังสมการที่ 3.3

3.7.2.4 วิธีการวัดค่าโมดูลัสของยัง

ทำการวัดค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus) ตามมาตรฐาน ASTM C 1259-94 โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.7.2.4.1 เตรียมชิ้นงาน RBSN ให้ได้ขนาด 4 x 6 x 30 mm.

- 3.7.2.4.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600, 800,
  1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1
  ไมครอน ตามลำดับ
- 3.7.2.4.3 ทำการชั่งน้ำหนัก (m), วัดความกว้าง (W), ความหนา (t) และความยาวของ
   ชิ้นงาน (L) เพื่อหาค่า T₁ ดังสมการที่ 3.4
- 3.7.2.4.4 ทดสอบหาค่าโมดูลัสของยังด้วยเครื่อง Grindosonic โดยการเคาะที่บริเวณ กึ่งกลางงาน เป็นจำนวน 10 ครั้ง บันทึกค่าความถี่กำทอนพื้นฐาน (fundamental resonant frequency, f<sub>f</sub>) ที่ได้ในแต่ละครั้ง และหาค่าเฉลี่ย
- 3.7.2.4.5 คำนวณหาค่าโมดูลัสของยัง ด้วยการแทนค่าต่างๆ ที่ได้ในสมการที่ 3.5

#### 3.7.3 การตรวจสอบสัดส่วนโครงสร้างทางเคมีด้วย X-Ray Diffractometer

- 3.7.3.1 น้ำชิ้นงาน RBSN มาตัดตามขวาง (ทิศตามแรงอัด) ขนาดประมาณ 4x6x30 มม.
- 3.7.3.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1 ไมครอน ตามลำดับ
- 3.7.3.3 ทำการตรวจสอบโดยการใช้เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) โดยใช้ step angle 0.04 deg. Count time 1.0 วินาที ใช้ Cu target receiving slit 0.2°, beam slit 1.0° ตรวจหา peak ที่มุมตั้งแต่ 10° ถึง 90°
- 3.7.3.4 ทำ peak search เพื่อเทียบกับ peak มาตรฐานที่มีอยู่
- 3.7.3.5 หาค่า integrated intensity ของแต่ละ peak และทำการคำนวณ relative integrated intensity เพื่อหาปริมาณเฟล  $\alpha$ , เฟล  $\beta$  และปริมาณ Si ที่เหลืออยู่

#### 3.7.4 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด

- 3.7.4.1 เตรียมชิ้นงาน RBSN ให้ได้ขนาดประมาณ 4 x 6 x 30 mm.
- 3.7.4.2 ขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 220, 320, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1 ไมครอน ตามลำดับ
- 3.7.4.3 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที ทั้งนี้ เพื่อทำให้ชิ้นงานสามารถนำไฟฟ้าได้
- 3.7.4.4 ตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่น JEOL (JSM-5410)

#### 3.8 การศึกษาการเกิดออกซิเดชัน

## 3.8.1 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง

ใช้ชิ้นงาน RBSN ที่ใช้มีขนาดอนุภาคซิลิคอนเริ่มต้น 3 ไมครอน ผ่านการอัดด้วย Uniaxial Press 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa ผ่านการเผาผนึกขั้นต้นที่ 1200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไนไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1500 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง มีความหนาแน่น 2.61 กรัม/ซ.ม.<sup>3</sup> จู พรุน 13.98 % ความแข็งแรงต่อการดัด 251 MPa และมีค่าโมดูลัสของยัง 199 GPa

# 3.8.2 วิธีการเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิต่างๆ

นำชิ้นงาน RBSN ตามข้อ 3.8.1 เข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง (High Temperature Furnace) ในบรรยากาศธรรมดา โดยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการเผาเป็น 700, 800, 900 และ 1000 องศา เซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง โดยตั้งโปรแกรมตามตารางที่ 3.6 และแสดงแผนภาพ การทำงานดังรูปที่ 3.7 จะได้เป็นชิ้นงาน RBSN

ตารางที่ 3.6 ข้อมูลการให้ความร้อนในการเผาเพื่อศึกษาการเกิดออกซิเดชัน

Heating Step	Heating rate (°C/hr)	Temperature (°C)	Dwell time (hr)
Oxidation	250	700*	20
Cooling	600	30	0

\*อุณหภูมิการเผาจะเปลี่ยนไปเป็น 800, 900 และ 1000 °C ตามลำดับ



รูปที่ 3.7 กระบวนการให้ความร้อนในการเผาเพื่อศึกษาการเกิดออกซิเดชัน

# 3.8.3 วิธีการหาค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชันและความหนาชั้นฟิล์ม SiO<sub>2</sub>

3.8.3.1 วัดขนาดเพื่อหาพื้นที่ผิวของชิ้นงานก่อนเผา โดยทำการวัดชิ้นงานซึ่งมีลักษณะเป็น ปริซึมสี่เหลี่ยมดังรูปที่ 3.8 โดยวัดความกว้าง, ความยาว, และความหนาแล้ว คำนวณหาพื้นที่ผิว



รูปที่ 3.8 ลักษณะชิ้นงาน RBSN ที่ใช้ในการทดลองการเกิดออกซิเดชัน

- 3.8.3.2 นำชิ้นงานออกจากเตา ปล่อยให้เย็นในอากาศ แล้วทำการชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะ เผา ในแต่ละช่วงเวลา รวมเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง
- 3.8.3.3 ทำการคำนวณหาค่าต่างๆ ที่ได้จากการเกิดออกซิเดชันตามความสัมพันธ์ของ สมการอัตราพาราโบลิคทั่วไป (general parabolic rate equation) ดังสมการที่ 2.17 คือ

$$\Delta W^2 + A \Delta W = k_p t + c$$

3.8.3.4 หาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่ผิว ( $\Delta$ W) และ ( $\Delta$ W<sup>2</sup>) โดยหาได้จากสมการที่ 3.8

$$\Delta W = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \frac{1}{\sqrt[$$

3.8.3.5 ทำการ plot กราฟระหว่าง  $\Delta W^2$  (g<sup>2</sup>/cm<sup>4</sup>) และ เวลา (ชั่วโมง) 3.8.3.6 คำนวณค่า parabolic rate constant, k<sub>p</sub> โดยหาได้จากสมการที่ 3.9

3.8.3.7 ทำการ plot กราฟระหว่าง log k<sub>p</sub> (g<sup>2</sup>cm<sup>-4</sup>min<sup>-1</sup>) และ 1/T (K<sup>-1</sup>)
 3.8.3.8 คำนวณหาค่า Activation Energy, Q (kJ/mol) โดยหาได้จากสมการที่ 3.10

Q = - (ความขันของกราฟ) x 2.303 R [3.10]  
= - 
$$\left( \frac{\log k_p (g^2 \text{cm}^{-4} \text{min}^{-1})}{1/T (\text{K}^{-1})} \right)$$
 x 2.303 R

เมื่อ R คือค่าคงที่ของแก๊ส = 8.314 J/mol-K หรือ = 1.987 cal/mol-K

3.8.3.9 คำนวณหาค่าความหนาของชั้นฟิล์มซิลิกา ( film thickness of SiO<sub>2</sub>, t ) โดยหาได้ จากสมการที่ 3.11 [John et al., 1989]

Film thickness, t (
$$\mu$$
m) =  $\Delta w_g \times 3 \times 10^4 \times M_{si02}$  [3.11]  
A × 39.97 ×  $\rho_{si02}$ 

เมื่อ t คือความหนาของชั้นฟิล์มออกไซด์ (thickness of oxide films) ( $\mu$ m),  $\Delta$ w<sub>g</sub> คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (g), A คือพื้นที่ผิวของชิ้นงานทดสอบ (cm<sup>2</sup>), M<sub>sio2</sub> คือค่า molecular weight ของ SiO<sub>2</sub>,  $\rho_{sio2}$  คือค่าความหนาแน่นของ SiO<sub>2</sub> (g/cm<sup>3</sup>), ทั้งนี้ สมมุติว่าเกิดบนผิวด้านบนทั้งหมด (external surface) โดยที่เลข 3 ในสมการ หมายถึง 1 mole ของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิด 3 mole ของ cristobalite-SiO<sub>2</sub> ดังสมการที่ 2.14 คือ

 $Si_{3}N_{4}(s) + 3O_{2}(g) \longrightarrow 3SiO_{2}(s) + 2N_{2}(g)$ 

ส่วนตัวเลข 39.97 คือค่ามวลที่เปลี่ยนแปลงต่อ 1 mole ของ Si $_3N_4$  (mass change per mole of Si $_3N_4$ ) ที่เปลี่ยนไปเป็น 3 mole ของ SiO $_2$ 

## 3.8.4 วิธีการตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศ์แบบส่องกวาด

- 3.8.4.1 ตัดชิ้นงานตามขวาง แล้วขัดเตรียมผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320, 600,
  800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ จากนั้นขัดด้วยผงเพชรขนาด 6, 3 และ 1
  ไมครอน ตามลำดับ
- 3.8.4.2 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที
- 3.8.4.3 ตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
- 3.8.4.4 ตรวจสอบส่วนประกอบทางเคมีด้วย Energy Dispersive Spectrometer (EDS)
- 3.8.4.5 ตรวจสอบส่วนประกอบทางเคมีด้วย mapping ที่ผิวเปรียบเทียบกับภายในชิ้นงาน

## 3.8.5 วิธีการวัดค่าความแข็งของชิ้นงานที่เกิดออกซิเดชัน

ทำการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน (Hardness, HV) ตามมาตรฐาน JIS R 1610 โดยมี ขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.8.5.1 ทำการ sputtering ด้วยทอง โดยใช้กระแสไฟฟ้า 15 A เป็นเวลา 120 วินาที

- 3.8.5.2 ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน RBSN โดยใช้แรงกด 300 กรัม เป็นเวลา 10 วินาที ทดสอบชิ้นละ 10 จุด และหาค่าเฉลี่ย
- 3.8.5.3 คำนวณค่าความแข็งโดยใช้สมการ 3.2

## 3.8.6 วิธีการวัดค่า Fracture toughness, $K_{_{1C}}$

การหาค่า Fracture toughness ด้วยวิธี Indentation Fracture โดยหาได้จากการ ประมาณความยาวของรอยแตกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกดแบบ Vickers hardness tester ดังรูปที่ 3.6 โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 3.8.6.1.1 เตรียมผิวชิ้นงานและทำการ sputtering ด้วยทองเช่นเดียวกับการวัดค่า ความแข็ง
- 3.8.6.1.2 ทดสอบความแข็งของชิ้นงาน RBSN โดยใช้แรงกด 1.5 กิโลกรัม เป็นเวลา 20 วินาที ทดสอบชิ้นละ 10 จุด และหาค่าเฉลี่ย
- 3.8.6.1.3 คำนวณค่า Fracture toughness โดยใช้สมการที่ 3.7

สามารถสรุปกระบวนการขึ้นรูปรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนในไตรด์ทั้งหมดได้ดังรูปที่ 3.9





#### บทที่ 4

#### ผลการทดลอง

## 4.1 ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพด้วยการวัดค่าความหนาแน่น

ผลจากการทดลองสรุปค่าความหนาแน่นจากการวัดขนาด (ชิ้นงาน green compact และ preform) และจากการต้มด้วยน้ำ (ชิ้นงาน RBSN) ได้ดังตารางที่ 4.1 โดยแสดงความสัมพันธ์ของผล ของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าความหนาแน่น ได้ดังรูปที่ 4.1 และแสดงความสัมพันธ์ของผลของแรงอัด แบบแนวเดียวต่อค่าความหนาแน่น ได้ดังรูปที่ 4.2

เงื่อนไขชิ้นงาน ความหนาแน่นเฉลี่ยของ Bulk density, $oldsymbol{ ho}$ (g/cm $^3$ )					m <sup>3</sup> )	จำนวน			
ขนาดผง	Uniaxial	CIP	Green co	Green compact		Preform		RBSN	
$(\mu m)$	(ton)		Uniaxial	CIP	ρ	STDV	ρ	STDV	ทดสอบ
3	1	ไม่	1.30	0. <u>2</u> //	1.42	.0113	2.26	.0985	10
6	1	ไม่	1.29	-	1.35	.0125	2.14	.0347	10
6	2	ไม่	1.38	1-14	1.44	.0044	2.15	.0228	10
6	4	ไม่	1.48	-	1.50	.0053	2.21	.0042	10
12	1	ไม่	1.27	-	1.29	.0159	1.98	.0356	10
3	1	CIP	1.31	1.49	1.60	.0073	<u>2.61</u>	.0316	10
6	1	CIP 👔	1.29	1.53	1.59	.0088	2.38	.0026	10
6	2	CIP	1.37	1.53	1.61	.0103	2.40	.0059	10
6	4	CIP	1.49	1.54	1.62	.0085	2.42	.0067	10
12	1	CIP	1.51	1.55	1.58	.0230	2.18	.0995	10
	Commercial *							<u>U</u>	-
	-	RE	3SN **				2.50	-	-

ตารางที่ 4.1 ความหนาแน่นของ Bulk density ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN

\*[กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543], \*\* [Morrell, 1985]



รูปที่ 4.1 ผลของผงซิลิคอนต่อค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa



รูปที่ 4.2 ผลของแรงอัดแบบแนวเดียวต่อค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ green compact มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่ 6 **µ** และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

จากรูปที่ 4.1 พบว่าเมื่อผงซิลิคอนมีขนาดเล็กลง จะได้ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผล ต่อค่าความหนาแน่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอน ส่งผลต่อค่าความหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะที่ขนาดอนุภาค 3 ไมครอนที่มีค่าความหนาแน่น ถึง 2.61 กรัม/ซ.ม<sup>3</sup> เมื่อพิจารณาชิ้นงานที่ผ่านการ CIP และไม่ผ่านการ CIP จะพบได้ว่าชิ้นงานที่ผ่าน การ CIP ที่ 300 MPa จะได้ค่าความหนาแน่นที่มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงานมีความหนาแน่น ส่ง่าเสมอกว่าและมีความหนาแน่นของ green compact ที่สูงกว่าด้วยนั่นเอง

จากรูปที่ 4.2 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงในการอัดแบบแนวเดียวในชิ้นงาน green compact ที่มีขนาดผง ซิลิคอนเริ่มต้น 6 ไมครอนสูงขึ้นจะได้ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เป็นค่าแรงสูงสุดในการอัดชิ้นงานแล้ว โดยพบว่าที่ 288 MPa นั้นชิ้นงานบางชิ้นมีการแตกหักขณะอัด ดังนั้นค่าแรงในการอัดที่ 72 MPa ถือว่าเหมาะสมดีแล้ว

จากผลการทดลอง สรุป % รูพรุนได้ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดง % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาด ผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ผ่านการอัดแบบแนวเดียวที่ 72 และ CIP ที่ 72 MPa และ 300 MPa ตามลำดับ สำหรับตารางที่ 4.3 แสดง % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอน เริ่มต้น 6 ไมครอน โดย green compact มีแรงอัดแบบแนวเดียวต่างกัน โดยซิลิคอนไนไตรด์มีความ หนาแน่นทางทฤษฎี 3.19 g/cm<sup>3</sup>

ชิ้นงาน	True density	Bulk density	% Theoretical density	% Porosity
RBSN	(g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	(%)	(%)
3 µ	2.77	2.61	81.70	<u>5.78</u>
6 µ	2.77	2.38	74.49	14.08
12 <b>µ</b>	2.77	2.18	68.32	21.30
Commercial*	2.99	2.67	84.46	10.74
RBSN	-	-	70-88 **	18 ***

ตารางที่ 4.2 % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ถูกอัด ด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

\*[กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543], \*\* [Traffner et al , 1991] และ \*\*\*[Gellner et al, 1983]

Uniaxial Press	True density	Bulk density	% Theoretical	% Porosity
(MPa)	(g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	density (%)	(%)
72	2.77	2.38	74.49	14.08
144	2.77	2.40	75.37	13.36
288	2.77	2.42	75.71	12.64
Commercial *	2.99	2.67	84.46	10.74
RBSN	-		70-88 **	18 ***

ตารางที่ 4.3 % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN เมื่ออัดแบบแนวเดียวด้วยแรงต่างๆ โดย green compact มี ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 µm และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

\* [กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543], \*\* [Traffner et al , 1991] และ \*\*\*[Gellner et al, 1983]

จากผลการทดลอง จะได้ค่าความหนาแน่นจริง (true density) มีค่าประมาณ 2.77 g/cm<sup>3</sup> (ข้อมูลแสดงในภาคผนวก ข.) และแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ของผลของขนาดของผงซิลิคอนเริ่มต้น ต่อ % porosity ได้ดังรูปที่ 4.3 และแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ของผลของแรงอัดแบบแนวเดียวที่ ต่างกันต่อ % porosity ได้ดังรูปที่ 4.4



แผนภูมิแสดง % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างกัน

รูปที่ 4.3 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อ % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรง แบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa



แผนภูมิแสดง % Porosity ของชิ้นงาน RBSN ที่มีแรงอัดแนวเดียวต่างกัน

รูปที่ 4.4 ผลของแรงอัดแบบแนวเดียวต่อ % รูพรุนของชิ้นงาน RBSN ที่ green compact มีขนาดผง ซิลิคอนเริ่มต้นที่ 6 µm โดยผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

จากรูปที่ 4.3 พบว่าเมื่อขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นของชิ้นงาน RBSN ลดลง จะได้ค่า % รูพรุนที่ ลดลงตามไปด้วย และจากรูปที่ 4.4 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงอัดแบบแนวเดียว จะทำให้ชิ้นงาน RBSN มีค่า % รูพรุนที่ลดลงไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากค่าความหนาแน่นที่ได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

## 4.2 ผลการตรวจสอบสมบัติทางกล

## 4.2.1 ผลการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน

จากผลการทดลอง สามารถสรุปค่าความแข็งของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ผ่านการอัดแนวเดียวและ CIP ที่ 72 MPa และ 300 MPa ตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.4 โดยแสดงความสัมพันธ์ของผลของขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่อค่าความแข็งได้ดังรูปที่

4.5

			V	/ickers H	ardness (H	HV)			
ขนาดผง		Preform				RBSN			
( $\mu$ m)	Un_(	CIP	CIP		Un_CIP		C	IP	ครั้งที่
	HV	STDV	HV	STDV	HV	STDV	HV	STDV	ทดสอบ
3	143.33	23.89	167.18	11.21	718.51	121.09	<u>971.06</u>	141.04	10
6	107.70	31.13	137.94	11.98	560.80	96.08	680.47	136.16	10
12	86.33	20.03	98.03	6.74	321.41	64.64	403.24	74.18	10
	Commercial [กั <mark>นยาทิพย์ ตั</mark> นติคมน์, 2 <mark>543]</mark> 780.30							263.64	10
	RE	3SN [Tra	ıffner et a	I, 1991	]		400-	-700	

ตารางที่ 4.4 ความแข็งของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดยที่ green compact ถูกอัดด้วยแรงแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa



รูปที่ 4.5 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าความแข็งของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

จากรูปที่ 4.5 แสดงผลของขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่อค่าความแข็ง พบว่าเมื่อผงซิลิคอนมี ขนาดเล็กลง จะได้ค่าความแข็งของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อ พิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อพิจารณาชิ้นงานที่มี green compact ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa จะได้ค่าความแข็งที่ มากกว่าชิ้นงานที่ green compact ไม่ผ่านการ CIP

#### 4.2.2 ผลการวัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด

สรุปค่าความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural strength, **σ**) ด้วยวิธี Three-point bending ของ ชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ผ่านการอัดแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa ได้ดังตารางที่ 4.5 (ข้อมูลจากการทดสอบแสดงในภาคผนวก ค.) และแสดงผลของ ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่ต่างกันต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัด ได้ดังรูปที่ 4.6

ตารางที่ 4.5 ความแข็งแรงต่อการดัดของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น ต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

	Flexural strength, <b>o</b> (MPa)								
ขนาดผง	Preform				RBSN				จำนวน
ซิลิคอน	Un_(	CIP	С	IP	Un_(	CIP	CIP		ขึ้น
$(\mu m)$	σ	STDV	υ	STDV	υ	STDV	σ	STDV	ทดสอบ
3	19.67	6.05	42.33	6.88	125.36	27.90	<u>250.79</u>	33.52	5
6	13.61	2.52	<mark>32</mark> .12	2.19	99.35	8.05	147.50	11.01	5
12	6.12	3. <mark>4</mark> 4	22.05	5.55	90.35	7.60	104.03	16.12	5
	196.99	8.71	5						
RBSN [Traffner et al , 1991]							150-350		-



รูปที่ 4.6 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัดของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa จากรูปที่ 4.6 พบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลง จะได้ค่าความแข็งแรงต่อการดัดเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัด เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความ แข็งแรงต่อการดัดอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ 3 ไมครอน มีค่าความ แข็งแรงต่อการดัดถึง 251 MPa ซึ่งมากกว่าชิ้นงานเชิงพาณิชย์ที่มีค่าเพียง 197 MPa

#### 4.2.3 ผลการวัดค่าโมดูลัสของยัง

สรุปค่า Young's Modulus (E) ที่ได้จากการวัดด้วย Grindosonic ของชิ้นงาน Preform และ ชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ผ่านการอัดแนวเดียวและ CIP ที่ 72 MPa และ 300 MPa ตามลำดับ ได้ผลดังตารางที่ 4.6 และแสดงผลของขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่ต่างกันต่อค่าโมดูลัสของ ยัง ได้ดังรูปที่ 4.7

ตารางที่ 4.6 โมดูลัสของยังของชิ้นงาน Preform และ RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

	Young's modulus, E (GPa)								
ขนาดผง	Preform				RBSN				จำนวน
( $\mu$ m)	Un_CIP Un_CIP Un_CIP		CIP	CIP		ชิ้น			
	E	STDV	E	STDV	E	STDV	E	STDV	ทดสอบ
3	10.88	0.50	25.66	0.84	124.63	23.96	<u>198.63</u>	3.45	5
6	10.74	2.57	20.75	0.51	102.24	4.97	145.66	9.39	5
12	5.88	1.48	9.45	0.91	84.22	3.07	121.64	5.92	5
Commercial [กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543]							255.84	8.38	3
RBSN [Traffner et al , 1991]							120-250	-	-

# จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.7 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อค่าโมดูลัสของยัง ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่าน/ไม่ผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

จากรูปที่ 4.7 พบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลง จะได้ค่าโมดูลัสของยังเพิ่มขึ้น โดยเมื่อ พิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าโมดูลัสของยังเล็กน้อย แต่เมื่อ พิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อโมดูลัสของยังอย่างเด่นชัด

## 4.2.4 ผลการวัดค่า Fracture toughness, K<sub>1C</sub>

ผลการวัดค่า Fracture toughness หรือ K<sub>1c</sub> ด้วยวิธี Indentation Fracture ของขึ้นงาน RBSN ที่ green compact ผ่านการอัดแนวเดียว ที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa ได้ผลดังตาราง ที่ 4.7 และแสดงผลของขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่ต่างกันต่อ K<sub>1c</sub> ได้ดังรูปที่ 4.8

ตารางที่ 4.7 Fracture toughness ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนต่างๆ โดย green compact ผ่านการอัดแนวเดียว ที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

Particle size ( $\mu$ m)	Fracture toughness, K <sub>1C</sub> (MPa . m <sup>1/2</sup> )
3	2.62
6	2.68
12	2.83
Traffner และคณะ [1991]	1.5-3.0





จากรูปที่ 4.8 พบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลง จะได้ Fracture toughness ลดลง

## 4.3 ผลการหาปริมาณเฟสในโครงสร้างจากการตรวจสอบด้วย X-Ray Diffractometer

ผลจากการตรวจสอบด้วย X-Ray Diffractometer (XRD) พบว่าชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอน เริ่มต้นต่างๆ ซึ่ง green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa ทั้งหมดไม่พบ peak ที่เป็น Si เหลืออยู่ และเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นเฟส  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> โดย สามารถแสดง Relative integrated intensity ของ peak  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เทียบกับ peak  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ได้ค่าดัง ตารางที่ 4.8 และแสดงตัวอย่างกราฟที่ได้จากการตรวจสอบดังรูปที่ 4.9 (รูปแสดงในภาคผนวก ง.)

ตารางที่ 4.8 Relative integrated intensity ของ peak  $\alpha$ -Si $_3N_4$  เทียบกับ  $\beta$ - Si $_3N_4$  ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ

RBSN	Relative Integrated	Relative Integrated	$I_{eta_{(210)}}$
sample size	Intensity ของ	Intensity ของ	
( $\mu$ m)	peak $\mathbf{\alpha}$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	peak $\beta$ - Si $_{3}$ N $_{4}$	$I_{\beta_{(210)}} + I_{\alpha_{(210)}}$
3	1180	215	0.15
6	1437	377	0.21
12	2473	728	0.23
จากข้อมูลพบว่าพื้นที่ใต้กราฟ (Integrated intensity) ของ peak  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่ peak (210), 2 $\theta$  (Cu $\kappa \alpha$ ) มีค่าเท่ากับ 2.54 เทียบกับพื้นที่ใต้กราฟของ peak  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่ peak (210), 2 $\theta$  (Cu $\kappa \alpha$ ) มีค่าเท่ากับ 2.49



รูปที่ 4.9 ข้อมูล XRD ของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 μm โดย green compact ถูก อัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

น้ำค่า Relative integrated intensity จากตารางที่ 4.8 มาเปรียบเทียบกับ calibration curve จากรูปที่ 4.10 จะได้ค่า weight fraction ของ β- Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่เหลือก็คือปริมาณเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> สรุปได้ดัง ตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ปริมาณของ lpha-Si $_3N_4$  และ eta- Si $_3N_4$  ของซิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

RBSN size ( $\mu$ m)	ปริมาณ $oldsymbol{lpha}$ -Si $_{_3}N_{_4}$ (%)	ปริมาณ $eta$ - Si $_{_3}N_{_4}$ (%)
3	90	10
6	86	14
12	83	17
Commercial *	81	19

\* [กันยาทิพย์ ตันติคมน์, 2543]



รูปที่ 4.10 Calibration curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง integrated intensity ของ  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เทียบกับ weight fraction ของ  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [Charles and Donald, 1977]

จากตารางที่ 4.9 พบว่าปริมาณ **α**-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> มีแนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้นเมื่อขนาดผงซิลิคอน เริ่มต้นเล็กลง โดยที่ชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอน 3 ไมครอนมีปริมาณของ **α**-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ถึง 90% ซึ่งมากกว่าชิ้นงานเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณเพียง 81% ทำให้ได้สมบัติบางอย่างมีค่าสูงกว่า ดังจะได้ อภิปรายในบทต่อไป

#### 4.4 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด

จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด (Scanning Electron Microscope, SEM) ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa ได้ผลดังรูปที่ 4.11 และรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.11 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน Preform ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น

้ ข่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

จากรูปที่ 4.11 แสดงโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน Preform ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นแตกต่าง กัน ซึ่ง green compact ผ่านการอัดแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa จากรูปพบว่า อนุภาคของซิลิคอนมีขนาดแตกต่างกัน โดยชิ้นงาน preform ที่มีขนาดผงเริ่มต้นเฉลี่ย 3 ไมครอนพบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดอนุภาคเล็กประมาณ 1-2 ไมครอน และพบขนาดอนุภาคประมาณ 3-4 ไมครอน กระจายอยู่ทั่วในโครงสร้าง ส่วนชิ้นงาน preform ที่มีขนาดผงเริ่มต้นเฉลี่ย 6 ไมครอนพบว่าส่วนใหญ่มี ขนาดอนุภาคเล็กประมาณ 3-4 ไมครอน และพบขนาดอนุภาคประมาณ 7-8 ไมครอน กระจายสลับกัน ทั่วไปในโครงสร้าง และสำหรับชิ้นงาน preform ที่มีขนาดผงเริ่มต้นเฉลี่ย 12 ไมครอนพบว่าอนุภาค ส่วนใหญ่มีขนาด 10-12 ไมครอนกระจายอยู่ทั่วไป โดยที่ชิ้นงาน preform ที่มีขนาดผงเริ่มต้นเฉลี่ย 3 ขนาด พบว่าอนุภาคมีการเกาะกันแบบไม่สม่ำเสมอ บางบริเวณมีอนุภาคเกาะกันแน่น ส่วนบาง บริเวณมีอนุภาคเกาะกันหลวมๆ ซึ่งจะพบฐพรุนเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในโครงสร้าง



a) RBSN ขนาด 3 **µ**m (x500)

b) RBSN ขนาด 3 **µ**m (x3500)



c) RBSN ขนาด 6 µm (x500)

d) RBSN ขนาด 6  $\mu$ m (x3500)



รูปที่ 4.12 โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

f) RBSN ขนาด 12 **µ**m (x3500)

e) RBSN ขนาด 12 **µ**m (x500)

จากรูปที่ 4.12 แสดงโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน RBSN ที่ green compact ผ่านการอัด แบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa โดยพบว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นซิลิคอนไนไตรด์ เกือบทั้งหมด โดยการกระจายตัวของซิลิคอนไนไตรด์ไม่สม่ำเสมอ มีบริเวณเนื้อซิลิคอนไนไตรด์ที่ เกาะกันแน่นเป็นบริเวณขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง สลับกับบริเวณที่ซิลิคอนไนไตรด์เกาะกันหลวมๆ ทำให้พบรูพรุนอยู่ทั่วไปในโครงสร้าง และยังพบว่าชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 ใมครอนจะมีบริเวณที่เป็นรูพรุนน้อยกว่า อีกทั้งรูพรุนมีขนาดเล็กและตื้นกว่าชิ้นงาน RBSN ที่มี ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 และ 12 ไมครอน โดยเฉพาะผงซิลิคอนเริ่มต้นขนาด 12 ไมครอน นั้น พบว่าอนุภาคเกาะกันหลวมๆ อีกทั้งยังมีรูพรุนที่ลึกและใหญ่โดยในบางบริเวณมีขนาดมากกว่า 10 ไมครอน

#### 4.5 ผลการศึกษาการเกิดออกซิเดชัน

# 4.5.1 ผลการเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง

ผลจากการนำชิ้นงาน RBSN ที่ green compact มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 ไมครอน ถูกอัด ด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa เผาในเตาอุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิ 700, 800, 900 และ 1000 °C เป็นเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง ทำการจับเวลา และซั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะเผา ได้ผลดังตารางที่ 4.10

เวลา	น.น. ที่เพิ่มขึ้น (g) x 10⁻⁴					
(ข.ม.)	เมื่อเผาที่ 700 °C	เมื่อเผาที่ 800 °C	เมื่อเผาที่ 900 °C	เมื่อเผาที่ 1000 °C		
0	0	0	0	0		
1	1	10	-	352		
2	11	25	83	420		
3	14	33	-	-		
4	18	35	118	485		
5	-	44	-	-		
7	20	Sale Ste- March	164	563		
8	- 38	51	-	-		
10	24	63	195	580		
13	29	66	226	628		
18	43	74	-	-		
20	43	98	275	684		
พื้นที่ผิว (cm²)	23.25	24.41	24.68	22.72		
				1		

ตารางที่ 4.10 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของชิ้นงานที่ผ่านการเผาในบรรยากาศ

# 4.5.2 ผลการหาค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชัน

ผลจากตารางที่ 4.10 นำไปคำนวณหาค่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยเวลา (ΔW) จากนั้น คำนวณหาค่า (ΔW<sup>2</sup>) สรุปได้ดังตารางที่ 4.11 จากนั้นนำค่าที่ได้ไป plot กราฟระหว่าง ΔW<sup>2</sup> และ เวลา (ชั่วโมง) เพื่อหาค่า k<sub>p</sub> จากความชันของกราฟ ดังรูปที่ 4.13 และทำการ plot กราฟระหว่าง log k<sub>p</sub> และ 1/T (K) ดังรูปที่ 4.14 โดยค่าที่คำนวณได้ต่างๆ สรุปดังตารางที่ 4.12 และทำการ คำนวณหาค่าพลังงานกระตุ้นที่เกิดออกซิเดชัน สรุปได้ดังตารางที่ 4.13

เวลา	$\Delta$ W x10 $^4$ (g)					$\Delta W^2 x$	10 <sup>8</sup> (g <sup>2</sup> )	
(ป.ม.)	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่	เมื่อเผาที่
	700 °C	800 °C	900 °C	1000 °C	700 °C	800 °C	900 °C	1000 °C
1	0.04	0.41	-	15.50	0.00	0.17	-	240.25
2	0.47	1.02	3.36	18.49	0.22	1.04	11.29	341.88
3	0.60	1.35	-	-	0.36	1.82	-	-
4	0.77	1.43	4.78	21.35	0.59	2.04	22.85	455.82
5	-	1.80	- \	11-	-	3.24	-	-
7	0.86	-	6.65	24.78	0.74	-	44.22	614.05
8	-	2.09	-	-	-	4.37	-	-
10	1.03	2.58	7.90	25.53	1.06	6.66	62.41	651.78
13	1.25	2.70	9.16	27.65	1.56	7.29	83.91	764.52
18	1.85	3.03	/-/8	9-11	3.42	9.18	-	-
20	1.85	4.02	11.14	30.11	3.42	16.16	124.10	906.61

ตารางที่ 4.11 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน RBSNที่ผ่านการเผาในบรรยากาศ



a)เส้นความสัมพันธ์ของการเกิดออกซีเดชันในแต่ละอุณหภูมิ



b) เส้นความสัมพันธ์ของการเกิดออกซิเดชันเฉพาะที่อุณหภูมิ 700, 800 และ 900 °C

รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ของ  $\Delta W^2~(g^2)$  กับ เวลา (ชั่วโมง) ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน



รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า k<sub>p</sub> (g²/(cm⁴. min)) และอุณหภูมิ (°C) ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันในแต่ละอุณหภูมิ

ตารางที่ 4.12 ค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ได้ในแต่ละอุณหภูมิการเกิดออกซิเดชัน

T (°C)	700	800	900	1000
1/T x 10 <sup>4</sup> (K <sup>-1</sup> )	10.28	9.32	8.53	7.86
$k_{p} (g^{2} cm^{-4} min^{-1})$	1.30 x 10 <sup>-4</sup>	12.79 x 10 <sup>-4</sup>	109.92 x 10 <sup>-4</sup>	544.63 x 10 <sup>-4</sup>
$Log k_p (g^2 cm^{-4} min^{-1})$	-3.89	-2.89	-1.96	-1.26

จากรูปที่ 4.14 สามารถหาค่าพลังงานกระตุ้น (Activation energy, Q) ได้จากความสัมพันธ์ ดังสมการที่ 3.10 ซึ่งได้จากความชันของกราฟ โดยสรุปค่าได้ดังตารางที่ 4.13 ซึ่งจะพบว่าค่า พลังงานกระตุ้นที่จะทำให้ชิ้นงาน RBSN เกิดออกซิเดชัน (เกิดชั้นฟิล์มซิลิกาบนผิวชิ้นงาน) ระหว่าง อุณหภูมิ 700-1000 °C มีค่าเท่ากับ 209 kJ/mole (50 kcal/mol)

ตารางที่ 4.13 ค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 700 -1000 °C

Activation energy, Q	อุณหภูมิการเกิดออกซิเดชัน 700 -1000 °C
E (kJ/mole)	209.09
E (kcal/mole)	49.97

## 4.5.3 ผลการหาความหนาของชั้นฟิล์ม SiO<sub>2</sub>

ผลจากคำนวณตามสมการที่ 3.11 จะสามารถทราบถึงความหนาของชั้นฟิล์มซิลิกาของ ชิ้นงาน RBSN ที่เกิดบริเวณผิว ณ อุณหภูมิต่างๆ เมื่อเผาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง สรุปได้ดังตารางที่ 4.14 และแสดงความหนาของชั้นฟิล์มซิลิกาในแต่ละอุณหภูมิการเกิดออกซิเดชันได้ดังรูปที่ 4.15

อุณหภูมิการเกิด	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น	พื้นที่ผิว	ความหนาของชั้นฟิล์ม
ออกซิเดชัน (°C)	(g)	(cm <sup>2</sup> )	SiO $_{_2}~(\mu\text{m})$
700	0.0043	23.25	3.59
800	0.0098	24.41	7.80
900	0.0275	24.68	21.65
1000	0.0684	22.72	58.50

ตารางที่ 4.14 สรุปความหนาของชั้นฟิล์มซิลิกาบนผิวของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน





จากรูปที่ 4.15 พบว่าความหนาของชั้นฟิล์มซิลิกา (SiO<sub>2</sub>) ที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเกิดออกซิเดชันสูงขึ้น ซึ่งที่ 700 °C พบว่าชั้นของ SiO<sub>2</sub> มีความหนาเพียงเล็กน้อย และชั้นของ SiO<sub>2</sub> จะหนาขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะที่ 1000 °C พบว่าชั้นของซิลิกามีความหนาถึง 58 ไมครอน

# 4.5.4 ผลการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน

จากผลการทดลอง สามารถสรุปค่าความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ ต่างๆ ได้ดังตารางที่ 4.15 โดยแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นขณะเผาต่อค่าความแข็งได้ ดังรูปที่ 4.16

อุณหภูมิที่เกิดออกซิเดชัน (°C)	Vickers Har	จำนวนครั้งที่	
	HV	STDV	ทดสอบ
RBSN ก่อนเผา	971.06	141.04	10
700	974.96	142.67	10
800	972.12	70.59	10
900	982.32	123.75	10
1000	1003.41	168.15	10

ตารางที่ 4.15 ความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ



รูปที่ 4.16 ความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ

จากรูปที่ 4.16 แสดงค่าความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิต่างๆ พบว่าเมื่ออุณหภูมิในการเผาชิ้นงานเพิ่มสูงขึ้นจะได้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพบว่ามีค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละตัวอย่างสูง แสดงถึงว่าค่าที่ได้อาจไม่แตกต่างกันมากนัก

#### 4.5.5 ผลการวัดค่า Fracture toughness, K<sub>1c</sub>

ผลการวัดค่า Fracture toughness หรือ K<sub>1c</sub> (MPa.m<sup>1/2</sup>) ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิด ออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่างๆ สรุปค่าไดดังได้ดังตารางที่ 4.16 โดยแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่ เกิดออกซิเดชันต่อค่า K<sub>1c</sub> ได้ดังรูปที่ 4.17

ตารางที่ 4.16 ค่า K<sub>1c</sub> ของชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 ไมครอน โดย green compact ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และผ่านการ CIP ที่ 300 MPa

Temperature of Oxidation (°C)	Fracture toughness, K <sub>1C</sub> (MPa . m <sup>1/2</sup> )
ก่อนเผา	2.62
700	2.54
800	2.56
900	2.43
1000	2.27



จากรูปที่ 4.17 พบว่าเมื่อชิ้นงาน RBSN เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงขึ้น จะได้ค่า Fracture toughness ลดลง

# 4.5.6 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันด้วยกล้อง จุลทรรศน์แบบส่องกวาด

จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยกล้อง SEM ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.18



a) เผาที่ 700 °C (x2500) b) เผาที่ 800 °C (x2500)



c) เผาที่ 900 °C (x2500) d) เผาที่ 1000 °C (x2500)

รูปที่ 4.18 ความหนาของชั้นฟิล์ม SiO<sub>2</sub> ของชิ้นงาน RBSN ที่ทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ ต่างๆ ตรวจสอบด้วยกล้อง SEM

จากรูปที่ 4.18 พบว่าชิ้นงาน RBSN จะเกิดชั้นของ SiO<sub>2</sub> ขึ้นบริเวณผิว โดยพบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะยิ่งพบ ชั้นของ SiO<sub>2</sub> หนามากขึ้น ซึ่งที่ 700 °C พบว่าชั้นของ SiO<sub>2</sub> แทบจะมองไม่เห็น และชั้นของ SiO<sub>2</sub> จะหนาขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะที่ 1000 °C จะเห็นชั้นของซิลิกาได้อย่างชัดเจน

# 4.5.7 ผลการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีด้วย Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) ร่วมกับการทำ Mapping

ผลจากการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000 °C ด้วย Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) แสดงดังรูปที่ 4.19 (อุณหภูมิอื่นแสดงใน ภาคผนวก จ.) และผลจากการ mapping แสดงได้ดังรูปที่ 4.20



#### a) ส่วนผสมบริเวณผิวของชิ้นงาน RBSN



# b) ส่วนผสมบริเวณภายในชิ้นงาน RBSN

รูปที่ 4.19 ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่ 1000 °C ที่บริเวณผิวเทียบกับภายในชิ้นงาน จากรูปที่ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบรูป a) เป็นส่วนผสมบริเวณผิว และ b) เป็นส่วนผสมบริเวณ ภายในชิ้นงาน พบว่ามีออกซิเจนเกิดขึ้นที่บริเวณผิวในปริมาณที่มากกว่า



รูปที่ 4.20 โครงสร้างจุลภาค แ<mark>ละ mapping ของชิ้นง</mark>าน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่ 1000 °C

จากรูปที่ 4.20 เมื่อพิจารณาที่บริเวณภายในชิ้นงานจะตรวจพบไนโตรเจนกระจายตัวอยู่ ทั่วไป ส่วนซิลิคอนพบว่ามีการกระจายตัวในสัดส่วนที่หนาแน่น และพบออกซิเจนกระจายทั่วไปด้วย เล็กน้อย ส่วนบริเวณผิวของชิ้นงานพบว่าไนโจรเจนและซิลิคอนกระจายตัวเบาบางลง ขณะที่พบว่า ออกซิเจนกระจายตัวในสัดส่วนที่หนาแน่นขึ้นเป็นลักษณะแนวเส้น

# จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย

### บทที่ 5 อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองที่ได้ในบทที่ 4 มีข้อสังเกตหลายประการทั้งที่เกี่ยวกับผลของขนาดผง ซิลิคอนเริ่มต้นต่อสมบัติต่างๆ ของชิ้นงานพรีฟอร์มและชิ้นงานรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ (Reaction-bonded silicon nitride, RBSN) และที่เกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชันของชิ้นงาน RBSN ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้

# 5.1 สมบัติของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่างๆ

#### 5.1.1 ความหนาแน่น

เมื่อชิ้นงานมีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นลดลง จะพบว่าทั้งชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าหลังจากผ่าน การเผาผนึกขั้นต้น (pre-sintering) แล้วชิ้นงานที่มีขนาดผงซิลิคอนที่เล็กกว่าจะมีความ หนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการที่ชิ้นงานที่มีขนาดผงเล็กจะมี driving force ในการ เกิด sintering เพิ่มขึ้น จากสมการที่ 5.1

driving force = 
$$\Delta \mu = \mu_{A} - \mu_{B} = \gamma \Omega \left( \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} \right)$$
 [5.1]

เมื่อ  $\mu_A \ \mu_B$  คือค่า chemical potential ของบริเวณ surface source (A) และ surface sink (B) ,  $\gamma$  คือค่า specific surface energy ของของแข็ง,  $\Omega$  คือค่า molar volume ของของแข็ง และ R<sub>1</sub> & R<sub>2</sub> คือค่า principle radii of the curvature

จากสมการที่ 5.1 พบว่าเมื่อรัศมีของส่วนโค้งเล็กลง จะได้ค่า driving force เพิ่มขึ้น ดังนั้นจะช่วยให้การลดลงของพื้นที่ผิวได้มากขึ้น มีการถ่ายมวลได้มากขึ้น ทำให้ชิ้นงาน dense ได้ดีกว่า ดังนั้นจึงได้ความหนาแน่นที่มากกว่า และรูพรุนลดลงไปด้วย เมื่อพิจารณาชิ้นงาน RBSN จะพบว่ามีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้พิจารณา จากการที่เมื่อชิ้นงานมีขนาดผงเล็ก จะมีพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยามากขึ้นทำให้เมื่อทำการใน ใตรเดชันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าและมากกว่า ทำให้ได้ความหนาแน่นสูงขึ้น อีกทั้งได้รูพรุนที่ เล็กและตื้นกว่าจึงทำให้มี % รูพรุนต่ำไปด้วย โดยที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 ไมครอนมีรูพรุน ประมาณ 6 % ซึ่งต่ำกว่าชิ้นงานเชิงพาณิชย์ที่มีรูพรุนประมาณ 11%

จากการตรวจสอบด้วย XRD พบว่ามีเฟสที่เกิดในโครงสร้าง 2 เฟสคือ α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> โดยไม่พบซิลิคอนเหลือในโครงสร้าง โดยกลไกการเกิดเฟสในโครงสร้างของชิ้นงานเมื่อ เกิดปฏิกิริยาในไตรเดชันนั้น ช่วงแรกของการเกิดปฏิกิริยาซิลิคอนจะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนที่ ผิวของซิลิคอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เกิดเป็นชั้นของซิลิคอนไนไตรด์ที่ละเอียด โดยปฏิกิริยาจะ เกิดได้ง่ายที่ผิว จากนั้นซิลิคอนจะแพร่ผ่านชั้นของซิลิคอนไนไตรด์ที่ละเอียด โดยปฏิกิริยาจะ เกิดได้ง่ายที่ผิว จากนั้นซิลิคอนจะแพร่ผ่านชั้นของซิลิคอนไนไตรด์เพื่อไปทำปฏิกิริยากับ ในโตรเจนบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา ซึ่งจะทำให้บริเวณที่ซิลิคอนแพร่ออกไปเกิดเป็นช่องว่างขึ้นและ ในโตรเจนก็จะแพร่ผ่านชั้นซิลิคอนไนไตรด์ที่เกิดก่อนเข้าไปทำปฏิกิริยากับซิลิคอนยังบริเวณ ช่องว่างที่เกิดขึ้นภายใน โดยปฏิกิริยาจะเกิดเข้าไปในอนุภาคของซิลิคอนเรื่อยๆ จนในโตรเจน ไม่สามารถแพร่ผ่านชั้นของซิลิคอนไนไตรด์ได้ ดังนั้นขนาดอนุภาคผงซิลิคอนที่เล็กกว่าจะทำให้ เกิดปฏิกิริยาได้สมบูรณ์ และปฏิกิริยาจะเกิดสิ้นสุดก่อนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเหลือ ซิลิคอนในโครงสร้างได้ [Jennings และ Richman, 1976] แสดงกลไกได้ดังรูปที่ 5.1

เมื่อพิจารณาที่ความหนาแน่นของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN พบว่ามีค่าเพิ่ม สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยพบว่าขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นที่เล็กลงจะทำให้ชิ้นงาน Preform มีค่า ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับชิ้นงาน RBSN จะพบว่ามีค่าความหนาแน่นเพิ่ม สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอนซึ่งมีค่าความ หนาแน่นสูงถึง 2.61 กรัม/ซ.ม<sup>3</sup> ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน Preform นั้นในขั้นการ sintering จะเป็น เพียงการลดพื้นที่ผิวและอนุภาคเกิดเป็นเกรน แต่ไม่ได้เปลี่ยนเฟสในโครงสร้างแต่อย่างใด ยังคงเป็นซิลิคอนเหมือนเดิมซึ่งมีความหนาแน่นในทางทฤษฎีเพียง 2.32 g/cm<sup>3</sup> ขณะที่การทำ ในไตรเดชันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจากซิลิคอนเป็นซิลิคอนไนไตรด์ซึ่งมีความ หนาแน่นในทางทฤษฎีสูงถึง 3.19 g/cm<sup>3</sup>





#### 5.1.2 ความแข็ง

จากการทดลองพบว่าเมื่อผงซิลิคอนมีขนาดเล็กลง จะได้ค่าความแข็งของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่า ขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน preform ซึ่งมีโครงสร้างเป็นซิลิคอนนั้น พบว่าขนาดผงซิลิคอนที่เล็กกว่าจะมีค่าความหนาแน่นที่สูงกว่า และมี % รูพรุนที่ต่ำกว่าด้วย ดังอภิปรายไว้ในเรื่องความหนาแน่น ส่วนชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาด อนุภาคผงซิลิคอนเล็กกว่านอกจากมีความหนาแน่นที่มากกว่า มี % รูพรุนต่ำกว่า แล้วยังพบว่า มีโครงสร้างของเฟล α-Si<sub>a</sub>N<sub>4</sub> ในโครงสร้างมากกว่าในชิ้นงานที่มีอนุภาคผงซิลิคอนเริ่มต้น ขนาดใหญ่ ซึ่งเฟล α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> นี้จะมีความแข็งสูงกว่า β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ซึ่งส่งผลให้ได้ความแข็งเพิ่มขึ้น (อธิบายการเกิดเฟสในหัวข้อ 5.2)

#### 5.1.3 ความแข็งแรงต่อการดัด

จากการทดลองพบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลง จะได้ค่าความแข็งแรงต่อการดัด ของชิ้นงาน Preform และชิ้นงาน RBSN เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่า ขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาที่ ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าความแข็งแรงต่อการดัดอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน preform มีโครงสร้างเป็นซิลิคอน โดยพบว่าชิ้นงาน preform ที่มีขนาดผง ซิลิคอนที่เล็กกว่าจะมีค่าความหนาแน่นที่สูงกว่าและมี % รูพรุนที่ต่ำกว่าด้วย ดังอภิปรายไว้ใน เรื่องความหนาแน่น จึงส่งผลให้ได้ค่าความแข็งแรงต่อการดัดเพิ่มขึ้น ส่วนชิ้นงาน RBSN ที่มี ขนาดอนุภาคผงซิลิคอนเล็กกว่านั้นนอกจากมีความหนาแน่นมากกว่า มี % รูพรุนต่ำกว่าแล้ว ยังมีโครงสร้างของเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ในโครงสร้างมากกว่าในชิ้นงานที่มีอนุภาคผงซิลิคอนเริ่มต้น ขนาดใหญ่ ซึ่งเฟล α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> นี้จะมีความแข็งสูงกว่า β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ซึ่งส่งผลให้ได้ความแข็งแรงต่อ การดัดเพิ่มขึ้น (อธิบายการเกิดเฟสในหัวช้อ 5.2)

โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงต่อการดัดกับสัดส่วน % รูพรุน ในชิ้นงาน ดังสมการที่ 5.2 [William, 1994]

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{o} \exp \left(-nP\right)$$
 [5.2]

เมื่อ **σ**<sub>0</sub> และ n เป็นค่าคงที่จากการทดลอง และ P คือสัดส่วนปริมาตรรูพรุนในชิ้นงาน ซึ่งจาก สมการที่ 5.2 พบว่าเมื่อชิ้นงาน RBSN มีความหนาแน่นมากหรือมีรูพรุนในชิ้นงานน้อย จะทำ ให้ค่าความแข็งแรงต่อการดัดมีค่าเพิ่มขึ้น และผลจากการทดลองก็เป็นไปในแนวเดียวกับ สมการที่ 5.2 โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงต่อการดัดและ % รูพรุน ของ ชิ้นงาน RBSN ได้ดังรูปที่ 5.2 ซึ่งพบว่าเมื่อปริมาณรูพรุนเพิ่มขึ้นจะได้ค่าความแข็งแรงต่อการ ดัดลดลง



รูปที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงต่อการดัดและ % รูพรุน

#### 5.1.4 โมดูลัสของยัง

จากการทดลองพบว่าเมื่อขนาดของผงซิลิคอนเล็กลง จะได้ค่าโมดูลัสของยังเพิ่มขึ้น โดย เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน Preform จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อค่าโมดูลัสของยังเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาที่ชิ้นงาน RBSN จะพบว่าขนาดผงซิลิคอนส่งผลต่อโมดูลัสของยังอย่างเด่นซัด ทั้งนี้เหตุผลเดียวกันกับสมบัติด้านความแข็งแรงต่อการดัด คือเมื่อพิจารณาชิ้นงาน preform ซึ่ง ยังมีโครงสร้างเป็นซิลิคอน เมื่อมีขนาดผงซิลิคอนที่เล็กกว่าจะมีค่าความหนาแน่นที่สูงกว่าและ มี % รูพรุนที่ต่ำกว่าด้วย ส่งผลให้ได้ค่าโมดูลัสของยังเพิ่มขึ้น ส่วนชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาด อนุภาคผงซิลิคอนเล็กกว่านั้นนอกจากมีความหนาแน่นมากกว่า มี % รูพรุนต่ำกว่าแล้วยังมี โครงสร้างของเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ในโครงสร้างมากกว่าในชิ้นงานที่มีอนุภาคผงซิลิคอนเริ่มต้นขนาด ใหญ่ ซึ่งเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> นี้จะมีความแข็งสูงกว่า β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ซึ่งส่งผลให้ได้ค่าโมดูลัสของยังเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน (อธิบายการเกิดเฟสในหัวข้อ 5.2)

โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสของยังกับสัดส่วน % รูพรุนในชิ้นงาน ดังสมการที่ 5.3 [William, 1994]

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{o} (1 - 1.9 \,\mathrm{P} + 0.9 \,\mathrm{P}^{2})$$
 [5.3]

เมื่อ E<sub>0</sub> คือ modulus of elasticity of the nonporous material และ P คือสัดส่วนปริมาตรรู พรุนในชิ้นงาน ซึ่งจากสมการที่ 5.3 พบว่าเมื่อชิ้นงาน RBSN มีความหนาแน่นมากหรือมีรูพรุน ในชิ้นงานน้อย จะทำให้ค่าโมดูลัสของยังมีค่าเพิ่มขึ้น และยิ่งมีสัดส่วนปริมาตรรูพรุนเพิ่มขึ้นยิ่ง ได้ค่าโมดูลัสของยังลดลงเป็นอย่างมาก และผลจากการทดลองนี้ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับ สมการที่ 5.3 โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสของยังและ % รูพรุน ของชิ้นงาน RBSN ได้ดังรูปที่ 5.3 ซึ่งพบว่าเมื่อปริมาณรูพรุนเพิ่มขึ้นจะได้ค่าโมดูลัสของยังลดลง



รูปที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสของยังและ % รูพรุน

5.1.5 Fracture toughness, K<sub>1C</sub>

จากการทดลองพบว่าเมื่อผงซิลิคอนมีขนาดเล็กลง จะได้ค่า Fracture toughness หรือ K<sub>1C</sub> ของชิ้นงาน RBSN ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดอนุภาคผง ซิลิคอนเล็กกว่า มีค่าความแข็งสูงกว่า (ดังได้อภิปรายในหัวข้อ 5.1.2) ซึ่งจากสมการหาค่า Fracture toughness (สมการที่ 3.7) พบว่าค่า K<sub>1C</sub> จะเป็นสัดส่วนผกผันกับค่าความแข็งของ ชิ้นงาน แต่ทั้งนี้ค่าความแข็งที่ได้มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง อีกทั้งรอยแตกบนผิวชิ้นงานไม่ คมทำให้การวัดความยาวรอยแตกที่ได้ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การคำนวณค่า K<sub>1C</sub> ในกรณีเทียบกับ ค่าความแข็งนี้มีความไม่ชัดเจนตามไปด้วย อีกทั้งวิธีการทดสอบหาค่า K<sub>1C</sub> แบบ Indentation Fracture ที่ใช้ในการทดลองนี้ไม่เหมาะที่จะนำมาทดสอบ เนื่องจากชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ มีรอยแตกจากการกดที่ไม่คม โดยทั้งนี้วิธี Indentation Fracture จะเหมาะกับชิ้นงานที่มีความ เปราะสูงและให้รอยแตกที่มีความคมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นวัสดุประเภทแก้ว เป็นต้น

สำหรับวิธีที่เหมาะสมในการวัดค่า K<sub>ic</sub> ของชิ้นงาน RBSN ซึ่งมีรอยแตกที่ไม่คม ควรจะ ใช้วิธีทดสอบ compact ตามมาตรฐาน ASTM E 813 โดยเตรียมชิ้นงาน ดังรูปที่ 5.4 ซึ่งมี ลักษณะเป็น edge-notched



รูปที่ 5.4 ชิ้นงานทดสอบสำหรับหาค่า K<sub>10</sub> [ASTM E1820-01, pp.1046]

หรืออีกวิธีในการช่วยวิเคราะห์ค่า K<sub>10</sub> คือการตรวจสอบโครงสร้างของขึ้นงาน RBSN เพื่อตรวจสอบลักษณะเฟลที่เกิดในโครงสร้าง เพราะจากการทดลองที่ผ่านมา เช่น การทดลอง ของ Lee และคณะ [2001] ที่พบว่าขึ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นใหญ่จะให้ค่า ความแข็งที่ต่ำกว่า แต่ว่าให้ค่า Fracture strength และค่า Fracture toughness มากกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นใหญ่ จะเกิดการโตของเกรนซิลิคอนไนไตรด์ที่เป็นแท่งยาว (rod-like Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> grain) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังรูปที่ 5.5 ซึ่งขึ้นงานที่มีผงซิลิคอนขนาดใหญ่จะมี rod-like Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ที่โตกว่าและมากกว่า ซึ่งจะส่งเสริมการ crack bridging และ crack deflection ได้ดีกว่า ทำให้มีค่า K<sub>10</sub> สูง



รูปที่ 5.5 Fracture surfaces ที่ได้จากกล้อง SEM ของชิ้นงาน GPSed-RBSN ของ a) ผงซิลิคอนขนาด 2 μm และ b) ผงซิลิคอนขนาด 7 μm [Lee และคณะ, 2001]

# 5.2 ปริมาณเฟสในโครงสร้างของชิ้นงาน RBSN ที่ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นต่าง ๆ

จากผลการทดลอง พบว่าปริมาณ Q-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> มีแนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้นเมื่อขนาดอนุภาคผง ซิลิคอนเริ่มต้นลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาชิ้นงานที่มีขนาดของอนุภาคผงเล็กกว่า จะมีพื้นที่ผิวในการ ทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ทำให้มีออกซิเจนจำนวนน้อยๆ บริเวณผิวของซิลิคอน ซึ่งออกซิเจนเหล่านี้จะ สามารถเปลี่ยนในโตรเจนอะตอม (active nitrogen) ไปเป็นในโตรเจนโมเลกุลได้ดังปฏิกิริยา [2.12] และ [2.13] ดังแสดงด้านล่าง

$$N + O_2 \rightarrow NO + O$$
  
 $N + NO \rightarrow N_2 + O : \Delta H^{\circ}_{298} = -313 \text{ kJ}$ 

โดยที่ในโตรเจนโมเลกุลที่เกิดขึ้นจะส่งเสริมให้เกิดเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกิด จากปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส และในโตรเจนอะตอมจะส่งเสริมให้เกิดเฟส β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ดังนั้นการที่มี พื้นที่ผิวมากจะส่งผลให้เกิดเฟสแอลฟาซิลิคอนในไตรด์ขึ้นบริเวณพื้นที่ทำปฏิกิริยา (พื้นที่ผิวที่ ปกติจะถูกปกคลุมด้วยออกไซด์) ทำให้อั<mark>ตร</mark>าส่วนของ α/β เพิ่มขึ้น [Jennings, 1983]

และพบว่า  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะเกิดได้ในทั้ง 2 ขนาด โดยไม่คำนึงถึงขนาดผง เริ่มต้น [Lee et al., 2001] ซึ่งสัดส่วนของ  $\beta/(\alpha+\beta)$  จะขึ้นกับขนาดของผง โดยที่ผงขนาดใหญ่ จะพบว่า  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เปลี่ยนไปเป็น  $\beta$ - Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ได้เร็วกว่าผงขนาดเล็ก เพราะว่าผงขนาดใหญ่มีเฟส ของเหลวมากกว่านั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากผงขนาดใหญ่จะมีชั้นของซิลิกาปกคลุมน้อยกว่าและ จากการกระจายตัวของ additive เป็นแบบ heterogeneous มากกว่าผงขนาดเล็กถึงแม้ว่า ปริมาณ additive จะเท่ากัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเฟสของเหลวมากขึ้นทำให้ได้สัดส่วนของ  $\beta/(\alpha+\beta)$  เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

Yasutomi และคณะ [1997] ได้ทำการศึกษากลไกการเกิดไนไตรเดชันของอนุภาค ชิลิคอน พบว่าชั้นของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> จะบางลงเมื่อขนาดผงลดลง และชั้นของ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเริ่ม เกิดไนไตรเดชันที่อุณหภูมิ 1100-1250 °C ระหว่างผงซิลิคอนและชั้นของออกไซด์ด้านนอก ซึ่ง พบว่าชั้นของซิลิคอนไนไตรด์ที่เกิดขึ้นมีความบางประมาณ 10-50 nm มีผลทำให้การเกิดไนไตร เดชันช้าลง เนื่องจากปฏิกิริยาถูกควบคุมด้วยการแพร่ ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งการที่ผงขนาดเล็กมีชั้น ชิลิคอนไนไตรด์ที่บางกว่าผงขนาดใหญ่จึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาไนไตรเดชันได้ดีกว่าด้วย

#### 5.3 การเกิดออกซิเดชันของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์

#### 5.3.1 ค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดออกซิเดชันของชิ้นงาน RBSN

จากการทดลองนี้ พบว่าค่าพลังงานกระตุ้นที่ทำให้ชิ้นงาน RBSN ที่มีขนาดผงซิลิคอน เริ่มต้น 3 ไมครอน เกิดออกซิเดชันระหว่างอุณหภูมิ 700-1000 °C (เกิดชั้นฟิล์มซิลิกาขึ้นบน ผิวชิ้นงาน) มีค่าเท่ากับ 209 kJ/mol (50 kcal/mol) ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับการทดลองที่ผ่านมา เช่นในการทดลองของ Horton [1969] ได้ทดสอบออกซิเดชันของผงซิลิคอนไนไตรด์บริสุทธิ์ใน อากาศแห้งที่อุณหภูมิระหว่าง 1065-1340 °C Hortor ได้ค่าพลังงานกระตุ้นเท่ากับ 255 kJ/mol หรือในการทดลองของ Fitzer และ Ebi [1974] พบว่าการเกิดออกซิเดชันมี 3 ช่วงที่อุณหภูมิ ระหว่าง 1000-1600 °C โดยได้ค่าพลังงานกระตุ้นแตกต่างกัน 3 ค่า โดยที่อุณหภูมิระหว่าง 1000-1200 °C, 1200-1400 °C และ 1400-1600 °C จะเกิดซิลิกาด้วยพลังงานกระตุ้น 151 kJ/mole, 90 kJ/mole และ 280 kJ/mole ตามลำดับ หรือในการทดลองอื่นๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 5.1

Investigators	Temperature range (K)	Activation energy, Q (kJ/mol)
Deal ແລະ Grove	1073-1473	119.3
Du และคณะ	1373-1673	464
Choi และคณะ	1273-1573	330
Hirai และคณะ	1823-1923	420
Schiroky และคณ <mark>ะ</mark>	1673-1873	276

ตางรางที่ 5.1 ค่าพลังงาน<mark>กระตุ้นของการเกิดออกซิเดชัน</mark>ของซิลิคอนไนไตรด์

[Jacobson, 1993]

# 5.3.2 ความแข็งของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน

จากการทดลองพบว่าเมื่อชิ้นงาน RBSN เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีค่าความ แข็งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากชั้นฟิล์มซิลิกาบนผิวของชิ้นงานนั่นเอง โดยเมื่อเปรียบเทียบความแข็ง พบว่าซิลิกามีความแข็งมากกว่าคืออยู่ที่ 11.5-13.5 GPa ในขณะที่ RBSN มีค่าความแข็งอยู่ที่ ประมาณ 11 GPa ซึ่งเมื่ออุณหภูมิการเกิดออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจะได้ชั้นฟิล์มซิลิกามากขึ้น ทำให้ ความแข็งโดยรวมของชิ้นงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จากผลการทดลองพบว่ามีความเบี่ยงเบน มาตรฐานมาก ทำให้ค่าความแข็งที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้อาจเพราะการเกิดของชั้นซิลิ กามีความไม่สม่ำเสมอในโครงสร้าง โดยในแต่ละบริเวณบนผิวของชิ้นงานอาจจะ dense ไม่ เท่ากัน และเมื่อพิจารณาจากภาพโครงสร้างจะพบว่าชั้นความหนาของซิลิกามีความลึกในแต่ ละบริเวณไม่เท่ากันอีกด้วย

# 5.3.3 Fracture toughness, K<sub>1c</sub> ของชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชัน

จากการทดลองพบว่าเมื่อชิ้นงาน RBSN เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีค่า Fracture toughness หรือ K<sub>1C</sub> ของชิ้นงาน RBSN ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน RBSN ที่เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงกว่าจะมีความหนาของชั้นซิลิกามากกว่า ซึ่งซิลิกาที่ เกิดขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมีความเปราะมากขึ้น เนื่องจากซิลิกาเป็นเฟสที่มีความเปราะ ดังนั้นจึง ส่งผลให้ชิ้นงานที่เกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงขึ้นมีค่า K<sub>1C</sub> ลดลง

และเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวในหัวข้อ 5.1.5 การใช้วิธี Indentation Fracture ในการหา ค่า K<sub>1c</sub> ไม่เหมาะกับการทดสอบชิ้นงานในการทดลองนี้เนื่องจากชิ้นงานมีรอยแตกจากการกด ไม่คม ดังนั้นค่า K<sub>1c</sub> ที่ได้จากการทดลองนี้จึงไม่ชัดเจน



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ สามารถสรุปได้ดังนี้

- เมื่อขนาดอนุภาคผงซิลิคอนเริ่มต้นเล็กลง จะส่งผลให้ความหนาแน่น ความแข็ง ความแข็งแรงต่อการดัด และโมดูลัสของยัง มีค่าเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนปริมาณเฟส α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> เพิ่มขึ้น โดยสมบัติทางกลจะแปรตามความหนาแน่น % รูพรุน และ ปริมาณ α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>
- ชิ้นงานพรีฟอร์มและชิ้นงานรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ ที่ผ่านการ CIP จะได้ความ หนาแน่น ความแข็ง ความแข็งแรงต่อการดัด และโมดูลัสของยัง มากกว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่าน การ CIP
- ชิ้นงาน RBSN มีค่าพลังงานกระตุ้นในการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิระหว่าง 700-1000 °C เท่ากับ 209 kJ/mol (50kcal/mol)
- เมื่ออุณหภูมิการเกิดออกซิเดชันเพิ่มขึ้น ความหนาชั้นฟิล์ม SiO<sub>2</sub> จะเพิ่มขึ้น

#### 6.2 ข้อเสนอแนะ

- จากการศึกษาการเกิดออกซิเดชันของชิ้นงาน RBSN นั้นพบว่าหากใช้งานที่อุณหภูมิ 1000 °C ขึ้นไปพบว่ามีการเกิดขึ้นของชั้นฟิล์ม SiO<sub>2</sub> มากพอสมควร (58 ไมครอน เมื่อเผา เป็นเวลา 20 ชั่วโมง) ถึงแม้ว่าสมบัติต่างๆ ที่ได้อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่ก็ควรศึกษาการเกิด ออกซิเดชันที่อุณภูมิใช้งานจริงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน พร้อมทั้งหาแนว ทางการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดออกซิเดชันนั้น
- ในการใช้งานจริงของหัวฉีดในโรงไฟฟ้า อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัด กร่อน ดังนั้นควรทำการศึกษาสมบัติด้านทนต่อการกัดกร่อนของชิ้นงาน RBSN ด้วย

#### รายการอ้างอิง

#### ภาษาไทย

- กุลจิรา สุจิโรจน์ และเบญญา เชิดหิรัญกร. <u>การผลิตและหาลักษณะเฉพาะของ Reaction-boned</u> <u>silicon nitride</u>. รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์, 2541.
- กันยาทิพย์ ตันติคมน์. <u>การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอกชั่นบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543.
- วีรศักดิ์ หอมกระจาย. <u>การเผาแบบปราศจากแรงดันของซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ยิทเทรียมออกไซด์</u> <u>อลูมิเนียมออกไซด์ และแมกนีเซียมออกไซด์เป็นสารปรับปรุงคุณสมบัติ</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

#### ภาษาอังกฤษ

Atkinson, A., Leatt, P.J., Moulson, A.J., and Roberts, E.W. A Mechanism for the Nitridation of Silicon Powder Compacts. Journal of Materials Science (1974): 981-984.

Ekstrom, T., and Ingelstrom, N. Characterisation and Properties of Sialon Materials in Non-Oxide Technical and Engineering Ceramics 5 (ed. S. Hampshire). <u>Elsevier</u>, 1992.

Fitzer, E., and Ebi, R. Kinetics Studies all the Oxidation of Silicon Carbide, in: <u>Silicon</u> <u>Carbide-1973</u>, ed. By R. C. Marshall et al, Columbia, SC, 1974.

Franz, I., And Langheinrich, W. Solid State Electron. vol. 14 (1971): 499.

- Franz, I., And Langheinrich, W. Proc. Seventh Internat. Symp. Reactivity of Solid, ed. By J.S. Anderson et al, London, 1972.
- Gogotsi, Y.G., and Grathwohl, G. Stress-Enhanced Oxidation of Silicon Nitride Ceramics. J. Amer. Ceram. Soc. Vol.76 No.12 (1993): 3093-30104.
- Goursat, P., Lortholary, P., Tetard, D., and Billy, M. Silicon Nitride and Oxynitride Stability in Oxygen Atmosphere at High Temperature. <u>Proc. Seventh Internat. Sym. Reactivity Of</u> <u>Solids</u>, ed. By Anderson J. S. et al, London, 1972.
- Haggerty, J.S., and Lightfoot, A. Oxidation and Fracture Strength of High-Purity Reaction-Bonded Silicon Nitride. <u>J. Amer. Ceram. Soc</u>. 72 (September 1989): 1675-1679.

Henderson, C.M.B., and Taylor, D. Trans. Brit. Ceram. Soc. 74 (1975).

Horton, R. M. J. Amer. Ceram. Soc. 52 (1969): 121.

- Jacobson, N., S. Corrosion of Silicon-Based Ceramics in Combustion Environments. <u>American Ceramic Society</u> Vol.76 No.1 (1993): 3-28.
- Jennings, H.M., Dalgleish, B.J., and Pratt, P.L. Reactions between silicon and nitrogen Part 2 Microstructure. <u>Journal of Materials Science</u> 23 (1983).
- Jennings, H.M. Review on Reactions between silicon and nitrogen Part 1 Mechanisms. Journal of Materials Science 18 (1983).
- Jennings, H.M., and Richman, M.H. Formation Mechanisms and Kinetics of Reaction-Boned Silicon Nitride. <u>Journal of Materials Science</u> 11 (1976).
- John, S., Haggerty, Ceramic-Ceramic Composites with Reaction Bonded Matrices. <u>Materials</u> <u>Science and Engineering</u>, Vol. A107, (1989).
- Kainasskii, I. S., Degtyareva, E.V., and Kukhtenko. Carborundum Products Bonded with Silicon Nitride. <u>Ogneupory</u> 25 (April 1960): 175-180.
- Kofstad, P. <u>High Temp. Oxidation of Metals</u>. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1996. Krasotkina, N. I. <u>Ogneupory</u>, 6 (1967): 33.
- Lee, B.T., Yoo, J.H., and Kim, H.D. Size effect of raw Si powder on microstructures and mechanical properties of RBSN and GPSed-RBSN bodies. <u>Journal of Materials Science</u> A000 (2001): 000-000.
- Longland, P., and Moulson, A.J. Journal of Materials Science 13 (1978).
- Messier, D.R., Riley, F.L., and Brook, R.J. Journal of Materials Science 13 (1978).
- Morgan, P.E.D. <u>ibid</u> 15 (1980).
- Morrell, R., Handbook of Porosities of Technical and Engineering Ceramics, Part I: <u>An</u> <u>Introduction for the Engineer and Designer</u>. London, 1985.
- Mostafa Maalmi and Arvind Varma. Intrinsic Nitridation Kinetics of High-Purity Silicon Powder. <u>AIChE Journal</u> Vol. 42 No.12 (1996).
- Moulson, A.J. Review Reaction-Boned Silicon Nitride; its formation and properties. <u>Journal of</u> <u>Materials Science</u> 14 (1979).

Neil, N., Ault, and Russell, L., Yeckley. Silicon Nitride. <u>Ceramic Bulletin</u> Vol. 71 No. 5 (1992). Pehlke, R.D., and Elliott, J.F. <u>Trans. Met. Soc. AIME</u> 215 (1959). Sheldon, B. W., Rankin, J., and Haggerty, J. S. Formation of Reaction-Boned Silicon Nitride from Silane-Derived Silicon Powders: Nucleation and Growth Mechanisms. <u>J. Amer.</u> <u>Ceram. Soc.</u> Vol.78 No.6 (1995): 1624-1632.

Singhal, S. C. J. Mater. Sci. 11 (1976): 500.

- Stull, D.R., and Prophet, H. <u>JANAF Thermochemical Tables</u>. U.S. National Bureau of Standards, Washington, DC, 1971.
- Sujit, Das, and T., Randall Curlee. The Cost of Silicon Nitride Powder and the Economic Viability of Advanced Ceramics. <u>American Ceramic Society Bulletin</u> Vol.71 No.7 (1992).
- Taffner, U., Carle, V., Schafer, U., et al. Ceramography of high performance ceramics Part V; silicon nitride. <u>Pract. Met.</u> (1991).
- Wagner, C. J. Appl. Phys. 29 (1958): 1295.
- William, E., Lee, and Mark, W., Rainforth. <u>Ceramic Microstructures Property Control by</u> <u>Processing</u>. Chapman & Hall, London, UK, 1994.
- Yasutomi, Y., Sawai, Y., and Miyata, M. J. Cream. Soc. Japan vol.105 (1997): 634-639.
- Ziegler G., Heinrich J., Wotting G., Review: Relationships between processing, microstructure and properties of Dense and Reaction-Boned Silicon Nitride, <u>Journal of</u> <u>Materials Science</u>, Vol. 22, (1987).

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวกิตติมา ศิลปษา เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2516 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 2539 จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยจำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งวิศวกรประจำโรงงาน จนกระทั่งปี 2540 จึง ลาออกและเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน และได้ลาศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมโลหการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2543



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สถาบนวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

# ภาคผนวก n. ข้อมูลการวัดขนาดผงด้วยเครื่อง Mastersizer

Range Lens: 3	OORF mm	Beam Length: 2.4	0 mm	Dispersent R L = 1	mpler: MS1	0	bscuration: 12.6 %
Analysis Mode	I: Polydisperse	[Particle K.I. = ( 2.3	5955, 1.0000),	Dispersant R.I. = 1	.3300j		Residual: 0.751 %
woomcations: i	None						
			Result	Statistics			
Distribution 1 y	pe: Volume	Concentration = $0$	0.0023 %Vol	Density = $2.320 \text{ g/}$	cub. cm	Specific S.A.	= 1.9866 sq.m/g 7.42 um
D [4, 3] = 6.6	58 um	D [3, 2] = 1.30 u	m	Span = 5.118E+00		Uniformity = $1.5$	595E+00
Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	in %	Size High (un	n) Under%
0.05	0.04	0.06	0.04	6.63	4.13	7.72	75.00
0.06	0.11	0.07	0.15	7.72	3.77	9.00	78.77
0.07	0.21	0.08	0.37	10.48	3.20 2.78	10,48	82.03
0.09	0.44	0.00	1.13	12.21	2.40	14.22	87.21
0.11	0.53	0.13	1.66	14.22	2.13	16.57	89.34
0.13	0.58	0.15	2.24	16.57	1.97	19.31	91.31
0.15	0.60	0.17	2.84	19.31	1.85	22.49	93.16
0.17	0.56	0.20	3.40	22.49	1.72	26.20	94.88
0.20	0.40	0.23	3.05	20.20	1.53	30.03	97.60
0.23	0.16	0.31	4.32	35.56	0.96	41.43	98.65
0.31	0.12	0.36	4.45	41.43	0.66	48.27	99.31
0.36	0.24	0.42	4.69	48.27	0.40	56.23	99.71
0.42	0.55	0.49	5.24	56.23	0.23	65.51	99.94
0.49	1.03	0.58	6.27	65.51	0.05	76.32	100.00
0,58	2.51	0.67	10.50	88.91	0.00	103 58	100.00
0.78	3.20	0.91	13.70	103.58	0.00	120.67	100.00
0.91	3.84	1.06	17.53	120.67	0.00	140.58	100.00
1.06	4.33	1.24	21.87	140.58	0.00	163.77	100.00
1.24	4.61	1.44	26.48	163.77	0.00	190.80	100.00
1.44	4.63	1.68	31.11	190.80	0.00	222.28	100.00
1.00	4.36	2.28	39.97	258.95	0.00	200.90	100.00
2.28	4.26	2.65	44.23	301.68	0.00	351.46	100.00
2.65	4.27	3.09	48.51	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	4.37	3.60	52.87	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.49	4.19	57.37	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.57	4.00	66.48	647 41	0.00	754.23	100.00
5,69	4.39	6.63	70.87	754.23	0.00	878.67	100.00
				%			
10							
1							90
							80
							70
							60
							50
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				40
							30
							20
1				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	•		10
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and a start and			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
0.01	0.	1	1.0	10.0	100	.0	1000.0
			Particle Dia	ameter (µm.)			
	1		1.		له.		
	รูปที่ 1	แสดงผลของขนาเ	<b>ลผงซิลิคอนที</b> ่ไ	ด้จากการวัดด้วยเ	ครื่อง Mast	ersizer	
	-		44 4 V	and the second			
		a) แลดงขนาดผง	บาลคอนเรมดา	ระสมุฏ 3 mm (202	% distributi	on)	

88

			Syste	m Details			
Range Lens: 300F Presentation: 3TJI	RF mm	Beam Length: 2.40 [Particle R.I. = ( 2.5	0 mm 935, 1.0000);	Sa Dispersant R.I. = 1.	mpler: MS1 3300]	Obscu	uration: 15.5 %
Analysis Model: P Modifications: Nor	Polydisperse ne			· ·		Resi	dual: 0.682 %
			Result	Statistics			
Distribution Type: Mean Diameters: D [4, 3] = 8.76 ι	Volume um	Concentration = 0 D (v, 0.1) = 1.14 D [3, 2] = 2.03 u	).0046 %Vol um m	Density = 2.320 g / D (v, 0.5) = 6.23 u Span = 3.096E+00	cub. cm m	Specific S.A. = 1. D (v, 0.9) = 20.43 Uniformity = 9.558	2736: sq. m / g 3 um E-01
Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.03	0.06	0.03	6.63	5.35	7.72	57.47
0.06	0.07	0.07	0.10	7.72	5.43	9.00	62.90
0.07	0.14	0.08	0.24	9.00	5,44	10.40	72 76
0.08	0.21	0.09	0.45	12.21	5.42	12.21	79.01
0.09	0.28	0.11	1.05	14.22	1.06	14.22	83.06
0.11	0.33	0.13	1.00	16.57	4.50	10.07	88.48
0.15	0.30	0.15	1 79	10.37	3.80	22.49	92.36
0.17	0.34	0.20	2 13	22 49	3 10	26.20	95 46
0.20	0.27	0.23	2.41	26.20	2.30	30.53	97.76
0.23	0.17	0.27	2.57	30.53	1.51	35.56	99.28
0.27	0.06	0.31	2.64	35,56	0.72	41.43	100.00
0.31	0.01	0.36	2.65	41.43	0.00	48.27	100.00
0.36	0.04	0.42	2.69	48.27	0.00	56.23	100.00
0.42	0.18	0.49	2.87	56.23	0.00	65.51	100.00
0.49	0.42	0.58	3.29	65.51	0.00	76.32	100.00
0.58	0.78	0.67	4.07	76.32	0.00	88.91	100.00
0.67	1.20	0.78	5.26	88.91	0.00	103.58	100.00
0.78	1.61	0.91	6.88	103.58	0.00	120.67	100.00
0.91	2.01	1.06	8.89	120.67	0.00	140.58	100.00
1.06	2.37	1.24	11.26	140.58	0.00	163.77	100.00
1.24	2.63	1.44	13.89	163.77	0.00	190.80	100.00
1.44	2.79	1.68	16.68	190.80	0.00	222.28	100.00
1.68	2.90	1.95	19.58	222.28	0.00	258.95	100.00
1.95	3.03	2.28	22.01	208.90	0.00	301.08	100.00
2.28	3.21	2.65	20.82	301.08	0.00	301.40	100.00
2.65	3.48	3.09	29.30	301.40	0.00	409.45	100.00
3.09	3.04	3.00	37 30	409.45	0.00	555 71	100.00
3.00	4.24	4.15	42.00	555 71	0.00	647 41	100.00
4.15	4.02	5.69	46.94	647 41	0.00	754 23	100.00
5.69	5.18	6.63	52.12	754.23	0.00	878.67	100.00
10				%			100
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······				******	90
							80
							70
-							50
							40
-				LIN \			30
+							20
0		/					10
0.01	C	).1	1.0 Particle [	10.0 Diameter (um.)	1(	0.0	1000.0
			ratuciet	nameter (µm.)			

# รูปที่ 1 - b) แสดงขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นเฉลี่ย 6 µm (50% distribution)

Range Lens: 300RF mm Presentation: 3TJD Analysis Model: Polydisperse Modifications: None

System Details
Sampler: MS1
Obscuration: 21.6 %

Prime
Beam Length: 2.40 mm
Sampler: MS1
Obscuration: 21.6 %

Image: Disperse of the second secon



รูปที่ 1 - c) แสดงขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้นเฉลี่ย 12 µm (50% distribution)

#### ภาคผนวก ข. ข้อมูลการหา True density ด้วย Ultrapycnometer

QUANTACHROME CORPORATION Ultrapycnometer 1000 Version 2.12 Analysis Report

Sample & User Parameters

Analysis Parameters

Sample ID: N3 Weight: 0.7316 grams Analysis Temperature: 24.8 degC

Date: 03-18-03 Time: 14:03:42 User ID: PATARAWAN Cell Size: Small V added - Small: 13.2349 cc V cell: 14.1472 cc Target Pressure: 17.0 psi Equilibrium Time: Auto Flow Purge: 1:00 min. Maximum Runs: 5 Number of Runs Averaged: 5

Results

Deviation Requested: 0.010 % Average Volume: 0.2646 cc Average Density: 2.7651 g/cc Coefficient of Variation: 0.4392 % Deviation Achieved: +/- 0.1878 % Std. Dev. : 0.0012 cc Std. Dev. : 0.0122 g/cc

Tabular Data

RUN	VOLUME (cc)	DENSITY (g/cc)
1	0.2629	2.7833
2	0.2638	2.7730
3	0.2652	2.7583
4	0.2648	2.7632
5	0.2662	2.7479

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการวัดค่า True density ของชิ้นงาน RBSN ที่ได้จากการทดลอง

# ภาคผนวก ค. ข้อมูลและกราฟจากการทดสอบ Three-point bending

Mechanical Characterization Laboratory National Metal and Materials Tech Center Rama VI Rd, Rajdhevee, Bangkok, Thailand

Kanyatip test-S.I.unit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type: Operator name:	Flex test		Instron Corporation Series IX Automated Materials Testing System 7.51.00				
Sample Identification:	Preform_3µ		Test Date: Friday, January 25, 2002				
Interface Type:	4500						
Sample Rate (pts/secs): 5.0000			Humidity (%): 64				
Crosshead Speed: 2nd Crosshead Speed	0.0450 1: 0.0000	mm/min mm/min	Temperature: 23 C				
Full Scale Load Rang	e: 10.003	kN					

Sample comments:

	Displement at Yield (mm)	Load at Yield (kN)	Stress at user Break (MPa)	Strain at user Break (mm/mm)	Stress at Yield (Max Load) (MPa)	Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
1	0.071	0.159	28.236	0.006	44.514	0.006	7788.195	0.159
2	0.055	0.183	15.646	0.005	43.553	0.005	9031.102	0.183
3	0.056	0.170	0.064	0.005	42,406	0.005	8820.971	0.170
4	0.059	0.195	0.085	0.005	49.995	0.005	10121.709	0.195
5	0.035	0.120	0.034	0.003	31.171	0.003	10401.704	0.120
Mean	0.055	0.166	8.813	0.005	42.328	0.005	9232.736	0.166
S.D.	0.013	0.029	12.784	0.001	6.884	0.001	1055.185	0.029

รูปที่ 3 แสดงข้อมูลจากการวัดขึ้นงานแบบ Three-point bending ด้วยเครื่อง Instion 4502 ของขึ้น งานที่ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa

a) ชิ้นงาน preform ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 µm
Kanyatip test-S.I.unit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type:FlexOperator name:testSample Identification:Preform_6Interface Type:4500			Instron Corporation Series IX Automated Materials Testing System Test Date: Friday, January 25, 2002
Sample Rate (pts/sec Crosshead Speed: 2nd Crosshead Speed	s): 5.0000 0.0450 d: 0.0000	mm/min mm/min	Humidity (%): 64 Temperature: 23 C
Full Scale Load Kang	ge: 10.003	KIN	

Sample comments:

	Displement at Yield (mm)	Displement Load at at Yield Yield (mm) (kN)		Stress Strain at user at user Break Break (MPa) (mm/mm)		Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
· 1	0.051	0.126	9.633	0.004	31.285	0.004	7344.598	0.126
2	0.042	0.093	0.053	0.003	28.864	0.003	8934.589	0.093
3	0.055	0.127	0.047	0.005	33.023	0.005	7210.797	0.127
4	0.049	0.136	-0.167	0.004	34.722	0.004	8329.445	0.136
5	0.047	0.128	0.074	0.004	32.718	0.004	8382.311	0.128
Mean	0.049	0.122	1.928	0.004	32.122	0.004	8040.348	0.122
S.D.	0.005	0.017	4.308	0.001	2.193	0.001	736.954	0.017

รูปที่ 3 - b) ขึ้นงาน Preform ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 µm

Kanyatip test-S.I.unit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type: Operator name: Sample Identification: Interface Type:		Flex test Preform_12µ 4500		Instron Corporation Series IX Automated Materials Testing System Test Date: Friday, January 25, 2002
	Sample Rate (pts/secs)	: 5.0000		Humidity ( % ): 64
	Crosshead Speed: 2nd Crosshead Speed:	0.0450 0.0000	mm/min mm/min	Temperature: 23 C
	Full Scale Load Range	: 10.003	kN	

Sample comments:

	Displcment at Yield (mm)	Load at Yield (kN)	Stress at user Break (MPa)	Strain at user Break (mm/mm)	Stress at Yield (Max Load) (MPa)	Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
1	0.039	0.121	16.594	0.003	32.224	0.003	10196.726	0.121
2	0.041	0.098	2.914	0.003	26.428	0.003	7789.217	0.098
3	0.046	0.075	0.055	0.004	22.017	0.004	6170.607	0.075
4	0.044	0.074	0.038	0.004	21.466	0.003	6444.677	0.074
5	0.044	0.128	0.067	0.004	33.331	0.004	9044.181	0.128
Mean	0.043	0.099	3.934	0.003	27.093	0.003	7929.082	0.099
S.D.	0.003	0.025	7.185	0.000	5,548	0.000	1710.329	0.025

รูปที่ 3 - c) ขึ้นงาน Preform ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 12 µm

Kanyatip test-S.Lunit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type: Operator name: Sample Identification: Interface Type:	Flex test RBSN_3µ 4500		Instron Corporation Series IX Automated Materials Testing System Test Date: Monday, March 04, 2002	7.51.00
Sample Rate (pts/sec	s): 5.0000		Humidity (%): 64	
Crosshead Speed: 2nd Crosshead Spee	0.0450 d: 0.0000	mm/min mm/min	Temperature: 23 C	
Full Scale Load Ran	ge: 10.000	kN		

Sample comments:

	Displcment at Yield (mm)	Load at Yield (kN)	Stress at user Break (MPa)	Strain at user Break (mm/mm)	Stress at Yield (Max Load) (MPa)	Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
1	0.101	1.037	-0.854	0.009	270.773	0.008	31851.037	1.037
2	0.140	1.016	0.523	0.012	251.482	0.012	21081.879	1.016
3	0.153	1.218	0.781	0.013	292.675	0.013	21996.549	1.218
4	0.111	0.682	0.351	0.009	205.644	0.009	24069.080	0.682
5	0.104	0.785	0.330	0.008	233.393	0.008	28952.039	0.785
Mean	0.122	0.948	0.226	0.010	250,793	0.010	25590.117	0.948
S.D.	0.023	0.214	0.630	0.002	33.522	0.002	4638.241	0.214

งหาลงกรณมหาวทยาลเ

รูปที่ 3 - d) ขึ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 µm

Kanyatip test-S.Lunit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type: Operator name:	Flex		Instron Corporation Series IX Automated Materials Testing System
Sample Identification: Interface Type:	RBSN_6µ 4500		Test Date: Monday, March 04, 2002
Sample Rate (pts/sec	s): 5.0000		Humidity (%): 64
Crosshead Speed: 2nd Crosshead Speed	0.0450 d: 0.0000	mm/min mm/min	Temperature: 23 C
Full Scale Load Rang	ge: 10.000	kN	

Sample comments:

	Displement at Yield (mm)	Load at Yield (kN)	Stress at user Break (MPa)	Strain at user Break (mm/mm)	Stress at Yield (Max Load) (MPa)	Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
1	0.079	0.619	0.195	0.007	152.391	0.007	22540.199	0.619
2	0.086	0.645	0.292	0.007	154.733	0.007	20904.609	0.645
3	0.072	0.556	0.234	0.006	135.964	0.006	21999.109	0.556
4	0.079	0.561	0.290	0.007	135.469	0.007	19645.729	0.561
5	0.079	0.630	0.290	0.007	158.930	0.007	23767.707	0.630
Mean	0.079	0.602	0.260	0.007	147.498	0.007	21771.471	0.602
<u>S.</u> D.	0.005	0.041	0.044	0.000	11.008	0.000	1573.050	0.041

รูปที่ 3 - e) ชิ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 µm

Kanyatip test-S.I.unit Modulus Limits: .25 & .75 Of Yield Load Compression Mode

Test type:	Flex		Instron Corporation
Operator name:	test		Series IX Automated Materials Testing System
Sample Identification:	RBSN_12 $\mu$		Test Date: Monday, March 04, 2002
Interface Type:	4500		
Sample Rate (pts/sec	s): 5.0000		Humidity (%): 64
Crosshead Speed:	0.0450	mm/min	Temperature: 23 C
2nd Crosshead Speed	1: 0.0000	mm/min	
Full Scale Load Rang	ge: 10.000	kN	

Sample comments:

	Displcment at Yield (mm)	nt Load Stress at at user Yield Break (kN) (MPa)		Strain at user Break (mm/mm)	Stress at Yield (Max Load) (MPa)	Strain at Yield (Max Load) (mm/mm)	Modulus (AutYoung) (MPa)	Load at Yield (Max Load) (kN)
1	0.051	0.313	0.187	0.004	84.390	0.004	20637.504	0.313
2	0.068	0.340	0.193	0.006	93.403	0.005	16922.682	0.340
. 3	0.065	0.396	0.217	0.005	107.604	0.005	20086.207	0.396
4	0.062	0.390	0.215	0.005	108.107	0.005	21482.738	0.390
5	0.070	0.470	0.204	0.006	126.643	0.006	21901.566	0.470
Mean	0.063	0.382	0.203	0.005	104.029	0.005	20206.141	0.382
S.D.	0.008	0.060	0.013	0.001	16.120	0.001	1967.596	0.060

งูฬาลงกรณมหาวทยาละ

รูปที่ 3 - f) ชิ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 12 µm



รูปที่ 4 แสดงกราฟระหว่าง Load & Displacement ที่ได้จากการทดสอบหาค่า Flexural Strength ของ ชิ้นงานที่ถูกอัดด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa a) ชิ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 3 µm



รูปที่ 4 - b) ขึ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 6 µm



รูปที่ 4 - c) ขึ้นงาน RBSN ขนาดผงซิลิคอนเริ่มต้น 12 µm

2-theta Pum-1.sld 1 (degree) 0.00 151 1611 80,00 Smoothing points Smoothing times 2-theta correction angle 9151 Scattering slit 70,00 5957 11E1-96E1-/nb) \$50 825 687} 1151 60,00 2437-955 6651 064 0.040 1.00 30.00 40.00 Cu 1 (degree) 0.2(trm) ZIN 608 50,00 Condition 999 688 1807 591 Step angle (deg.) Count time (sec) 40,00 Voltage (kV) Current (mA) Target name Divergence slit Receiving slit 1257 564.004.2 2057 509'7 1297-5128 5128 92852 Step 2-theta/theta Ordinary /687 2003/Feb/19 30,00 Pum-1.std RBSN-3 314 EBE 206 20,00 055 1120 9120 6287 Measurement method Measurement date Measurement axis Operator name Sample name Counts Filename Memo Mode Ig 250-102 3 500-400 ŝ 5 25 녌 5 แสดงกราฟที่ได้จากการตรวจสอบชิ้นงาน RBSN ด้วย XRD ของชิ้นงานที่ถูกอัด รูปที่ ด้วยแรงแบบแนวเดียวที่ 72 MPa และ CIP ที่ 300 MPa a) ชิ้นงาน RBSN ขนาดผงชิลิคอนเริ่มต้น 3 µm

ภาคผนวก ง. กราฟและข้อมูลจากการวัดด้วย XRD





41-0360					1	Wavelength= 1	.5406			
a-Si3N4	d.	Int	h	k	1	d.	Int	h	k	1
Silicon Nitride	6.71245 4.30985 3.87683 3.35902 2.88270	8 78 41 31 100	1 1 2 2	0 0 1 0 0	0 1 0 0 1	1.41768 1.40517 1.37539 1.35066 1.32062	24 13 3 30 10	4 0 1 3 3	1 0 0 2 1	1 4 2 3
Rad.: Cukal X: 1.5406 Filter: Graph Mono. d-sp: Diffractometer Cut off: Int.: Diffract. I/lcor.: Ref: Norris, D et al., Powder Diffraction, 5, 225 (1990)	2.80998 2.59276 2.53819 2.31318 2.27551 2.23788	11 85 99 54 11	0 1 2 1 3	0 0 1 1 1	2 0 1 2 0	1.30593 1.29914 1.29218 1.26912 1.23745 1.22901	5 20 11 2 5 9	5 4 3 4 4 2	013221	1 2 0 0 1
Sys.: Hexagonal  S.G.: P31c (159)    a: 7.7541(4)  b:  c: 5.6217(4)  A:  C: 0.7250    α:  β:  γ:  Z: [4]  mp:    Ref: Ibid.	2.15527 2.07962 1.93847 1.88373 1.86268 1.80458 1.76792	28 44 16 9 8 10 19	2322313	0 0 2 1 1 0 1	2 1 0 2 0 3 1	1.21069 1.18972 1.17885 1.15488 1.06580 1.05047 1.03803	1 9 5 8 2 3 3	25354243	0 2 1 1 0 2 2	2313534
Dx: $3.183$ Dm:SS/FOM: $F_{30}=75(.0108, 37)$ Produced by thermal decomposition of silicon diimide and the Starck powder by nitridation of metallic silicon. N4 Si3 type. Silicon used as an internal stand. PSC: hP28. To replace 9-250. Mwt: 140.28. Volume[CD]: 292.73.	$\begin{array}{c} 1.75217\\ 1.59554\\ 1.55206\\ 1.53978\\ 1.50680\\ 1.48557\\ 1.43648\\ \end{array}$	1 22 3 5 32 24	3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0 2 1 2 1 2 0	2 2 2 0 3 1 3	1.02755 1.01404 1.00711 .951047 .945521 .931122 .907846	7 3 2 3 1 4 4	4 5 6 4 5 6 5	3 1 3 3 2 3	2 3 1 3 1 0 2
33-1160						Wavelength=	1.5405	98		
β÷Si3N4	d.	Int	h	k	1	d.	Int	h	k	]
Silicon Nitride Rad.: CuKa1 & 1.5405 Filter: Mono. d-sp: Diffractometer Cut off: Int.: Diffract. I/lcor.: Ref: Natl. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 18, 59 (1981)	6.58300 3.80000 3.29300 2.66000 - 2.48900 2.31000 2.19390 2.17970 1.90130 1.89160 - 1.82750	34 35 100 99 93 9 10 31 8 5	1121213223	0 1 0 0 1 1 0 0 2 1	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	$\begin{array}{c} 1.16180\\ 1.15510\\ 1.14450\\ 1.13770\\ 1.09570\\ 1.08280\\ 1.05450\\ 1.04760\\ 1.02690\\ 1.02190\\ 1.01470\end{array}$	<1 2 3 3 4 3 <1 6 <1 4 1	3 2 4 3 5 4 5 3 6 4 4 4	3 2 2 1 1 3 2 2 0 1 3	$  \begin{array}{c}    1 \\    2 \\    1 \\    2 \\    1 \\    0 \\    2 \\    1 \\    1 \\  $
Sys.: HexagonalS.G.: $P6_3/m$ (176)a: 7.6044(2)b:c: 2.9075(1)A:C: 0.3823 $\alpha$ : $\beta$ : $\gamma$ :Z: 2mp:Ref. Ibid.SS/FOM: $F_{30}=108(.0087, 32)$ Color: Grayish whiteThe sample was prepared at NBS, Gaithersburg, Maryland, USA, by J. Waring by heating Si3 N4 obtained from GTE Products, Towanda, Pennsylvania, USA to 1785 C for 1 hour at 15 psig. The sample was contained in a Si3 N4 crucible within a molybdenum crucible. N4 Si3 type. Also called: HPSN (hot pressed silicon nitride).Silicon used as an internal stand. PSC: hP14. To replace 9–259 and 29–1132. Mwt: 140.28.	1.75250 1.59110 1.54670 1.51080 1.45340 1.43680 1.43250 1.41970 1.34080 1.32990 1.31730 1.28830 1.26750 1.25540 1.24470 1.19980 1.18310	37 12 6 15 15 15 8 5 1 39 6 5 18 7 16 1 2 2	3 3 3 3 3 0 4 4 1 1 3 2 5 4 3 2 2 4 5 5	0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0	1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	1.01410 1.00430 .991400 .976100 .958900 .945500 .949500 .945500 .949500 .947500 .913200 .903400 .895000 .886600 .872200 .871200 .868200 .863400	234 3581 121 34356 551	765551 36452564537642	1 2 0 0 3 1 2 3 0 0 1 2 4 3 0 1 2 3 2	0 1 2 3 2 1 2 0 3 2 0 1 1 3 0 0 1 1 2 3 0 0 1 2 3 2 0 1 1 2 3 2 0 1 2 3 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 2 1 2

©1996 JCPDS-International Centre for Diffraction Data. All rights reserved.

รูปที่ 5 - d) แสดง Diffraction data เพื่อใช้ในการหา Integrate intensity ที่มุม 0 แต่ละมุม

ของ CC-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> และ  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>



ภาคผนวก จ. กราฟจากการตรวจสอบด้วย EDS













